固体系における原子間ポテンシャル作成のための枠組みの提案

-共有結合・金属結合系への適用-

平成19年 2月

熊谷知久

目 次

| 第1章 | 序論 | 11 |
|-----|-------------------------------------------|----|
| 1.1 | 本論文で用いる用語の定義........................ | 11 |
| 1.2 | 研究の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
| 1.3 | 既存の原子間ポテンシャル作成に関する研究........... | 12 |
| 1.4 | 研究の目的と論文の構成.......................... | 13 |
| 第2章 | 本研究で用いる基礎的な計算手法 | 16 |
| 2.1 | 古典分子動力学法の基礎........................... | 16 |
| | 2.1.1 古典分子動力学法のアルゴリズム | 16 |
| | 2.1.2 周期境界条件と格子マトリクス | 16 |
| | 2.1.3 book-keeping 法 | 17 |
| | 2.1.4 原子間ポテンシャル | 18 |
| | 2.1.5 原子間力 | 20 |
| | 2.1.6 運動方程式 | 20 |
| | 2.1.7 運動方程式の数値積分法 | 21 |
| | 2.1.8 弾性定数の算出法 | 22 |
| | 2.1.9 動径分布関数の算出法 | 24 |
| 2.2 | 第一原理分子動力学法 | 24 |
| | 2.2.1 Born-Oppenheimer 近似 | 24 |
| | 2.2.2 密度汎関数理論とバンド計算 | 24 |
| | 2.2.3 平面波擬ポテンシャル法 | 26 |
| | 2.2.4 波動関数の仮想的な運動方程式から電子状態を解く手法 | 29 |
| 2.3 | 数值最適化手法 | 30 |
| | 2.3.1 数値最適化問題の定義 | 30 |
| | 2.3.2 制約条件のない1次元数値最適化手法 | 30 |
| | 2.3.3 制約条件のない多次元数値最適化手法 | 33 |
| | 2.3.4 不等式制約条件下,等式制約条件下における最適化問題 | 41 |
| 第3章 | 原子間ポテンシャル作成手法の枠組みの提案 | 42 |
| 3.1 | 全体の工程 | 42 |
| 3.2 | 計算目的の設定における指針 | 43 |

| 3.3 | ポテンシャル関数形の決定における指針 | 44 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4 | 合わせ込み物性の選択/収集における指針 | 44 |
| | 3.4.1 合わせ込み物性の選択における指針 | 44 |
| | 3.4.2 合わせ込み物性の収集における指針 | 51 |
| 3.5 | ポテンシャルパラメータの最適化における指針 | 53 |
| | 3.5.1 数值最適化手法 | 53 |
| | 3.5.2 最適化関数の定義 | 53 |
| | 3.5.3 許容範囲にあるポテンシャルパラメータセットの選別 | 57 |
| 3.6 | ポテンシャルパラメータセットの評価/選択における指針 | 58 |
| 3.7 | 結言 | 59 |
| 笠∕辛 | サ方は会営元系への適用 | <u> </u> |
| 牙 ₩ 早 4 1 | 共有約 ロ 半 ル ぶ へ の 過 用 | 01 |
| 4.1 | 約百 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 01 61 |
| | | 01 |
| | 4.1.2 ホテノジャル作成力野にのける肖京と日的 | 62 62 |
| 4.2 | 4.1.5 13 小ナノンヤル | 02 62 |
| 4.2 | ELASI, MELI 小ナノシャルの用光 | 03 |
| | 4.2.1 前昇日的の設定 | 04 |
| | 4.2.2 ホナノシャル (実数形の) 沃正 ··································· | 64 65 |
| | 4.2.3 日わせ込み初往の選択 | 00 |
| | 4.2.4 日わせ込み初任の収集 | 00 |
| | 4.2.3 ホナノシャルハフメータの取過化 | 00 |
| 4.2 | 4.2.0 結末 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0/ |
| 4.3 | MOD 小ナノシャルの開発 | 70 |
| | | 72 |
| | | 12 |
| | 4.3.3 日わせ込み物性の迭折/収集 | 13 |
| | 4.3.4 小ナノシャルハフメータの取過化 | 13 |
| 1 1 | 4.3.3 | 13 77 |
| 4.4 | 「ち奈 | 70 |
| 4.5 | 柏日 | 79 |
| 第5章 | 共有結合2元系への適用 | 80 |
| 5.1 | 緒言 | 80 |
| | 5.1.1 工学的な背景 | 80 |
| | 5.1.2 ポテンシャル作成における背景と目的 | 80 |
| 5.2 | Si-B 系原子間ポテンシャルの開発................. | 81 |
| | 5.2.1 計算目的の設定 | 81 |

| | 5.2.2 | ポテンシャル関数形の決定 | 81 |
|-----|---------|---------------------------------------------|-----|
| | 5.2.3 | B 同種原子間パラメータ作成のための合わせ込み物性の選択 . | 83 |
| | 5.2.4 | Si-B 異種原子間パラメータ作成のための合わせ込み物性の選択 | 83 |
| | 5.2.5 | 合わせ込み物性の収集 | 86 |
| | 5.2.6 | ポテンシャルパラメータの最適化............ | 86 |
| 5.3 | 結果 . | | 87 |
| | 5.3.1 | 得られたポテンシャルパラメータ........... | 87 |
| | 5.3.2 | 結晶の再現性............................ | 87 |
| | 5.3.3 | SiB 拡散構造の再現性 | 89 |
| | 5.3.4 | クラスタ構造の再現性 | 89 |
| 5.4 | 開発し | た原子間ポテンシャルを用いた古典分子動力学計算 | 93 |
| | 5.4.1 | 格子間 Si による B の拡散 | 93 |
| | 5.4.2 | Si-B クラスタの形成 | 93 |
| 5.5 | 結言 . | | 98 |
| 第6章 | 金属結 | 合2元系への適用 | 99 |
| 6.1 | 緒言 . | | 99 |
| | 6.1.1 | 工学的な背景 | 99 |
| | 6.1.2 | ポテンシャル作成における背景と目的 | 100 |
| 6.2 | Zr-Ni 🦉 | 系ポテンシャルの開発 | 101 |
| | 6.2.1 | 計算目的の設定........................ | 101 |
| | 6.2.2 | ポテンシャル関数形の決定 | 101 |
| | 6.2.3 | Ni 同種原子間パラメータ作成のための合わせ込み物性の選択 | 103 |
| | 6.2.4 | Zr 同種原子間パラメータ作成のための合わせ込み物性の選択. | 104 |
| | 6.2.5 | ZrNi 異種原子間ポテンシャルパラメータ作成のための合わせ | |
| | | 込み物性の選択......................... | 104 |
| | 6.2.6 | 合わせ込み物性の収集 | 106 |
| | 6.2.7 | ポテンシャルパラメータの最適化........... | 107 |
| 6.3 | 結果 . | | 107 |
| | 6.3.1 | ポテンシャルパラメータ.................. | 107 |
| | 6.3.2 | 合わせ込みに用いた結晶の物性値と欠陥の物性値の再現性 | 109 |
| | 6.3.3 | Zr ₇₀ Ni ₃₀ アモルファスの特性 | 124 |
| 6.4 | 考察 . | | 124 |
| 6.5 | 結言 . | | 126 |
| 第7章 | 結言と | 将来の展望 | 127 |
| 7.1 | 結言 . | | 127 |
| 7.2 | 将来の | 展望 | 127 |

| | 7.2.1 枠組み適用範囲の拡大 | 127 |
|------|-----------------------------------|-----|
| | | 120 |
| | | 129 |
| | 7.2.4 枠組みの使われ方に関する展望 | 129 |
| 付録A | AIN 系への適用 | 131 |
| A.1 | ポテンシャル作成手法の AlN 系への適用 | 131 |
| A.2 | ポテンシャル関数の決定 | 131 |
| A.3 | 合わせ込み物性の選択/収集 | 132 |
| Δ 4 | ポテンシャル合わせ込み結果 | 133 |
| Δ.5 | | 133 |
| Π.J | | 155 |
| 付録B | Standard Fitting Data において用いられる構造 | 135 |
| B.1 | 架橋型2元系構造 | 135 |
| B.2 | 等配合2元系構造 | 138 |
| B.3 | Diamond 型構造 | 139 |
| B.4 | SC 型構造 | 140 |
| B.5 | BCC 型構造 | 141 |
| B.6 | FCC 型構造 | 143 |
| B.7 | Cu ₂ Mg 型構造 | 143 |
| | | |
| 参考文南 | X | 144 |
| 研究業績 | | 151 |
| 謝辞 |] | 157 |



| 1.1 | The flowchart of this thesis | 15 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2.1 | Periodic boundary condition | 17 |
| 2.2 | Book-keeping method for MD calculation | 18 |
| 3.1 | The flowchart for fitting process | 43 |
| 4.1 | Cohesive energy as a function of atomic volume for ELAST potential | 71 |
| 4.2 | Cohesive energy as a function of atomic volume for MELT potential | 71 |
| 4.3 | Normalized angular-dependent terms of our proposed potential and the | |
| | T3 potential. | 74 |
| 4.4 | Cohesive energy as a function of atomic volume for MOD potential | 77 |
| 4.5 | Dependence of melting point on potential parameter c_4 was shown. The | |
| | potential potential parameters h , c_5 , R_1 and R_2 are identical to those of | |
| | our proposed potential shown in Table 4.7. The other parameters are op- | |
| | timized so that coordination dependence and elastic properties can be re- | |
| | produced. | 78 |
| 5.1 | B diffusion structures (left) and Si-B cluster structures (right) used for | |
| | fitting. (A) indicates structures identified by Alippi et al. [60] | 85 |
| 5.2 | SiB cluster structures were identified by Windl et al. [59] | 85 |
| 5.3 | Mean square displacement of substitutional boron atom for B structure as | |
| | a function of time with no interstitial silicon atoms. | 94 |
| 5.4 | Mean square displacement of substitutional boron atom for BI strucure as | |
| | a function of time with intersitial silicon atoms. | 94 |
| 5.5 | Mean square displacement of substitutional boron atom for BI structure | |
| | every 100 pico second | 96 |
| 56 | Mean square displacement of substitutional boron atom for R. I structure | |
| 5.0 | We all square displacement of substitutional boron atom for \mathbf{B}_4 is declare | |
| 5.0 | every 100 pico second | 96 |
| 5.0 5.7 | every 100 pico second | 96 |
| 5.7 | every 100 pico second | 96 97 |

| 5.8 | Mean square displacement of substitutional boron atom for B_4I_3 structure |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | every 100 pico second |
| | |
| 6.1 | Φ_{ZrZr}, Φ_{ZrNi} and Φ_{NiNi} as a function of bond length |
| 6.2 | f_{Zr} as a function of interatomic distance |
| 6.3 | f_{Ni} as a function of interatomic distance |
| 6.4 | F_{Zr} as a function of electron density |
| 6.5 | F_{Ni} as a function of electron density |
| 6.6 | $\frac{dF_{Zr}}{d\rho}$ as a function of electron density |
| 6.7 | $\frac{dF_{Ni}}{d\rho}$ as a function of electron density |
| 6.8 | $\frac{d^2 F_{Zr}}{d\rho^2}$ as a function of electron density |
| 6.9 | $\frac{d^2 F_{Ni}}{d\rho^2}$ as a function of electron density |
| 6.10 | Energy curve as a function of atomic volume for SC-Zr |
| 6.11 | Energy curve as a function of atomic volume for BCC-Zr |
| 6.12 | Energy curve as a function of atomic volume for HCP-Zr |
| 6.13 | Energy curve as a function of atomic volume for FCC-Zr |
| 6.14 | Energy curve as a function of atomic volume for SC-Ni |
| 6.15 | Energy curve as a function of atomic volume for BCC-Ni |
| 6.16 | Energy curve as a function of atomic volume for FCC-Ni |
| 6.17 | Averaged radial distribution runctions for 8 case of Zr ₇₀ Ni ₃₀ amorphous |
| | structures annealed at 500K. Experimeltal as-quenched data are shown |
| | for comparison. |
| 6.18 | Radial distribution functions of $Zr_{36,3}Ni_{63,7}$ amorphous structure. That of |
| | experimental data[81] and that obtained using GEAM potential are shown |
| | for comparison. |
| | |
| B .1 | A schematic figure of bridged graphitic structure |
| B.2 | A schematic figure of bridged diamond-type structure |
| B.3 | A schematic figure of bridged SC-type structure |
| B.4 | A schematic figure of bridged BCC-type structure |
| B.5 | A schematic figure of bridged FCC-type structure |
| B.6 | A schematic figure of hetro dimer structure |
| B.7 | A schematic figure of hetro chain structure |
| B.8 | A schematic figure of hetro graphitic structure |
| B.9 | A schematic figure of Diamond-type X_7Y_1 |
| B .10 | A schematic figure of Diamond-type X_5Y_3 |
| B .11 | A schematic figure of ZnS (Diamond-type X_4Y_4) |
| B.12 | A schematic figure of SC-type X_7Y_1 |

| B.13 A schematic figure of SC-type X_6Y_2 |
|----------------------------------------------------------|
| B.14 A schematic figure of NaCl (SC-type X_4Y_4) |
| B.15 A schematic figure of BCC-type $X_{14}Y_2$ \ldots |
| B.16 A schematic figure of BCC-type $X_{12}Y_4$ \ldots |
| B.17 A schematic figure of BCC-type $X_{10}Y_6$ |
| B.18 A schematic figure of CsCl (BCC-type X_8Y_8) |
| B.19 A schematic figure of FCC-type X_3Y_1 |
| B.20 A schematic figure of FCC-type X_2Y_2 |
| B.21 A schematic figure of Cu_2Mg -type X_2Y |

表目次

| 1.1 | Systems used for applications of the proposed framework | 14 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Coordination numbers between the nearest neighbor atoms and bond angles between the nearest neighbor bonds for polytypes. | 48 |
| 3.2 | Bond angles of various crystals. θ_{ijk} inclates the angle of the bonds be- | 10 |
| | tween ij and ik . | 49 |
| 3.3 | Coordination numbers of various crystals. | 50 |
| 4.1 | Coordination numbers between the nearest neighbor atoms and bond an- | |
| | gles between the nearest neighbor bonds for silicon polytypes used for | |
| | fitting | 65 |
| 4.2 | Potential parameters for ELAST potential and MELT potential. | 67 |
| 4.3 | Physical properties of diamond silicon calculated using ELAST potential | |
| | and MELT potential. E_0 , a , C_{ij} , ζ and T_m are cohesive energy, lattice | |
| | constant, elastic constants, Kleinman's internal strain parameter and the | |
| | melting point, respectively. C_{44}^0 is the theoretical value obtained for C_{44} | |
| | in the absence of internal displacement, and C_{44}^* is defined by $C_{44}^0 - C_{44}$. | 68 |
| 4.4 | The relative energies of polytypes of silicon calculated using ELAST po- | |
| | tential and MELT potential in eV/atom. | 69 |
| 4.5 | The bond lengths of polytypes of silicon calculated using ELAST poten- | |
| | tial and MELT potential in Å. | 70 |
| 4.6 | Formation energies for vacancy and self-interstitial defects calculated us- | |
| | ing ELAST potential and MELT potential in eV | 72 |
| 4.7 | Potential Parameters for MOD potential. | 74 |
| 4.8 | Physical properties of diamond silicon calculated using MOD potential. | 75 |
| 4.9 | Relative energies of silicon polytypes calculated using MOD potential in | |
| | eV/atom. | 76 |
| 4.10 4.11 | Bond lengths of silicon polytypes calculated using MOD potential in $Å$. Formation energies for vacancy and self-interstitial defects calculated us- | 76 |
| | ing MOD potential in eV. | 78 |
| 5.1 | Coordination number and bond angles of polytypes of boron. | 83 |

| 5.2 | Coordinations and bond angles of various crystals |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5.3 | Developed potential parameters. Upper and Lower show two-body and |
| | three-body parameters, respectively |
| 5.4 | Developed potential parameters for two body terms |
| 5.5 | Developed potential parameters for three body terms |
| 5.6 | Cohesive energies and equilibrium bond lengths used for fitting and those |
| | calculated using developed potential |
| 5.7 | Elastic properties of Si-B crystals in GPa. B indicates bulk modulus and |
| | C_{ii} indicates elastic constant |
| 5.8 | Energies of B diffusion structures |
| 5.9 | Energies of cluster structures |
| | |
| 6.1 | Coordination numbers of various Zr-Ni binary crystals |
| 6.2 | Developed Potential Parameters for Zr-Ni Systems |
| 6.3 | Material Properties for HCP Zr |
| 6.4 | Material Properties for FCC Ni |
| 6.5 | Relative Energies for Zr Polytypes in eV/atom |
| 6.6 | Lattice Constants for Zr Polytypes |
| 6.7 | Bulk moduli for SC-Zr, BCC-Zr, FCC-Zr and HCP-Zr |
| 6.8 | Relative Energies for Ni Polytypes |
| 6.9 | Lattice Constants for Ni Polytypes |
| 6.10 | Bulk moduli for SC-Ni, BCC-Ni and FCC-Ni |
| 6.11 | Reaction Energies of Zr-Ni binary crystals used for fitting |
| 6.12 | Lattice constants of Zr-Ni binary crystals used for fitting |
| 6.13 | Bulk moduli of Zr-Ni binary crystals used for fitting |
| 6.14 | Defect formation energies of Zr-Ni defected structures used for fitting. In |
| | this table, Octa, Split and Mono vac indicate Octahedral-type interstitial, |
| | split(100)-type interstitial and Mono vacancy, respectively |
| A.1 | Cohesive energies and equilibrium bond lengths of polytypes for Al 134 |
| A.2 | Cohesive energies and equilibrium bond lengths of polytypes for N 134 |
| A.3 | Cohesive energies and equilibrium bond lengths of binary crystals for Al- |
| | N |

第1章 序論

1.1 本論文で用いる用語の定義

本節ではまず,本論文で用いる用語の定義を行う.古典分子動力学における原子間 ポテンシャルとは,空間上(主に3次元空間)に存在する原子のの原子種と原子位置 が与えられたとき,系のポテンシャルエネルギを定義する微分可能である解析的な関 数のことである.原子間ポテンシャルはその関数の形式であるポテンシャル関数形 とそのパラメータである複数のポテンシャルパラメータという要素からなる.ある1 種の原子間ポテンシャルにおいて用いられる複数のポテンシャルパラメータをポテ ンシャルパラメータセットと呼ぶ.逆に言えば,ポテンシャル関数形とポテンシャル パラメータセットを合わせて,原子間ポテンシャルとなる.ある物性を再現するよう にポテンシャルパラメータセットを決定することをポテンシャルを合わせ込む,もし くはフィッティングを行うと呼び,この行為自体をポテンシャル合わせ込み,もしく はポテンシャルフィッティングと呼ぶ.

1.2 研究の背景

古典分子動力学計算において,原子間ポテンシャルが原子間の相互作用を決定す ることから,最も支配的な要素のひとつであるといえる.しかしながら,一部の単元 系とごく少数の多元系についてしか,高精度な原子間ポテンシャルは作成されていな い.さらに,計算対象とする元素系の原子間ポテンシャルが既に開発されていたとし ても,解析を行う目的ごとに求められる精度や再現すべき物性は異なるため,既存の 原子間ポテンシャルをそのまま利用できることは少ない.このため,古典分子動力学 法を用いて解析する人間が,計算目的に応じた原子間ポテンシャルを作成しなければ いけないという状況に直面することがある.

近年では、商用の古典分子動力学ソフトウェアの普及により、設計現場において古 典分子動力学解析が行われるようになってきている.このような場合、新たな材料や 配合を試したりするため、3元系以上の多元系や希少な元素を含む系の古典分子動力 学計算となる.しかしながら、高い精度を持った3元系以上の多元系や希少な元素を 含む系の原子間ポテンシャルは開発されていない場合がほとんどであるため、解析 者が原子間ポテンシャルを作成しなければいけないという事態が以前より頻繁に起 こっていると考えられる。

原子間ポテンシャルの作成が含まれる研究においては、作成された原子間ポテン シャルを用いた計算が目的となることが多く、その場合は、原子間ポテンシャル作成 手法については詳細に記述されない. このため、原子間ポテンシャルを作成しようと 考えている解析者が、そのような手法に倣って原子間ポテンシャルを作成するために は、手法を調査したり、試行錯的な作業を行う必要がある. このように、古典分子動力 学計算をスタートする前に、原子間ポテンシャルの作成に大きな手間がかかってしま うため、計算目的に応じた原子間ポテンシャルがない場合の古典分子動力学を用いた 解析というのは簡単に行えないのが現状である. このような原子間ポテンシャル作 成の困難さは、古典分子動力学計算分野におけるもっとも大きな障害の1つとなって いる.

1.3 既存の原子間ポテンシャル作成に関する研究

1980年代くらいまでの計算機の能力が低い時代は,計算機能力に頼るポテンシャル パラメータフィッティングが難しかったために,多数のポテンシャルパラメータを持っ たポテンシャル関数を作成することが難しかった.このため,自由に決定できるポテ ンシャルパラメータの数の少ない厳密な理論に基づいたポテンシャル関数が用いら れ,ポテンシャルパラメータの数とほぼ同じ程度の限られた数の物性を再現できるよ うに,ポテンシャルパラメータは解析的に決定されていた.よって,少ない数ではある が,合わせ込んだ物性は完璧に再現できる反面,ポテンシャルパラメータの調整によっ て,合わせ込んでいない物性の再現性を高めるということはできなかった.代表的な ものに,Lennard-Jones ポテンシャル,Daw と Baskes による Embedded Atom Method (EAM) ポテンシャル[1], Baskes による Modified Embedded Atom Method (MEAM) ポ テンシャル[2] などがある.

これに対し、1990年代に入り計算機の能力が高まってくると、計算機能力を用い たポテンシャルパラメータフィッティングができるようになり、多数のポテンシャル パラメータを持ったポテンシャル関数を作成できるようになった.このため、ポテン シャル関数の定式化の後に多くのポテンシャルパラメータを追加することによって、 自由に決定することのできるポテンシャルパラメータの数が多くして、合わせ込む 物性の数を増やすことができるようになった.これらのポテンシャルパラメータを 多次元最適化手法を用いて決定する.多次元最適化手法を用いたポテンシャルパラ メータ最適化によって、ポテンシャルパラメータの数以上の物性の合わせ込みが可能 となった.代表的なものに、Tersoff[3][4][5]、Brenner ポテンシャル[6]、Mishin ポテン シャル[7][8][9][10] などがある.

ここで挙げた原子間ポテンシャルのうち,作成手法が手順化されているのはMEAM ポテンシャルのみである. MEAM ポテンシャルは角度依存項を含む近距離型ポテン シャル関数形を持ち、そのポテンシャルパラメータのほとんどは合わせ込む物性値から解析的に決定され、ごく一部のポテンシャルパラメータのみがフィッティングされる.また、多元系ポテンシャルとしては、参照構造となる1つの構造しか合わせ込みに用いることができない.このように、MEAM ポテンシャル作成手順は MEAM ポテンシャル関数形に限られてしまうために、その適用範囲は狭い.また、解析的に決定されるポテンシャルパラメータが多いために、合わせ込みに用いることのできる物性の種類が少ないという欠点もある.このため、原子間ポテンシャルが開発されていない系の原子間ポテンシャルを作成する手法として用いることは難しい.MEAM ポテンシャル以外でも手順化された作成手法が明示されている原子間ポテンシャルはほとんどないのが現状である.

1.4 研究の目的と論文の構成

1.2節で述べたように、計算目的に応じて、手間をかけずに原子間ポテンシャルを作 成できる手法に対する要望は高い.このような要望にこたえる1つの形として、汎用 化された原子間ポテンシャル作成ソフトウェアの開発が考えられる.このソフトウェ アは、ユーザが計算の対象とする元素、使用するポテンシャル関数形、合わせ込む物 性を入力すれば、ポテンシャルパラメータが出力されるというシステムである.いわ ば、古典分子動力学計算を行うためのプリプロセッサのような役割を持つといえる. このような汎用化されたソフトウェアがあれば、解析を行うたびに目的に合った原子 間ポテンシャルを作成して、古典分子動力学計算を行うことや、複数の原子間ポテン シャルを作成して、それぞれを古典分子動力学計算で試してみるということなどの、 今までできなかったような解析が可能となる.しかしながら、1.3節で述べたように、 現状ではこのように高い自由度を持った原子間ポテンシャル作成ソフトウェアを実 現できるような原子間ポテンシャル作成手順はいまだに知られていない.

このため、本論文では、汎用原子間ポテンシャル作成ソフトウェアを実現できるような、様々な古典分子動力学計算の目的に対応できる原子間ポテンシャル作成手法のための枠組みの提案を目的とする.なるべく幅広く、古典分子動力学計算の目的に対応できるようにするためには、できるだけ広い範囲で計算の対象とする元素、使用するポテンシャル関数形、合わせ込む物性の入力を可能とする必要がある.しかし、もし、ごくたまにしか実用的な原子間ポテンシャル(つまり、古典分子動力学計算中に系が不安定にならない)を生成できない手法であっては、簡便に原子間ポテンシャルを作成することが不可能となり、古典分子動力学が敬遠されるという障害の原因を取り除くことができない.このため、提案する原子間ポテンシャルを生成できることが望ましい.

本来,あらゆる系に関して提案した枠組みを適用してその適用性を確かめるのが 望ましいが,本研究はまだその段階まで到達していない.本研究では,固体系である ボンドオーダ型ポテンシャル関数形を用いた共有結合単元系,ボンドオーダ型ポテン シャル関数形を用いた共有結合2元系,EAM型ポテンシャル関数形を用いた金属結 合単元系,EAM型ポテンシャル関数系を用いた金属結合2元系に提案した枠組みを 適用し,その適用性を確かめるに留まっている.Table 1.1 に本研究における適用例を まとめて示す.さらに,計算目的に即して重要となるような物性として,融点温度,拡 散現象,クラスタリング現象,アモルファス構造など静的に計算することが難しい物 性の再現も行う.

Table 1.1: Systems used for applications of the proposed framework.

| | 兀系 | N 元糸ホテンシャル | 結合形態 | 関数形 | 計算目的 |
|-------------------|--------|---------------------------------------|--------|-------------|-------------------|
| 4章 | Si | 単元系 (Si-Si) | 共有結合 | ボンドオーダ型 | 融点,弾性定数の再現 |
| 5章 | Si, B | 単元系 ^a (B-B) 2 元系 (Si-B) | 共有結合 | ボンドオーダ型 | 拡散現象 クラスタリング現象 |
| 6章 | Zr, Ni | 単元系 (Zr-Zr,Ni-Ni) | 金属結合 | EAM 型 | アモルファス構造 |
| | | 2 元系 (Zr-Ni) | | | |
| 付録 | Al, N | 単元系 (Al-Al,N-N) | 共有結合 | ボンドオーダ型 | 化学的秩序 |
| | | 2 元系 (Al-N) | | | |
| ^a Si-S | i には既i | 写の Tersoff 3 ポテンシ | ャルパラメ- | - タ [4] を採用 | |

本論文はまず,ここまで述べたように第1章にて,用語の定義,背景としてのポテンシャル作成手法の研究が必要とされる古典分子動力学シミュレーションの現状,これまでのポテンシャル作成手法の研究の紹介,本研究の目的を述べる.

第2章にて、本研究で用いる基礎的な計算手法について説明する. 最初に古典分子 動力学法について述べる. この手法は原子間ポテンシャルを用いて、エネルギをはじ めとする系の物性値を算出するために必要な技術である. 次に、平面波密度汎関数法 について述べる. この手法は合わせ込みに用いるための物性値を算出するために用 いられる. 本研究で、平面波密度汎関数法を行うためには、商用パッケージを用いて いるが、その基礎となる部分については説明を行う. 最後に数値最適化手法について 述べる. この手法はポテンシャルパラメータの最適化や原子構造の最適化のために 用いられ、用途によって様々な手法を使い分ける必要があり、本研究で用いた手法を 中心に説明を行う.

第3章にて、本研究で提案する原子間ポテンシャル作成手法の枠組みについて述べる. この原子間ポテンシャル作成手法の枠組みについて、全体の手順と手順における 各工程の指針を説明する.

第4章にて、本研究で提案した枠組みを共有結合単元系に適用し、拡張 Tersoff ポテンシャル関数形を用いたシリコンの弾性定数と融点を再現する原子間ポテンシャルの作成したケースについて述べる.

第5章にて、本研究で提案した枠組みを共有結合2元系に適用し、拡張 Tersoff ポテンシャル関数形を用いたシリコン中のボロンの拡散とクラスタリングを取り扱うこ

とのできる原子間ポテンシャルを作成したケースについて述べる.

第6章にて、本研究で提案した枠組みを金属結合2元系に適用し、EAM ポテンシャル関数形を用いたアモルファス ZrNi 金属のを再現する原子間ポテンシャルを作成したケースについて述べる.

第7章にて、本研究によって得られた知見と今後の展望を述べる. 本論文の構成を Fig. 1.1 に示す.



Fig. 1.1: The flowchart of this thesis

第2章 本研究で用いる基礎的な計算 手法

2.1 古典分子動力学法の基礎

2.1.1 古典分子動力学法のアルゴリズム

古典分子動力学法とは、計算機上の分子・原子にある経験的ポテンシャルを与える ことによって原子に働く力を求め、与えられた系の運動方程式に基づいて原子を動か し、挙動を捉える計算手法である、実際には

(1) 初期条件の作成

- (2) 原子間力を計算する原子対を求める (book-keeping 法)
- (3) 原子間ポテンシャルにより原子間力を算出
- (4) Verlet 法によって, *∆t* 後の原子の位置・速度を求める
- (5) 物理量の算出
- (6) (2) に戻る
- という手順で各原子の時間軌跡が求まることになる.

2.1.2 周期境界条件と格子マトリクス

実際に計算機で10²² 個程度の原子は今の計算機能力では扱えない. そこで, 通常バルクの性質を表すためには周期境界条件を用いる. バルクの性質を見る場合には境界として周期境界条件を使うのが一般的である. 周期境界条件とは, 原子の集合を長さLの1つの単位胞 (unit cell) と考え, その周り (image unit) に同じものが周期的に並んでいると考える境界条件 (Fig. 2.1) で, 擬似的な無限系を作ることができ, エネルギーが正確に保存され, 物理的矛盾が少ない.



Fig. 2.1: Periodic boundary condition

単位胞の表現は格子マトリクス *h* によって行う. 3 次元の場合, 単位胞を 3 つの基本ベクトル $a = (a_x, a_y, a_z)$, $b = (b_x, b_y, b_z)$, $c = (c_x, c_y, c_z)$ を辺とする平行 6 面体と考え, 格子マトリクスを

$$\boldsymbol{h} = \begin{bmatrix} a_x & b_x & c_x \\ a_y & b_y & c_y \\ a_z & b_z & c_z \end{bmatrix}$$
(2.1)

のように表す. これによって, α 番原子の位置 r^{α} を

$$\boldsymbol{r}^{\alpha} = \rho_{ax}\boldsymbol{a} + \rho_{bx}\boldsymbol{b} + \rho_{cx}\boldsymbol{c} = \boldsymbol{h}\boldsymbol{\rho}_{\boldsymbol{a}} \left(0 < \rho_{ax}, \rho_{bx}, \rho_{cx} \right)$$
(2.2)

規格化して表現することができる.

2.1.3 book-keeping法

原子間の力は原子間距離が長くなれば非常に小さくなるので、せいぜい数単位格 子長さ範囲を計算すれば近似的に良いとされている.原子間力を計算する範囲を半 径 *r*_c とすると,ある原子の半径 *r*_c の球内の原子をあらかじめ覚えておいて,その原 子との間の力のみを求めれば計算時間を削減できる.また,登録する原子を *r*_c 内だけ に設定すると原子の位置が更新されるたびに再登録をする必要があるので,登録する範囲を r_c より少し大きい $R_c(>r_c)$ とすれば毎回の再登録が必要でなくなり効率的である.以上の方法をbook-Keeping法と呼ぶ. Fig. 2.2 にその概念図を示す. R_c , または有効ステップ N_{up} は以下のように決定される.

温度 *T*K での粒子の運動エネルギーから平均粒子速度 v_{ave}^T を出す. 粒子の最大速度は平均速度の 3 倍程度なので (分布より確認), $v_{max}^T \simeq 3v_{ave}^T$, これと計算時間 (有効ステップ) $N_{up}\Delta t$ を掛け合わせたものがその時間ステップに粒子が動ける最大距離 $\Delta r_c = v_{max}^T N\Delta t$ なので, r_c に Δr_c を足せば少なくとも N_{up} ステップでは, R_c (= $r_c + \Delta r_c$) 外の粒子は r_c 内に入らないという条件が得られる.



Fig. 2.2: Book-keeping method for MD calculation

2.1.4 原子間ポテンシャル

ここで改めて原子間ポテンシャルについて説明を行う.1.1節でも述べたように古 典分子動力学における原子間ポテンシャルとは,空間上(主に3次元空間)に存在す る原子のの原子種と原子位置が与えられたとき,系のポテンシャルエネルギを定義す る微分可能である解析的な関数のことである.原子間ポテンシャルはその関数の形 状であるポテンシャル関数とそのパラメータである複数のポテンシャルパラメータ からなる.

もっとも単純な表記として,系のポテンシャルエネルギは

$$\Phi = E_0 + \frac{1}{2!} \sum_{\alpha,\beta} V_2\left(\boldsymbol{r}^{\boldsymbol{\alpha}}, \boldsymbol{r}^{\beta}\right) + \frac{1}{3!} \sum_{\alpha,\beta,\gamma} V_3\left(\boldsymbol{r}^{\boldsymbol{\alpha}}, \boldsymbol{r}^{\beta}, \boldsymbol{r}^{\gamma}\right) + \dots$$
(2.3)

となる. ここで r^{α} は系において原子が N 個含まれるとき, すべての原子に 1 から nまでの番号を振っていき, そのうち α 番目の原子の原子位置ベクトルを表す. 以降こ の α 番目の原子のことを α 番原子と表記する.

原子間ポテンシャル関数には様々なものがあるが、主に

- Pair Potential
- Cluster Potential
- Pair Funtional
- Cluster Functional

に4種類に分類することができる[11].

Pair Potential の関数形は

$$\Phi = E_0 + \frac{1}{2} \sum_{\alpha,\beta} V_2^{eff} \left(\boldsymbol{r}^{\alpha}, \boldsymbol{r}^{\beta} \right)$$
(2.4)

となる.単純に系に含まれる原子対の位置に応じたエネルギを足し合わせたものが ポテンシャルエネルギとなる.この関数形は単純であるために,ごく限られた範囲の 原子は配置でしか物性を再現できない.

Cluster Potential の関数形は

$$\Phi = E_0 + \frac{1}{2!} \sum_{\alpha,\beta} V_2^{eff} \left(\boldsymbol{r}^{\alpha}, \boldsymbol{r}^{\beta} \right) + \frac{1}{3!} \sum_{\alpha,\beta,\gamma} V_3^{eff} \left(\boldsymbol{r}^{\alpha}, \boldsymbol{r}^{\beta}, \boldsymbol{r}^{\gamma} \right) + \dots$$
(2.5)

となる. 高次項を加えていくことによって, Pair Potential 関数形にくらべて, 広い範囲の原子配置での物性の再現することができる. しかしながら, 合わせ込みに用いた物性は再現できるものの, ポテンシャル関数形の理論的背景が薄いために, 合わせ込みに用いていない物性の再現性は保証されない. また, 計算時間を考えると, 実際的には3次項程度までしか考えることができず, ある程度の範囲の原子配置の物性までしか再現することができない.

Pair Functional の関数形は

$$\Phi = E_0 + \frac{1}{2!} \sum_{\alpha,\beta} V_2^{eff} \left(\boldsymbol{r}^{\alpha}, \boldsymbol{r}^{\beta} \right) + \sum_{\alpha} U \left(\sum_{\alpha} g_2 \left(\boldsymbol{r}^{\alpha}, \boldsymbol{r}^{\beta} \right) \right)$$
(2.6)

となる. 近接の単純な局所原子環境の貢献を表す関数を引数とする汎関数 U を導入 することにより, 非常に広い範囲の原子配置における物性の再現を可能としている が, ただし, 局所原子環境の貢献を2体項の形式でしか取り入れることができないた めに, 再現できる範囲は広いものの, その再現性自体は非常に高いとはいえない. Cluster Functional の関数形は

$$\Phi = E_0 + \frac{1}{2!} \sum_{\alpha,\beta} V_2^{eff} \left(\boldsymbol{r}^{\alpha}, \boldsymbol{r}^{\beta} \right) + \sum_{\alpha} U \left(\sum_{\beta} g_2 \left(\boldsymbol{r}^{\alpha}, \boldsymbol{r}^{\beta} \right), \sum_{\beta,\gamma} g_3 \left(\boldsymbol{r}^{\alpha}, \boldsymbol{r}^{\beta}, \boldsymbol{r}^{\gamma} \right), \dots \right) (2.7)$$

となる. 近接の高次の局所原子環境の貢献の汎関数 U を導入することにより,非常に 広い範囲の原子配置における物性の再現を可能とし,その精度も高くなるが,その計 算負荷は高くなる.

2.1.5 原子間力

原子間力はヘルマン-ファインマン則によって求める. 即ち, 系全体のポテンシャル エネルギを Φ とすれば, 系の α 番原子に作用する原子間力ベクトル $f^{\alpha}(3$ 次元であれ ば $f^{\alpha} = (f_x^{\alpha}, f_y^{\alpha}, f_z^{\alpha}))$ の *i* 成分は

$$f_i^{\alpha} = -\frac{\partial \Phi}{\partial r_i^{\alpha}} \tag{2.8}$$

となる.

2.1.6 運動方程式

分子動力学法では設定したアンサンブルに応じて異なる運動方程式を解いて,原 子間力を原子の加速度に変換する.原子数(N),体積(V),エネルギ(E)一定であるミ クロカノニカルアンサンブルの場合もっとも基礎的な運動方程式

$$\boldsymbol{f}^{\alpha} = m^{\alpha} \frac{d^2 \boldsymbol{r}^{\alpha}}{dt^2}$$
(2.9)

を解くことになる. ここで m^{α} は α 番原子の質量である.

温度制御法

系の温度 Tは, α 番原子の速度を v^{α} としたとき,

$$\frac{3}{2}Nk_BT = \sum_{\alpha} \frac{1}{2}m^{\alpha} (v^{\alpha})^2$$
(2.10)

のように算出することができる. ここで k_B はボルツマン定数である. 代表的な温度 制御法には Nose の方法と速度スケーリング法が存在する. 本研究では簡単に実装で きる速度スケーリング法を用いている. 速度スケーリング法においては強制的に各 原子の速度をスケーリングする. 即ち, ある時刻における温度が T, 目標温度が T_c, ス ケーリング前の α 番原子の速度 v^{α} であるとき, スケーリング後の α 番原子の速度 $v^{\alpha'}$ を

$$v^{\alpha'} = \sqrt{\frac{T_c}{T}} v^{\alpha} \tag{2.11}$$

とする.

圧力制御法

 α 番原子の速度を v^{α} としたとき, 原子間ポテンシャルを用いてセルにかかる圧力 を系全体の平均圧力テンソルの σ_{ii} 成分は,

$$\sigma_{ij} = \frac{1}{2V} \sum_{\alpha} \frac{\partial \Phi}{\partial r_i^{\alpha}} r_j^{\alpha}$$
(2.12)

のように表現することができる. ここで, σ_{ij} は計算セルにかかる平均圧力テンソル の ij成分, $r_i^{\alpha\beta}$ は系における α 番原子の位置ベクトルの i成分, V は h で表現される セルの体積であり, V = det(h)となる.

圧力の制御法としては Andersen 法や Parrinello-Rahman 法などが存在するが,本研 究では単純に,圧縮の圧力がかかっている場合はセルを拡張し,引張りの圧力がかかっ ている場合はセルを縮小する手法を用いた.

2.1.7 運動方程式の数値積分法

運動方程式の数値積分法には分子動力学計算に最も良く用いられる速度 Verlet 法 を用いた. 原子座標 $r^{\alpha}(t \pm \Delta t)$ を Tayler 展開し,式 (2.9) の関係を用いると,

$$r_{i}^{\alpha}(t \pm \Delta t) = r_{i}^{\alpha}(t) \pm v_{i}^{\alpha}(t) \Delta t + \frac{(\Delta t)^{2}}{2}a_{i}^{\alpha}(t) \pm O\left((\Delta t)^{3}\right)$$
$$= r_{i}^{\alpha}(t) \pm v_{i}^{\alpha}(t) \Delta t + \frac{(\Delta t)^{2}}{2}\frac{f_{i}^{\alpha}(t)}{m^{\alpha}} \pm O\left((\Delta t)^{3}\right)$$
(2.13)

となる. ここで, $v_i^{\alpha}(t) a_i^{\alpha}(t)$ それぞれ時刻 t における α 番原子の速度ベクトルの i 成分、 α 番原子の加速度ベクトルの i 成分である. この両式の和を取ると,

$$r_{i}^{\alpha}(t + \Delta t) = 2r_{i}^{\alpha}(t) - r_{i}^{\alpha}(t - \Delta t) + (\Delta t)^{2} \frac{f_{i}^{\alpha}(t)}{m^{\alpha}} + O\left((\Delta t)^{4}\right)$$
(2.14)

$$\approx 2r_i^{\alpha}(t) - r_i^{\alpha}(t - \Delta t) + (\Delta t)^2 \frac{f_i^{\alpha}(t)}{m^{\alpha}}$$
(2.15)

となり、この式 (2.15)を原子座標に対する時間積分公式として用いる手法を Verlet 法 と呼ぶ. 特に速度 $v_i^{\alpha}(t)$ を

$$v_i^{\alpha}(t) = \frac{1}{2\Delta t} \left[r_i^{\alpha} \left(t + \Delta t \right) - r_i^{\alpha} \left(t - \Delta t \right) \right]$$
(2.16)

と定義すれば,式(2.15)より,

$$r_i^{\alpha}(t + \Delta t) = r_i^{\alpha}(t) + \Delta t v_i^{\alpha}(t) + \frac{f_i^{\alpha}(t)}{2m^{\alpha}} \left(\Delta t\right)^2$$
(2.17)

となり, これは

$$v_i^{\alpha}(t) = \frac{1}{\Delta t} \left[r_i^{\alpha}(t + \Delta t) - r_i^{\alpha}(t) \right] - \frac{f_i^{\alpha}(t)}{2m^{\alpha}} \left(\Delta t \right)$$
(2.18)

となるから,

$$v_{i}^{\alpha}(t + \Delta t) + v_{i}^{\alpha}(t) = \frac{1}{\Delta t} \left[r_{i}^{\alpha}(t + 2\Delta t) - r_{i}^{\alpha}(t) \right] - \frac{f_{i}^{\alpha}(t + \Delta t) + f_{i}^{\alpha}(t)}{2m^{\alpha}} \left(\Delta t \right)$$
$$= 2v_{i}^{\alpha}(t + \Delta t) - \frac{f_{i}^{\alpha}(t + \Delta t) + f_{i}^{\alpha}(t)}{2m^{\alpha}} \left(\Delta t \right)$$
(2.19)

となる.よって,

$$v_i^{\alpha}(t + \Delta t) = v_i^{\alpha}(t) + \frac{f_i^{\alpha}(t + \Delta t) + f_i^{\alpha}(t)}{2m^{\alpha}}(\Delta t)$$
(2.20)

となる. この式 (2.17), (2.20) を用いて時間積分を行う手法を速度 Verlet 法という. プログラム上, 式 (2.20) は

$$v_{i}^{\alpha}\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right) = v_{i}^{\alpha}\left(t\right) + \frac{f_{i}^{\alpha}\left(t\right)}{m^{\alpha}}\frac{\Delta t}{2}$$

evaluate $f_{i}^{\alpha}\left(t + \Delta t\right)$ using $\mathbf{r}\left(t + \Delta t\right)$
 $v_{i}^{\alpha}\left(t + \Delta t\right) = v_{i}^{\alpha}\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right) + \frac{f_{i}^{\alpha}\left(t + \Delta t\right)}{m^{\alpha}}\frac{\Delta t}{2}$

$$(2.21)$$

のように計算する. 速度 Verlet 法は通常の Verlet 法に比べ, 積分誤差の累積が小さく 計算が安定しやすい, 座標と同時刻の速度を追加計算する必要がない, などの利点を 持つ.

2.1.8 弾性定数の算出法

弾性定数は解析的に算出することができる.しかし,ポテンシャル関数を変更する たびに,ポテンシャル関数の2階微分に相当する数式を導出,コーディングするため には手間がかかるため,本研究では単純に平衡構造の格子マトリクスにひずみを与 え,内部構造を緩和し,そのときの圧力を求め,そこから Hooke の法則を用いて弾性 定数を求める変形テストによって弾性定数を算出している. 圧力テンソルを

| σ_x | | σ_{11} | |
|-------------|---|------------------------------|--------|
| σ_y | | σ_{22} | |
| σ_z | _ | σ_{33} | (2.22) |
| $	au_{yz}$ | | σ_{23} | |
| $	au_{zx}$ | | σ_{31} | |
| τ_{xy} | | $\left[\sigma_{12} \right]$ | |

ひずみテンソルを

г

$$\begin{bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \epsilon_z \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{zx} \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix}$$
(2.23)

とすれば、一般化された3次元における Hooke の法則は

$$\begin{bmatrix} \sigma_{x} \\ \sigma_{y} \\ \sigma_{z} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{zx} \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & C_{15} & C_{16} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} & C_{24} & C_{25} & C_{26} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} & C_{34} & C_{35} & C_{36} \\ C_{41} & C_{42} & C_{43} & C_{44} & C_{45} & C_{46} \\ C_{51} & C_{52} & C_{53} & C_{54} & C_{55} & C_{56} \\ C_{61} & C_{62} & C_{63} & C_{64} & C_{65} & C_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon_{x} \\ \epsilon_{y} \\ \epsilon_{z} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{zx} \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix}$$
(2.24)

のように表される. ここで C_{ij} は弾性定数のij成分である. このうちひずみテンソル は変形時に任意の値を与え, 圧力テンソル σ_{ij} は式 (2.12) を用いて算出することが可 能であるため、これを解けば弾性定数 C_{ii} を求めることができる.

しかしながら、この行列を解くのはやや手間がかかるため、実用的には簡単に計算 できるよう1つのひずみ成分以外をゼロにして弾性定数を求めている.

例えば, ϵ_x 以外のひずみ成分をゼロとしたならば,

| ϵ_x | | ϵ_x | |
|---------------|---|--------------|--------|
| ϵ_y | | 0 | |
| ϵ_z | _ | 0 | (2.25) |
| γ_{yz} | | 0 | (2.23) |
| γ_{zx} | | 0 | |
| γ_{xy} | | | |

となるため.

$$\begin{bmatrix} \sigma_{x} \\ \sigma_{y} \\ \sigma_{z} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{zx} \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} = \frac{1}{\epsilon_{x}} \begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{31} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} \\ C_{21} \\ C_{31} \\ C_{41} \\ C_{51} \\ C_{61} \end{bmatrix}$$
(2.26)

となり, 簡単に弾性定数 C_{i1}を求めることができる. 他の弾性定数の成分もひずみテ ンソルを*i*成分以外ゼロにすることによって求めることができる.

2.1.9 動径分布関数の算出法

動径分布関数 (Radial Distribution Function: RDF) の算出には簡易手法によって算 出する [12]. 即ち,

$$G(r) = \frac{\sum_{i} x_i x_j b_i b_j}{\{\sum_{i} x_i b_i\}} g_{ij}.$$
(2.27)

ここで, *i*, *j* は原子種, *x_i* は *i* の組成比, *g_{ij}* は *i*, *j* 間の 2 体相関関数である. *b_i* 中性子散 乱実験による RDF を算出するならは *i* の散乱長を用い, X 線回折実験による RDF を 算出するなら平均的な *i* の原子散乱因子 (有効原子散乱因子) を用いる. 原子散乱因 子は散乱ベクトルの大きさ $\sin \theta / \lambda$ によって変化するが, 本研究では有効原子散乱因 子として, $\sin \theta / \lambda = 0$ のときの原子散乱因子に相当する原子番号の値を用いている.

2.2 第一原理分子動力学法

第一原理分子動力学法 [13] は、原子の動きの度毎に電子系について密度汎関数理 論 (Density Functional Theory : DFT) に基づく第一原理バンド計算を実行し、全エネ ルギー(内部エネルギー)と原子に働く力を正確に求め、分子動力学計算や静力学 緩和計算を高精度に行う方法である.実質的には、平面波基底を用いる第一原理擬ポ テンシャル法バンド計算を高速、高効率に且つ少ないメモリで実行する計算技術であ り、電子構造計算を高効率化するテクニックと平面波基底数を減らすような効率的な 擬ポテンシャルを構築して用いるテクニックとからなる.前者のテクニックとして、 オリジナルの Car-Parrinello 法以降、共役勾配法など新たな方法が提案されており、大 規模構造や金属的な系についてはそれらが用いられることが多くなっている.本研 究においても擬ポテンシャル法による平面波密度汎関数法によって第一原理計算を 行っている.本章では密度汎関数理論による平面波擬ポテンシャル法を用いた第一 原理分子動力学の枠組みについて説明する.

2.2.1 Born-Oppenheimer 近似

電子の質量が原子核に比べ充分小さいため、原子核の運動に対して瞬時にその原 子配置に対する最安定構造を取ることができるとした近似がBorn-Oppenheimer近似 (断熱近似)である.系に対して、このBorn-Oppenhaimer近似を行う.これによって、原 子の力学と電子の力学とを分離して、個別に計算できるようになる.

2.2.2 密度汎関数理論とバンド計算

まず現在の原子の位置に対する電子状態を密度汎関数理論を用いて計算すること になる. 密度汎関数法とは以下のように基底状態の電子状態を求める手法である.電子密度分布 $\rho(\mathbf{r})$ の汎関数として,多電子系の基底状態の全エネルギー $E_{tot}[\rho]$ が以下のように一意的に与えられる.

$$E_{tot}[\rho] = \int V(\boldsymbol{r}) \,\rho(\boldsymbol{r}) \,d\boldsymbol{r}^3 + T[\rho] + \frac{e^2}{2} \int \int \frac{\rho(\boldsymbol{r}\boldsymbol{\prime}) \,\rho(\boldsymbol{r})}{\boldsymbol{r}^{\prime} - \boldsymbol{r}} d\boldsymbol{r}^{\prime 3} d\boldsymbol{r}^3 + E_{xc}[\rho] \,(2.28)$$

第2項は ρ を与えるような一電子近似の電子系の運動エネルギー,第3項は電子間静 電相互作用,第4項は全ての電子間多体相互作用を含む交換相関エネルギー項である.

この $E_{tot} \left[\rho \right]$ を $\rho \left(\boldsymbol{r} \right)$ について変分することにより, 以下の Kohn-Sham 方程式が求められる.

$$\left[-\left(\frac{\hbar^2}{2m}\right)\nabla^2 + V_{eff}\left(\boldsymbol{r}\right)\right]\psi_i\left(\boldsymbol{r}\right) = E_i\psi_i\left(\boldsymbol{r}\right)$$
(2.29)

$$V_{eff}(\boldsymbol{r}) = V(\boldsymbol{r}) + V_{H}(\boldsymbol{r}) + \mu_{xc}(\boldsymbol{r})$$
(2.30)

$$V_{H}(\boldsymbol{r}) = \int \frac{e^{2}\rho(\boldsymbol{r'})}{|\boldsymbol{r'} - \boldsymbol{r}|} d\boldsymbol{r'}$$
(2.31)

$$\mu_{xc}\left(\boldsymbol{r}\right) = \frac{\delta E_{xc}\left[\rho\right]}{\delta\rho} \tag{2.32}$$

この Kohn-Sham 方程式は一電子 Schrödinger 方程式であり、これによって多電子問題 を解決できる. Kohn-Sham 方程式を自己無撞着に解くことによって、波動関数を求め ることができる. そして、波動関数から以下のように電子密度 ρ が求められる.

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{i}^{occ} |\psi_i(\mathbf{r})|^2$$
(2.33)

しかし,交換相関エネルギーと交換相関ポテンシャルの正確な形がわからない.ここで,局所密度近似(LDA)により,一様電子ガスの交換相関エネルギー密度 *ε_{xc}*を用いて,

$$E_{xc}\left[\rho\left(\boldsymbol{r}\right)\right] = \int \epsilon_{xc}\left(\boldsymbol{r}\right)\rho\left(\boldsymbol{r}\right)d\boldsymbol{r}^{3}$$
(2.34)

$$\mu_{xc}(\mathbf{r}) = \epsilon_{xc}(\mathbf{r}) + \rho(\mathbf{r}) \frac{\delta \epsilon_{xc}}{\delta \rho}$$
(2.35)

と表せる.また,一般化密度勾配近似 (GGA) を用いると, $f_{xc}(\rho, \nabla \rho)$ を一様な電子密度に密度勾配を考慮した補正を施した関数として,

$$E_{x}c\left[\rho\left(\boldsymbol{r}\right)\right] = \int f_{xc}\left(\rho,\nabla\rho\right)d\boldsymbol{r}^{3}$$
(2.36)

$$\mu_{xc}(\mathbf{r}) = \frac{\partial f_{xc}}{\partial \rho} - \nabla \cdot \frac{\partial f_{xc}}{\partial \nabla \rho}$$
(2.37)

となる.

2.2.3 平面波擬ポテンシャル法

kohn-sham 方程式においては価電子のみを解き, 内殻の効果を価電子のハミルトニ アンと擬ポテンシャルを平面波基底で展開を行う. 擬ポテンシャルとは, 電子が感じ る screen された有効ポテンシャルのことであり, 計算に用いる平面波基底を減らすた めにこれを設定したカットオフ距離以内ではポテンシャルを浅く滑らかにする. カッ トオフ距離以内での擬波動関数のノルムを保存するようにしたノルム保存擬ポテン シャルやさらにソフトネスを高めたウルトラソフト型擬ポテンシャルなどがある. 平面波基底系を以下のように取る.

$$|\mathbf{k} + \mathbf{G}\rangle = \Omega^{-\frac{1}{2}} \exp\left[i\left(\mathbf{k} + \mathbf{G}\right)\right]$$
(2.38)

ここで, Ω は結晶全体の体積, G は逆格子ベクトル, k は Brillouin ゾーン内の波数ベクトルである.

また,結晶系では一般に以下の式が成立する.

$$\Omega^{-1} \int \exp\left[i\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}\right] d\boldsymbol{r}^3 = \delta_{\boldsymbol{G},\boldsymbol{0}}$$
(2.39)

さらに、ブラーベクトルとケットベクトルの内積は以下のように表される.

$$\langle \phi | \psi \rangle = \int \phi^*(\mathbf{r}) \psi(\mathbf{r}) d\mathbf{r}^3$$
(2.40)

よって,式(2.38),(2.39),(2.40)より

$$\langle \boldsymbol{k} + \boldsymbol{G} \mid \boldsymbol{k} + \boldsymbol{G'} \rangle = \int \left(\Omega^{-\frac{1}{2}} \exp\left[i\left(\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G}\right)\right] \right)^* \Omega^{-\frac{1}{2}} \exp\left[i\left(\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G}\right)\right] d\boldsymbol{r}^3$$

$$= \Omega^{-1} \int \exp\left[-i\left(\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G}\right)\right] \exp\left[i\left(\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G}\right)\right] d\boldsymbol{r}^3$$

$$= \Omega^{-1} \int \exp\left[i\left(\boldsymbol{G'} - \boldsymbol{G}\right)\right] d\boldsymbol{r}^3$$

$$= \delta_{\left(\boldsymbol{G'} - \boldsymbol{G}\right), \boldsymbol{0}$$

$$= \delta_{\boldsymbol{G}, \boldsymbol{G'}}$$

$$(2.41)$$

のように規格化直交系である.

よって、kohn-sham 方程式の運動エネルギーの項の行列要素 $\left\langle \mathbf{k} + \mathbf{G} \mid -\left(\frac{\hbar^2}{2m}\right) \nabla^2 \mid \mathbf{k} + \mathbf{G'} \right\rangle$ は以下のようになる.式 (2.38), (2.39) より

$$\left\langle \mathbf{k} + \mathbf{G} \right| - \left(\frac{\hbar^2}{2m}\right) \nabla^2 \left| \mathbf{k} + \mathbf{G'} \right\rangle$$

$$= \int \left(\Omega^{-\frac{1}{2}} \exp\left[i\left(\mathbf{k} + \mathbf{G}\right) \cdot \mathbf{r}\right] \right)^* \left[- \left(\frac{\hbar^2}{2m}\right) \nabla^2 \right] \Omega^{-\frac{1}{2}} \exp\left[i\left(\mathbf{k} + \mathbf{G'}\right) \cdot \mathbf{r}\right] d\mathbf{r}^3$$

$$= \Omega^{-1} \int \exp\left[-i\left(\mathbf{k} + \mathbf{G}\right) \cdot \mathbf{r}\right] \left[- \left(\frac{\hbar^2}{2m}\right) \nabla^2 \right] \exp\left[i\left(\mathbf{k} + \mathbf{G'}\right) \cdot \mathbf{r}\right] d\mathbf{r}^3$$

$$= \Omega^{-1} \int \exp\left[-i\left(\mathbf{k} + \mathbf{G}\right) \cdot \mathbf{r}\right] \left\{ -\left(\frac{\hbar^{2}}{2m}\right) \right\} \left\{ i^{2} | \mathbf{k} + \mathbf{G}' |^{2} \right\} \exp\left[i\left(\mathbf{k} + \mathbf{G}'\right) \cdot \mathbf{r}\right] d\mathbf{r}^{3}$$

$$= \Omega^{-1} \left(\frac{\hbar^{2}}{2m}\right) | \mathbf{k} + \mathbf{G}' |^{2} \int \exp\left[-i\left(\mathbf{k} + \mathbf{G}\right) \cdot \mathbf{r}\right] \exp\left[i\left(\mathbf{k} + \mathbf{G}'\right) \cdot \mathbf{r}\right] d\mathbf{r}^{3}$$

$$= \Omega^{-1} \left(\frac{\hbar^{2}}{2m}\right) | \mathbf{k} + \mathbf{G}' |^{2} \delta_{\mathbf{G},\mathbf{G}'}$$

$$= \left(\frac{\hbar^{2}}{2m}\right) | \mathbf{k} + \mathbf{G}' |^{2} \delta_{\mathbf{G},\mathbf{G}'}$$

$$= \left(\frac{\hbar^{2}}{2m}\right) | \mathbf{k} + \mathbf{G}' |^{2} \delta_{\mathbf{G},\mathbf{G}'}$$

$$(2.42)$$

次にポテンシャル成分について考える.式(2.30)におけるV(r)成分は外場の影響 がないとすれば,擬ポテンシャル $V^{PS}(r)$ である.a原子の擬ポテンシャルが局所成 分 $V_a^L(r)$ (全体に渡って作用するポテンシャル)と非局所成分 $\sum_l P_l^+ V_{a,l}^{NL}(r) P_l$ (但し P_l はa原子を中心として1の軌道角運動量を持つ波成分への射影演算子,カットオフ 距離内のみでのポテンシャル)から成るとする.よって,系全体の擬ポテンシャルは 系全体の局所成分の和 $V_L(r)$ と非局所成分の和 $V_{NL}(r)$ とに分けることができる.

$$V(\boldsymbol{r}) = V_L(\boldsymbol{r}) + V_{NL}(\boldsymbol{r})$$
(2.43)

系全体の局所成分の和 $V_L(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{R}} \sum_{\mathbf{t}_a} V_a^L(\mathbf{r} - \mathbf{R} - \mathbf{t}_a)$ (\mathbf{t}_a はa原子の位置ベクトル, \mathbf{R} はセルの並進ベクトル)は式の形から明らかに格子周期関数であり, 一般に格子周期関数 $u(\mathbf{r})$ (格子ベクトル \mathbf{R} に対して, $u(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = u(\mathbf{r})$)は逆格子ベクトル \mathbf{G} のフーリエ級数によって以下のように展開可能であるから,

$$u(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{G}} u(\mathbf{G}) \exp\left[i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}\right]$$
(2.44)

但し,

$$u(\boldsymbol{G}) = \Omega^{-1} \int u(\boldsymbol{r}) \exp\left[-i\boldsymbol{G} \cdot \boldsymbol{r}\right] d\boldsymbol{r}^{3}$$
(2.45)

よって, $V_L(r)$ も以下のようにフーリエ級数で展開することができる.

$$V_L(\boldsymbol{r}) = \sum_{\boldsymbol{G}} V_L(\boldsymbol{G}) \exp(i\boldsymbol{G} \cdot \boldsymbol{r})$$
(2.46)

$$V_L(\boldsymbol{G}) = \Omega^{-1} \int V_L(\boldsymbol{r}) \exp(-i\boldsymbol{G} \cdot \boldsymbol{r}) d\boldsymbol{r}$$
(2.47)

$$= \Omega^{-1} \sum_{\boldsymbol{R}} \sum_{\boldsymbol{t}_{\boldsymbol{a}}} \int V_{\boldsymbol{a}}^{L} (\boldsymbol{r} - \boldsymbol{R} - \boldsymbol{t}_{\boldsymbol{a}}) \exp(-i\boldsymbol{G} \cdot \boldsymbol{r}) d\boldsymbol{r}$$
(2.48)

$$= \Omega^{-1} \sum_{\boldsymbol{R}} \sum_{\boldsymbol{t}_{\boldsymbol{a}}} \int V_{\boldsymbol{a}}^{L} (\boldsymbol{r} - \boldsymbol{R} - \boldsymbol{t}_{\boldsymbol{a}}) \exp\left(-i\boldsymbol{G} \cdot (\boldsymbol{r} - \boldsymbol{R} - \boldsymbol{t}_{\boldsymbol{a}})\right) d\boldsymbol{r} \quad (2.49)$$

$$= \Omega_c^{-1} \sum_{\boldsymbol{t}_a} V_a^L(\boldsymbol{G}) \exp\left(-i\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}\right)$$
(2.50)

$$V_a^L(\boldsymbol{G}) = \int V_a^L(\boldsymbol{r}) exp(-i\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}) d\boldsymbol{r}$$
(2.51)

ここで、 Ω_c は結晶全体の体積はユニットセルの体積である.よって、 $V_L(r)$ に<k+G|と|k+G'>を作用させると、

$$\langle \mathbf{k} + \mathbf{G} | V^{L}(\mathbf{r}) | \mathbf{k} + \mathbf{G}' \rangle$$

$$= \left\langle \mathbf{k} + \mathbf{G} \right| \sum_{\mathbf{G}} V^{L}(\mathbf{G}) \exp [i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}] \left| \mathbf{k} + \mathbf{G}' \right\rangle$$

$$= \int \left(\Omega^{-\frac{1}{2}} \exp [i(\mathbf{k} + \mathbf{G}) \cdot \mathbf{r}] \right)^{*} \sum_{\mathbf{G}''} V^{L}(\mathbf{G''}) \exp [i\mathbf{G''} \cdot \mathbf{r}] \Omega^{-\frac{1}{2}} \exp [i(\mathbf{k} + \mathbf{G}') \cdot \mathbf{r}] d\mathbf{r}^{3}$$

$$= \Omega^{-1} \int \exp \left[-i(\mathbf{k} + \mathbf{G}) \cdot \mathbf{r} \right] \sum_{\mathbf{G}''} V^{L}(\mathbf{G''}) \exp \left[i\mathbf{G''} \cdot \mathbf{r} \right] \exp \left[i(\mathbf{k} + \mathbf{G'}) \cdot \mathbf{r} \right] d\mathbf{r}^{3}$$

$$= \sum_{\mathbf{G}''} V^{L}(\mathbf{G''}) \Omega^{-1} \int \exp \left[i(\mathbf{G'} + \mathbf{G''} - \mathbf{G}) \cdot \mathbf{r} \right] d\mathbf{r}^{3}$$

$$= \sum_{\mathbf{G}''} V^{L}(\mathbf{G''}) \delta_{\left(\mathbf{G'} + \mathbf{G''} - \mathbf{G}\right), \mathbf{0}$$

$$= \sum_{\mathbf{G}''} V^{L}(\mathbf{G''}) \delta_{\mathbf{G}'', \left(\mathbf{G} - \mathbf{G}'\right)}$$

$$= V(\mathbf{G} - \mathbf{G'})$$

$$(2.53)$$

となる.

よって、Kohn-Sham 方程式のハミルトニアンの各成分は以下のようになる.

$$\langle \boldsymbol{k} + \boldsymbol{G} | \mathcal{H} | \boldsymbol{k} + \boldsymbol{G'} \rangle$$

$$= \left(\frac{\hbar^2}{2m} \right) | \boldsymbol{k} + \boldsymbol{G'} |^2 \delta_{\boldsymbol{G}, \boldsymbol{G'}} + V_L (\boldsymbol{G} - \boldsymbol{G'})$$

$$+ V_{NL} (\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G}, \boldsymbol{k} + \boldsymbol{G'}) + V_H (\boldsymbol{G} - \boldsymbol{G'}) + \mu_{xc} (\boldsymbol{G} - \boldsymbol{G'})$$
(2.55)

ここで, V_H は静電ポテンシャルであり,

$$V_{H}\left(\boldsymbol{G}\right) = \frac{8\pi\rho\left(\boldsymbol{G}\right)}{\left|\boldsymbol{G}\right|^{2}} \tag{2.56}$$

となる. この行列のn番目の固有値 E_{k^n} とこれに属する固有ベクトル C_{k+G}^n を求めれば, 固有関数 $\psi_{kn}(r)$ は以下のようになる.

$$\psi_{kn}\left(\boldsymbol{r}\right) = \sum_{\boldsymbol{G}} C_{\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G}}^{n} |\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G}\rangle$$
(2.57)

... D 7

固有値 E_{k_n} は即ちエネルギを表すから,電子を低エネルギの状態からスピンを含めて2電子ずつ詰めて行く.よって,電子密度分布は以下のようになる.

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{n}^{occ} \sum_{\mathbf{k}}^{B.Z.} |\psi_{kn}(\mathbf{r})|^{2}$$

=
$$\sum_{n}^{occ} \sum_{\mathbf{k}}^{B.Z.} \sum_{\mathbf{G}} \sum_{\mathbf{G}'} C_{\mathbf{k}+\mathbf{G}}^{n} C_{\mathbf{k}+\mathbf{G}'}^{n} \Omega^{-1} exp\left[i\left(\mathbf{G}-\mathbf{G'}\cdot\mathbf{r}\right)\right]$$
(2.58)

この求まった電子密度が入力に使用した電子密度と等しければ、自己無撞着に解けたことになる. 等しくなければ、この求まった電子密度を用いて新たな電子密度、例えば $\rho_{new} = (1 - \alpha) \rho_{in} + \alpha \rho_{out}$ を再度入力として電子密度を計算し、入力の電子密度と出力の電子密度が等しくなるまで計算を行う. しかし、このように行列を解くとN³ オーダの計算量が必要となってしまう.

2.2.4 波動関数の仮想的な運動方程式から電子状態を解く手法

前節のように、Kohn-Sham 方程式を平面波展開して行列を対角化して解くには、N³ オーダの計算量が必要となる.ところが、波動関数に関しての仮想的な運動方程式か ら電子状態を解く手法を用いれば、計算量を最大 *NlogN* まで減らすことができる. この考え方を用いた手法を統べて、広義に Car-Parrrinello 法と呼ぶ.この手法には狭 義の Car-Parrrinello 法、最急降下法、共役勾配法などがある.

まず、 $\{\psi_i\}$ の規格化条件付きの最小化を Lagrange の未定定数法を使うと以下のようになる.

$$\tilde{E}_{tot} = E_{tot} - \sum_{ij} \lambda_{ij} \left(\langle \psi_i | \psi_j \rangle - \delta_{ij} \right)$$
(2.59)

これの変分は以下のようになる.

$$\frac{\partial \tilde{E}_{tot}}{\psi_i^*} = \frac{\partial E_{tot}}{\psi_i^*} \psi_i - \lambda \psi_i = [H - \lambda] \psi_i \qquad (2.60)$$
$$(\lambda = \langle \psi_i | H | \psi_i \rangle)$$

この $-[H - \lambda] \psi_i$ を波動関数の 2 階微分 (波動関数に働く力) としたのが狭義の Car-Parrrinello 法である. 解く方程式は μ を波動関数の仮想的な質量として, 以下の ようになる.

$$\mu \bar{\psi}_i = -\left[H - \lambda\right] \psi_i \tag{2.61}$$

この $-[H - \lambda] \psi_i$ を波動関数の 1 階微分 (波動関数の速度) としたのが最急降下法法 である. 解く方程式は以下のようになる.

$$\mu\psi_i = -\left[H - \lambda\right]\psi_i \tag{2.62}$$

この $- [H - \lambda] \psi_i$ と共役勾配方向に波動関数を変化させるのが共役勾配法である. 最 急降下法よりも早く収束する.

 ψ_i をこれらの運動方程式または共役勾配法に従って変化させて行き,最終的に $-\frac{\partial \tilde{E}_{tot}}{\psi_i^*} = -[H - \lambda] \psi_i = 0$ を満たす ψ_i が求まる.これは $H\psi_i = \lambda \psi_i$ であり, Kohn-Sham 方程式を解くのと同等である.

2.3 数值最適化手法

ポテンシャル合わせ込みの作業は、ポテンシャルパラメータをベクトルの要素と し、ポテンシャルパラメータセットをベクトルとするベクトル空間において、合わせ 込みに用いる物性の値とベクトル空間における点に対応するポテンシャルパラメー タセットを用いて算出された物性の値の差を最小化する多次元最適化問題に帰着す る. また、ポテンシャル合わせ込みにおいては、平衡構造の物性を合わせ込むという ことが重要となるが、その際にも構造最適化が必要になる. このようにポテンシャル 合わせ込みには2重に数値最適化が行われる. このため、本章ではまず本研究で用い る数値最適化手法について説明を行う.

2.3.1 数値最適化問題の定義

一般に最適化問題は次のように表現することができる [14]. n 次元ベクトル x を引数とした目的関数 f(x) を l 個の不等式制約条件,

$$g_i\left(\boldsymbol{x}\right) \le 0, i = 1, \dots, l,\tag{2.63}$$

m 個の等式制約条件,

$$h_i(\boldsymbol{x}) = 0, i = 1, \dots, m$$
 (2.64)

のもとで最小化する x* を求める問題となる.

まず, l = 0, m = 0 の場合, つまり, 不等式制約条件, 等式制約条件のない場合の最 適化手法について説明を行う.

2.3.2 制約条件のない1次元数値最適化手法

n = 1のとき、つまり、1次元における数値最適化手法を別名、直線探索とも言う. 様々な直線探索手法が提案されているが、本研究では収束性の良いBrentの方法[15] を専ら用いるため、これについて説明を行う.また、最も代表的な直線探索手法で、 Brentの方法の一部を担う黄金分割法[15]についても説明を行う.

黄金分割法

1次元の x を引数とする関数 f(x) を最小化する問題を考える. a < b < c なるa, b, cについて, f(a) > f(b) かつ f(c) > f(b) であるとする. まず, a, c 区間内に新たな点 x を取る. この x が a < x < b のとき, f(x) < f(b) であれば, x を新たなb, b を新たな c として更新し, f(x) > f(b) であれば, x を新たな a として更新する. x がb < x < cのとき, f(x) < f(b) であれば, x を新たなb, b を新たなa として更新し, f(x) > f(b)であれば, x を新たな c として更新する. この新たな点 x を取るステップを繰り返し, a,c 間の最小点を探索することができる. この新たな x の取り方を効率的に行う手法 が黄金分割法である. まず, b は a から右に c - a の W 倍だけ進んだ点とする. すな わち,

$$\frac{b-a}{c-a} = W, \frac{c-b}{c-a} = 1 - W$$
(2.65)

また新たな点xはbから右にc - aのZ倍だけ進んだ点である, つまり,

$$\frac{x-b}{c-a} = Z \tag{2.66}$$

であるとする. すると, x がb < x < cのとき, 次のステップの区間がa からxとなる 場合, そのステップ幅が現在のステップのW + Z 倍となり, 次のステップの区間がbからcとなる場合, そのステップ幅が現在のステップの1 - W 倍となる. 最悪の場合 の区間幅を最小にするためには, これらが等しくなるようにするためには,

$$W + Z = 1 - W \tag{2.67}$$

なればよい. また, この x が a < x < bのとき, 次のステップの区間が a から bとなる 場合, そのステップ幅が現在のステップの W 倍となり, 次のステップの区間が x から cとなる場合, そのステップ幅が現在のステップの 1 - W - Z 倍となる. 最悪の場合 の区間幅を最小にするためには, これらが等しくなるようにするためには,

W = 1 - W - Z

(2.68)

となればよい. 式 (2.67) と式 (2.68) は等価であり, *b* < *x* < *c*, *a* < *x* < *b* のどちらで あっても, つまり,

$$Z = 1 - 2W \tag{2.69}$$

であれば、最悪の場合の区間幅は最小になる. ここで、W < 0.5のとき、Z > 0となり、 W > 0.5のとき、Z < 0となる. 言い換えれば、W < 0.5のとき、xは (b, c)間, W > 0.5のとき、xは (a, b)間に入ることになる. このとき、

$$\frac{x-b}{c-a} = 1 - 2\frac{b-a}{c-a}$$
(2.70)

$$\begin{array}{rcl} b-a &=& c-x & (2.71) \\ \frac{a+c}{2}-b &=& x-\frac{a+c}{2} & (2.72) \end{array}$$

となり,新しい点 *x* は (*a*, *c*)内で *b* と対称な位置に来る. つまり, *x* は (*a*, *c*), (*b*, *c*) のう ち幅に広い方に入る.

つまり,現在のステップはW < 0.5なら,幅1 - Wの区間の左からW: 1 - 2Wもしくは1 - 2W: Wの位置に新たなbを決定するステップとなる.ここで、 $W > \frac{1}{3}$ なら広い方の幅がW,狭いほうの幅が1 - 2Wとなるが、 $W < \frac{1}{3}$ なら広い方の幅が1 - 2W,狭いほうの幅がWとなる.このとき、前のステップでも同様の作業をしていたと考えると、前のステップは幅1の区間を、広いほうの幅を1 - W、狭いほうの幅をWとする点にbを決定していたと考えられる.このため、前のステップと今回のステップが相似的であるとすれば、狭いほうの幅の比率を考えて、 $W > \frac{1}{3}$ なら、 $\frac{W}{1-W} = W W < \frac{1}{3}$ なら、 $\frac{1-2W}{1-W} = W$,となるが、前者の場合W = 0となってしまうから、 $\frac{1-2W}{1-W} = W$ となるため、

$$W^2 - 3W + 1 = 0 (2.73)$$

$$W = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} = 0.38197, 0.3333 < 0.38197 < 0.5$$
(2.74)

となり, $W < \frac{1}{3}$ を満たす. また, W > 0.5なら, 幅Wの区間の左から1-W:-1+2Wもしくは-1+2W:1-Wの位置に新たなbを決定するステップとなる. ここで, $W > \frac{2}{3}$ なら広い方の幅が-1+2W, 狭いほうの幅が1-Wとなるが, $W < \frac{2}{3}$ なら 広い方の幅が1-W, 狭いほうの幅が-1+2Wとなる. このとき, 前のステップでも 同様の作業をしていたと考えると, 前のステップは幅1の区間の左からW:1-Wの点にbを決定するステップであったといえる. このため, 前のステップと今回のス テップが相似的であるとすれば, 広いほうの幅を考えて, $W > \frac{2}{3}$ なら, $\frac{-1+2W}{W} = W$, $W < \frac{2}{3}$ なら, $\frac{1-W}{W} = W$ となるが, 前者の場合W = 1となってしまうから, $\frac{1-W}{W} = W$ となるため,

$$W^2 + W - 1 = 0 \tag{2.75}$$

$$W = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} = 1 - 0.38197 = 0.666667 > 1 - 0.38197 > 0.5$$
(2.76)

となり, $W < \frac{2}{3}$ を満たす.

結局, x は W < 0.5 なら, (a, c), (b, c) のうち幅に広いほうの区間 (b, c) を $1 - 2 \times 0.38197 : 0.38197$ に分割した点となり, W > 0.5 なら, (a, c), (b, c) のうち幅に広いほうの区間 (a, b) を $0.38197 : 1 - 2 \times 0.38197$ に分割した点となる. この 2 つは, 「3 点 a, b, c が与えられたとき, 点 b から区間の幅が広いほうへ ac 間の幅の $1 - 2 \times 0.38197$ 倍だけ進んだほうに, 新たな点 x を取る」というルールに統一できる.

もし,最初に与えられた3点が0.38197:1-0.38197,もしくは1-0.38197:0.38197 になっていなくとも、この分割作業を繰り返せば、次第に0.38197:1-0.38197,もし くは0.38197:0.38197に収束する、収束の速度は有効桁数が関数のの評価回数の1次 関数として増える1次収束である.

Brentの方法

[15] Brent の方法は放物線補間と黄金分割法を併用する手法である.まず, 放物線 補間について説明する.3点 f(a), f(b), f(c)を通る放物線の極小の x 座標を求める には

$$x = b - \frac{1}{2} \frac{(b-a)^2 \left[f(b) - f(c)\right] - (b-c)^2 \left[f(b) - f(a)\right]}{(b-a) \left[f(b) - f(c)\right] - (b-c) \left[f(b) - f(a)\right]}$$
(2.77)

とすればよい. しかしながら, x は区間 (a, c) 外となることもあり, 無条件に使えるわ けではない.このため、この補間が有効でありそうな場合は、この補間を用い、そう でない場合は黄金分割法を用いる手法である Brent の方法が提案されている. この Brentの方法においては6点a,b,u,v,x,wを更新していくアルゴリズムを用いる.こ れらの点については、それぞれ区間 (a, b) 間に極小点があるような点 a, b, (a, b) 内に ある現在までの最小値を与える点x, xの次に小さい関数値を与える点w, 1つ前のwの値である点 v, 関数を評価した最も新しい点 u とする. まず, 点 u, v, w を放物線補 間して得られた極小が (a, b) 間にあるかチェックする. もしなければ, a, x, b に黄金分 割法を行う.極小が(a,b)間にあった場合に,前回のステップで黄金分割法を用いて いたならば、今回の放物線補間のxの更新幅が前回の黄金分割法の|a-x|, |b-x|の うち幅の広い方の半分よりも大きければ黄金分割法を行い、小さければ放物線補間 を行う. 極小が (a, b) 間にあった場合に、前回のステップで放物線補間を用いていた ならば、今回の放物線補間のxの更新幅が前々回のステップのxの更新幅の半分より も大きけれは黄金分割法を行い、小さければ放物線補間を行う.このように黄金分割 法もしくは放物線補間によって、新たな評価点 *u* を更新し、*a*、*b*、*x*、*w*、*v*、*u* を条件に合 うように更新する.前回、もしくは前々回の更新幅に関する値との比較は、xを振動を 防ぎ、収束させるための条件で、経験的なものである、実際にはもう少し細かい条件 判定をしている部分もあるが、大まかなアルゴリズムは述べた通りである.

2.3.3 制約条件のない多次元数値最適化手法

n > 1のときの数値最適化手法について説明を行う. 制約条件のない多次元数値 最適化手法には多くの手法が提案されている. 代表的なものとしては最急降下法,共 役勾配法,準ニュートン法,シミュレイティドアニーリング法,遺伝的アルゴリズム (Genetic Algorithms) などが挙げられる. 最急降下法,共役勾配法,準ニュートン法は 出発点近くの極小解を厳密に求めていく手法である. 本研究でこのような目的の数 値最適化を行う場合には,最急降下法に比べて収束性が保証されており,準ニュート ン法よりも手間のかからない手法である共役勾配法を用いている. このため,本節で は共役勾配法とこれを単純にした最急降下法について説明を行う. 準ニュートン法 については他の文献を参照していただきたい [15]. シミュレイティドアニーリング 法と遺伝的アルゴリズムは,局所安定点から抜け出せるという特徴を持つために多 峰性のあるような複雑な目的関数において、大域的最適解を発見しやすい手法(大域 的探索手法)である.本研究でこのような目的の数値最適化を行う場合には、多点か らスタートできるために、より大域的最適解を探しやすい手法となっている遺伝的ア ルゴリズム、特に多次元数値最適化手法と簡単に結びつけることのできる実数遺伝 的アルゴリズムを用いる.シミュレイティッドアニーリング法については他の文献を 参照[15]していただきたい.

最急降下法

最急降下法は反復法に基づく数値最適化手法である.まず,反復法の基本的なアル ゴリズムについて説明する.具体的な手順は

- 1. 初期ベクトル x_0 からスタートする. k = 0とする.
- 2. 停止条件が満たされていれば, x_k を解とみなす. さもなければ次のステップへ行く.
- 3. 探索方向 *d*_k を決定する.

4. d_k 方向の刻み幅 α_k を求める.

- 5. $\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{x}_k + \alpha_k \boldsymbol{d}_k$
- 6. k = k + 1とおいて1ステップ目に戻る.

となる. d_k 方向の刻み幅 α_k を求めるステップでは 2.3.2 節で説明した黄金分割法や Brent の方法などの直線探索手法を用いる. 反復法を特徴的にしているのは, 探索方向 d_k の決め方であり, 最急降下法とは単純にもっとも目的関数の値を減少させられる と思われる勾配方向 $d_k = -\nabla f(x_k) = -\frac{\partial f(x)}{\partial x}|_{x=x_k}$ に探索方向をとる手法である.

共役勾配法

まず,本章で説明する共役勾配法のために共役性について説明する.正定値対称行列A、ゼロでない2つのベクトルu,vに対して,

$$\boldsymbol{u}^T \boldsymbol{A} \boldsymbol{v} = 0 \tag{2.78}$$

が成立するとき, u, v は A に関して, 共役であるという.

十分に滑らかな関数 f(x) は最適解 x^* のまわりで

$$f(\boldsymbol{x}) \approx \frac{1}{2} (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*)^T \nabla^2 f(\boldsymbol{x}^*) (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*) + \nabla f(\boldsymbol{x}^*)^T (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*) + f(\boldsymbol{x}^*) (2.79)$$

= $q(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{2} \boldsymbol{x}^T \boldsymbol{G} \boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}^T \boldsymbol{x} + \boldsymbol{c}$ (2.80)

のように 2 次関数に近似して Tayler 展開することができる. ここで, *G* は *n* 次の正定 値対称行列, *c* は *n* 次元ベクトルである. また, この *q*(*x*) の勾配は

$$abla q\left(oldsymbol{x}
ight)=oldsymbol{G}oldsymbol{x}+oldsymbol{b}$$

となる. この係数行列 *G* に関して互いに共役な方向ベクトルが生成することがで きれば有限回の手順で最適解に到達することが以下の定理によって保証されること が知られている. 即ち, $q(x) = \frac{1}{2}x^TGx + b^Tx + c$ としたときに, *n* 個のベクトル s_0, \ldots, s_{n-1} が*G* に関して共役であるとする. このとき, 任意の点 x_0 から出発して,

$$q\left(\boldsymbol{x}_{k}+\alpha_{k}\boldsymbol{s}_{k}\right)=\min\left\{q\left(\boldsymbol{x}_{k}+\alpha\boldsymbol{s}_{k}\right)\right\}$$
(2.82)

$$\boldsymbol{x}_k = \boldsymbol{x}_k + \alpha_k \boldsymbol{s}_k, k = 0, \dots, n-1$$
(2.83)

(2.81)

とすれば, x_n が q(x) の最適解になるという定理である. 最急降下法は単純でわかり やすい方法ではあるが, 定数回で収束する保証がなく, 共役なベクトルを用いる手法 は高々n回の探索で解に収束するため, 優れている手法であるといえる. 共役方向の生 成手法がいくつか存在するが, 目的関数を 2 次関数で近似できると仮定して, $\nabla q(x)$ を利用することによって共役方向を作って最適解を求める手法を, 総じて共役勾配法 という.

2次関数の場合は Gram-Schmidt の方法を用いて, 正確に共役勾配方向を生成する ことができる. $G \in n \times n$ 正定値対称行列, g_0 を任意のベクトルとし, $h_0 = g_0$ と置 く. i = 0, 1, ... について次の2系列のベクトルを定義する.

$$\boldsymbol{g}_{i+1} = \boldsymbol{g}_i - \lambda_i \boldsymbol{G} \boldsymbol{h}_i \tag{2.84}$$

$$\boldsymbol{h}_{i+1} = \boldsymbol{g}_{i+1} + \gamma_i \boldsymbol{h}_i \tag{2.85}$$

ここで λ_i, γ_i は $g_{i+1}^T g_i = 0, h_{i+1}^T G h_i = 0$ を満たすように選ぶ. 即ち,

$$\lambda_i = \frac{\boldsymbol{g}_i^T \boldsymbol{g}_i}{\boldsymbol{g}_i^T \boldsymbol{G} \boldsymbol{h}_i} \tag{2.86}$$

$$\gamma_i = -\frac{\boldsymbol{g}_{i+1}^T \boldsymbol{G} \boldsymbol{h}_i}{\boldsymbol{h}_i^T \boldsymbol{G} \boldsymbol{h}_i}$$
(2.87)

とする. このとき, すべての $i \neq j$ について次式が成り立つ.

 $\boldsymbol{g_i}^T \boldsymbol{g_j} = \boldsymbol{0} \tag{2.88}$

$$\boldsymbol{h_i}^T \boldsymbol{G} \boldsymbol{h_j} = \boldsymbol{0} \tag{2.89}$$

これらは以下のように証明できる.

 $i, j \leq k, i \neq j$ に対して、式 (2.88) が成立するとすれば、常に $g_{i+1}^T g_i = 0$ より、 $g_{k+1}^T g_k = 0$ となるから、 $i, j \leq k+1, i \neq j$ に対して、式 (2.88) が成立する. ここで、 k = 1のとき、 $g_1^T g_0 = 0$ より、式 (2.88) が成立するから、式 (2.88) は帰納的に証明された. $i, j \leq k, i \neq j$ に対して、式 (2.89) が成立するとすれば、常に $h_{i+1}{}^{T}Gh_{i} = 0$ より、 $h_{k+1}^{T}Gh_{k} = 0$ となるから、 $i, j \leq k+1, i \neq j$ に対して、式 (2.89) が成立する. ここで、 k = 1のとき、 $h_{1}^{T}Gh_{0} = 0$ より、式 (2.89) が成立するから、式 (2.89) は帰納的に証明 された.

また,

$$\boldsymbol{h}_{n} = \boldsymbol{g}_{n} + \gamma_{n-1}\boldsymbol{h}_{n-1}$$

$$= \boldsymbol{g}_{n} + \gamma_{n-1} \left(\boldsymbol{g}_{n-1} + \gamma_{n-2}\boldsymbol{h}_{n-2} \right)$$

$$\cdots$$

$$= a_{0}\boldsymbol{h}_{0} + \sum_{i=1}^{n} a_{i}\boldsymbol{g}_{i}$$

$$= \sum_{i=0}^{n} a_{i}\boldsymbol{g}_{i}$$
(2.90)

となる. ここで a_i は g_i の実数の係数である. よって, 式 (2.88) より

$$\boldsymbol{g}_{n+1}^{T}\boldsymbol{h}_{n} = 0 \tag{2.91}$$

となる.

式 (2.88), 式 (2.89) が成立するとき, 式 (2.84), 式 (2.85) から, λ_i , γ_i を次のように変換することができる.

$$\gamma_i = \frac{g_{i+1}^T g_{i+1}}{g_i^T g_i}$$
(2.92)

$$= \frac{\left(\boldsymbol{g_{i+1}}^T - \boldsymbol{g}_i^T\right)\boldsymbol{g}_{i+1}}{\boldsymbol{g}_i^T\boldsymbol{g}_i}$$
(2.93)

$$\lambda_i = \frac{\boldsymbol{g}_i^T \boldsymbol{h}_i}{\boldsymbol{h}_i^T \boldsymbol{G} \boldsymbol{h}_i}$$
(2.94)

式 (2.92) は,式 (2.88) を用いて, γ_i が

$$\gamma_{i} = \frac{g_{i+1}^{T}Gh_{i}}{h_{i}^{T}Gh_{i}}$$

$$= -\frac{g_{i+1}^{T}\left(\frac{g_{i+1}-g_{i}}{\lambda_{i}}\right)}{h_{i}^{T}\left(\frac{g_{i+1}-g_{i}}{\lambda_{i}}\right)}$$

$$= -\frac{g_{i+1}^{T}g_{i+1}}{h_{i}^{T}\left(g_{i+1}-g_{i}\right)}$$
(2.95)

となり、ここで、i > 0 なら式 (2.85)、式 (2.88)、式 (2.91) を用いて

$$\gamma_{i} = -\frac{g_{i+1}^{T}g_{i+1}}{(g_{i} + \gamma_{i-1}h_{i-1})^{T}(g_{i+1} - g_{i})}$$

= $\frac{g_{i+1}^{T}g_{i+1}}{g_{i}^{T}g_{i}}$ (2.96)
となり,

$$\gamma_0 = -\frac{\boldsymbol{g}_1^T \boldsymbol{g}_1}{(\boldsymbol{h}_0)^T (\boldsymbol{g}_1 - \boldsymbol{g}_0)}$$
$$= \frac{\boldsymbol{g}_1^T \boldsymbol{g}_1}{\boldsymbol{g}_0^T \boldsymbol{g}_0}$$
(2.97)

となるためである. また, 式 (2.94) は, i > 0のとき, 式 (2.88), 式 (2.89), 式 (2.85) を用いて

$$\lambda_{i} = \frac{\boldsymbol{g}_{i}^{T}\boldsymbol{g}_{i}}{\boldsymbol{g}_{i}^{T}\boldsymbol{G}\boldsymbol{h}_{i}}$$

$$= \frac{\boldsymbol{g}_{i}^{T}(\boldsymbol{h}_{i} - \gamma_{i-1}\boldsymbol{h}_{i-1})}{(\boldsymbol{h}_{i} - \gamma_{i-1}\boldsymbol{h}_{i-1})^{T}\boldsymbol{G}\boldsymbol{h}_{i}}$$

$$= \frac{\boldsymbol{g}_{i}^{T}\boldsymbol{h}_{i}}{\boldsymbol{h}_{i}^{T}\boldsymbol{G}\boldsymbol{h}_{i}}$$
(2.98)

となり,i = 0のとき,

$$\lambda_0 = \frac{\boldsymbol{g}_0^T \boldsymbol{g}_0}{\boldsymbol{g}_0^T \boldsymbol{G} \boldsymbol{h}_0}$$

= $\frac{\boldsymbol{g}_0^T \boldsymbol{g}_0}{\boldsymbol{h}_0^T \boldsymbol{G} \boldsymbol{h}_0}$ (2.99)

となるためである. ここで,目的関数が2次関数なら係数行列*G*が既知であり,式 (2.84),式(2.85),式(2.92)や式(2.93),式(2.94)を用いて共役方向を生成できるため, 目的関数を最小化することができる.しかしながら,2次関数でない場合は係数行列 *G*をあからさまに知ることができない.

ここで、たまたま $g_i = \nabla q(x_i)$ であったとする. この点 x_i から方向 h_i に沿って qの極小 x_{i+1} に到達したとして、さらに $g_{i+1} = \nabla q(x_{i+1})$ となったとする. すると、この g_i は式 (2.84)、式 (2.85)を用いて構成したのと同じベクトルになる. これは

$$\boldsymbol{g}_i = -\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{b} \tag{2.100}$$

$$\boldsymbol{g}_{i+1} = -\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}_{i+1} + \boldsymbol{b} = -\boldsymbol{G}\left(\boldsymbol{x}_i + \lambda \boldsymbol{h}_i\right) + \boldsymbol{b} = \boldsymbol{g}_i - \lambda \boldsymbol{G}\boldsymbol{h}_i$$
(2.101)

であり、極小点においては探索方向と勾配の内積はゼロになるから $h_i \nabla q = -h_i g_{i+1} = 0$ となり、式 (2.101)からやはり、式 (2.94)と同様

$$\lambda_i = \frac{\boldsymbol{g_i}^T \boldsymbol{h_i}}{\boldsymbol{h_i}^T \boldsymbol{G} \boldsymbol{h_i}}$$

のようになることから証明できる. つまり, 目的関数が2次関数なら, $g_i = \nabla q(x_i)$ と すれば, *G*を使わずに厳密に共役勾配方向を生成し, 最小化を行うことができる. 任 意の目的関数に関しても 2 次関数で近似できると仮定して,式 (2.92) や式 (2.93),式 (2.94), ∇q(x)を用いて G を使わず,擬似的に共役勾配方向を生成する.

これらの定式化を反復法のアルゴリズムに当てはめると新たな探索方向 $d_{k+1} = -\nabla f(x_k) + \beta_k d_k$ の β_k を式 (2.92) に基づき,

$$\beta_{k} = \frac{\left|\nabla f\left(\boldsymbol{x}_{k+1}\right)\right|^{2}}{\left|\nabla f\left(\boldsymbol{x}_{k}\right)\right|^{2}}$$
(2.102)

とする Fletcher-Reeves の方法や式 (2.93) に基づき,

$$\beta_{k} = \frac{\nabla f\left(\boldsymbol{x_{k+1}}\right)^{T}\left(\nabla f\left(\boldsymbol{x_{k+1}}\right) - \nabla f\left(\boldsymbol{x_{k}}\right)\right)}{\left|\nabla f\left(\boldsymbol{x_{k}}\right)\right|^{2}}$$
(2.103)

とする Polak-Ribiere-Polyak の方法を用いることになる.しかしながら,定数回での 収束が保証されているのは2次関数の場合だけであり,実際には任意の目的関数を2 次関数として近似する.このため,実際に共役勾配法を行う場合,共役勾配方向の更 新を繰り返した後,また新たに,最急降下方向に探索方向を取り直し,再出発の手続 きが取られる.

- 1. 初期ベクトル x_0 からスタートする. k = 0 とする. 再出発の周期 p を与える, $\beta_0 = 0$ とする.
- 2. $\boldsymbol{d}_{k+1} = -\nabla f(\boldsymbol{x}_k)$ とする.
- 3. $\nabla f(\boldsymbol{x}_k) = \mathbf{0}$ が満たされていれば, \boldsymbol{x}_k を解とみなして停止する. さもなければ 次のステップに進む.
- 4. 直線探索によって $f(\boldsymbol{x}_k + \alpha \boldsymbol{d}_k)$ を最小にする α_k を求める.
- 5. $\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{x}_k + \alpha_k \boldsymbol{d}_k$ とおく.
- 6. k+1 が p の倍数ならば k = k+1 とおいて, ステップ1 へ行く. さもなければ, ステップ6 に進む.
- 7. $d_{k+1} = -\nabla f(x_k) + \beta_k d_k$ として探索方向を求める. ただし, β_k は式 (2.92) もし くは式 (2.93) によって計算される.
- 8. k = k + 1とおいてステップ2へ行く.

実数パラメータを用いる遺伝的アルゴリズム

遺伝的アルゴリズムとは,解の候補(個体)の集団から適応度に応じて選択を行って,次世代へ生存させたり,また,交叉,突然変異などにより,解の候補を変化させ,よ

り良い解の候補を探索するというよう遺伝的操作を繰り返して,世代を重ねること によって最適化を行う手法である.

一般的な遺伝的アルゴリズムは染色体で2進数を表現するが、本研究においてはポ テンシャルパラメータで直接染色体を表現したいため、実数パラメータ遺伝的アルゴ リズムを用いた.実数パラメータ遺伝的アルゴリズムでは1つの実数パラメータが 染色体となり、実数パラメータのセットが個体となる[16].

実数パラメータ遺伝的アルゴリズムは遺伝的操作が2進数遺伝的アルゴリズムと 異なる.以下,実数パラメータ遺伝的アルゴリズムの遺伝的操作について述べる.

選択

選択とは個体の中で問題への適応度の良いものを生存させたり,増殖させたりする 操作である.選択については数パラメータ遺伝的アルゴリズムは遺伝的操作も2進 数遺伝的アルゴリズムも同様であり,適応度の高い個体を次世代にそのまま残すエ リート保存選択,適応度によって各個体をランク付けし,あらかじめ各ランクに対し て決められた確率で子孫を残せるようにするランキング選択,集団の適応度の総計 を求めて,総計に対する各個体の適応度に応じて選択されるルーレット選択などの通 常の遺伝的操作を行うことが出来る.

交叉

交叉とは選択された個体間での変数の組み換えにより,新しい個体を生成する操作 である.代表的な実数パラメータ遺伝的アルゴリズムの交叉の手法について述べる.

Linear Crossover

Linear Crossoverとは $\chi_i^{(1,t)}$ を親1のt世代のi番目の変数とし, $\chi_i^{(2,t)}$ を親2のt世代の i番目の変数としたとき、 $0.5\left(\chi_i^{(1,t)} + \chi_i^{(2,t)}\right), \left(1.5\chi_i^{(1,t)} - 0.5\chi_i^{(2,t)}\right), \left(-0.5\chi_i^{(1,t)} + 1.5\chi_i^{(2,t)}\right)$ を新たな解として生成する交叉である.

Native Crossover

2進数遺伝的アルゴリズムのように,変数の交叉位置を選び,変数を入れ替える手法である.例えば1点交叉を3番目の変数位置で入れ替えるとき

$$Parent1: \left(\chi_{1}^{(1,t)}, \chi_{2}^{(1,t)}, \chi_{3}^{(1,t)}, \chi_{4}^{(1,t)}, \cdots, \chi_{n}^{(1,t)}\right)$$

$$Parent2: \left(\chi_{1}^{(2,t)}, \chi_{2}^{(2,t)}, \chi_{3}^{(2,t)}, \chi_{4}^{(2,t)}, \cdots, \chi_{n}^{(2,t)}\right)$$

$$Offspring1: \left(\chi_{1}^{(1,t)}, \chi_{2}^{(1,t)}, \chi_{3}^{(1,t)}, \chi_{4}^{(2,t)}, \cdots, \chi_{n}^{(2,t)}\right)$$

$$Offspring2: \left(\chi_1^{(2,t)}, \chi_2^{(2,t)}, \chi_3^{(2,t)}, \chi_4^{(1,t)}, \cdots, \chi_n^{(1,t)}\right)$$

のように新たな解を生成する.

Blend Crossover

Blend Crossover (BLX- α) とは μ_i を 0 から 1 の乱数として,次世代の個体の i 番目 の変数 $\chi_i^{(1,t+1)}$ を

$$\chi_i^{(1,t+1)} = (1 - \gamma_i)\chi_i^{(1,t)} + \gamma_i\chi_i^{(1,t)}$$
(2.104)

とする交叉である. ただし, $\gamma_i = (1+2\alpha) \mu_i - \alpha$ である.

突然変異

突然変異とは選択された個体における変数の値を変化させることによって新しい 個体を生成する操作である. 代表的な実数パラメータ遺伝的アルゴリズムの突然変 異の手法について述べる.

Random Mutation

この手法はランダムに突然変異を行う手法であり, $\mathbf{r}_i \ge 0$ から 1 の乱数として, 突 然変異によって生成される次世代の個体における i 番目の変数 $\mathbf{y}_i^{(1,t+1)} \ge \mathbf{i}$ 番目の変 数の上限 $\chi_i^{(U)}$ i 番目の変数の下限 $\chi_i^{(L)}$ のもと,

$$y_i^{(1,t+1)} = r_i \left(\chi_i^{(U)} - \chi_i^{(L)} \right)$$
(2.105)

とする手法や

$$y_i^{(1,t+1)} = \chi_i^{(1,t)} + (r_i - 0.5)\Delta_i$$
(2.106)

とする手法である. ここで Δ_i はユーザが設定した i 番目の変数に対する最大の変化幅である.

Normally Distributed Mutation

ゼロ平均ガウス分布 $N(0,\sigma)$ のもと, 突然変異によって生成される次世代の個体に おける i 番目の変数 $\mathbf{y}_{i}^{(1,t+1)}$ を

$$y_i^{t+1} = \chi_i^{1,t} + N(0,\sigma)$$
(2.107)

とする手法である.標準偏差σはユーザがあらかじめ設定しておく.

2.3.4 不等式制約条件下,等式制約条件下における最適化問題

不等式制約条件や等式制約条件を最適化問題で取り扱えために最も簡単な方法は 変換法といわれる制約条件つき最小化問題を適当に変換して無制約最小化問題に置 き換える方法を用いることである.変換法にはペナルティ関数法,拡張 Langrange 乗 数法などがある.また,ペナルティ関数法にも不等式制約条件のみを取り扱うことの できる内点ペナルティ法,不等式制約条件,等式制約条件ともに扱うことのできる外 点ペナルティ法,不等式制約条件,等式制約条件ともに扱うことのできる上に収束計 算の不要な正確なペナルティ法などがある.本研究では不等式制約条件や等式制約 条件を厳密に扱う最適化を行うことはしないため,収束計算の不要な正確なペナル ティ法のみを用いている.

正確なペナルティ法は1個の不等式制約条件, m 個の等式制約条件

$$g_i(\mathbf{x}) \le 0, i = 1, \dots, l,$$
 (2.108)

$$h_i(\mathbf{x}) = 0, i = 1, \dots, m$$
 (2.109)

のもとで, f(x)を目的関数として最小化する問題において, 十分大きなrに対して, 次の

$$P(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + r \left\{ \sum_{i=1}^{m} max(0, g_i(\mathbf{x})) + \sum_{j=1}^{l} |h_j(\mathbf{x})| \right\}$$
(2.110)

を制約条件なしで最小化すれば, f(x)を制約条件の下で最小化した場合と同じ最小 点が得られるという手法である.このため,制約条件があっても正確なペナルティ法 を用いれば,共役勾配法や遺伝的アルゴリズムの目的関数を P(x) にすれば,簡単に 制約条件を組み入れることが可能である.

第3章 原子間ポテンシャル作成手法の 枠組みの提案

本章ではまず,原子間ポテンシャルの作成手法の枠組みの提案を行う.この提案す る枠組みは5ステップの工程からなる.この提案する手順は単なる枠組みであって, 実際に実用性の高い原子間ポテンシャルを作るためにはいくつかの注意すべき点が 存在する.これらの注意点の全てを網羅することは現実的ではないが,本論文で作成 した共有結合,金属結合のそれぞれ単元系,多元系の原子間ポテンシャル作成におい て得られた知見について,原子間ポテンシャル作成の各工程における指針という形 式で説明を行う.この指針は経験的に得られたものであり,必ずしも従う必要はなく, これを用いた場合,少なくとも原子間ポテンシャル作成が上手く行ったことがあると いう位置づけであり,絶対のものではない.

3.1 全体の工程

Fig. 3.1 に提案する合わせ込み手法の全体の工程を示す. 最初に、「計算目的の設 定」工程において、古典分子動力学計算を行う目的を設定する.この最も重要である 計算目的に沿って,原子間ポテンシャルを構築することになる.まず、「ポテンシャ ル関数の決定」工程において、系の結合形態を良く表すポテンシャル関数形を選択す る.次に、「合わせ込み物性の選択/収集」工程において、ポテンシャルパラメータを 合わせ込む物性の選択、収集を行う、そして、「ポテンシャルパラメータの最適化」工 程において、多次元最適化手法を用いてポテンシャルパラメータ最適化を行って、多 数のポテンシャルパラメータセットを生成する、短い算出時間できる合わせ込み物 性は、多次元最適化の最適化関数に含めることができるが、長い算出時間を要する合 わせ込み物性は多次元最適化の最適化関数に含めることができない. この得られた 多数のポテンシャルパラメータセットの中から合わせ込みに用いる物性(長い算出時 間を要する合わせ込み物性も含めて)の再現性に優れているポテンシャルパラメー タセットを選び出す(通常複数のポテンシャルパラメータセット) 最後に、「ポテン シャルパラメータセットの評価/決定」工程においては、これらの中から1つのポテ ンシャルパラメータセットを選択する.ただし、作成されたポテンシャルパラメータ セットの評価が悪ければ、いくつかの工程で修正を行って再フィッティングすること

もあり得る.この枠組みは,元素系,ポテンシャル関数形,合わせ込み物性について特に制約はなく,これらについて自由に入力を行うことができる枠組みとなっている.



Fig. 3.1: The flowchart for fitting process

3.2 計算目的の設定における指針

あらゆる物性を再現することのできる完璧な原子間ポテンシャルを作成できれば 良いが、従来研究からそれは非常に難しいことがわかっている.つまり、原子間ポテ ンシャルにはどうしても適用範囲が存在すると考えられる.このため、解析者は計算 目的を具体的に設定し、その目的に合致する原子間ポテンシャルを用意する必要性が ある.ここで、計算目的に応じた原子間ポテンシャルというのは、計算対象としてい る現象もしくはそれに密接に関連した物性を再現できるような原子間ポテンシャル のことを指している.このため、解析者は計算目的を具体的に設定するという指針の もとに計算目的の設定を行うことになる.

例えば、単元系、2元系、不純物を含む系なのか、結合形態が、共有結合、金属結合、イオン結合なのか、によって、原子間ポテンシャル作成の方針は変わる.また、計算系の弾性的性質を計算の目的と設定する場合には、弾性的性質を精度良く再現する原子間ポテンシャルを作成する必要がある.また、融解現象を取り扱うような計算であれば、融点温度を再現することのできる原子間ポテンシャルを作成する必要がある.

3.3 ポテンシャル関数形の決定における指針

この工程では計算したい系の結合形態を良く記述するポテンシャル関数形を選択 する.ただ、1からポテンシャル関数形を組み立てるのは非常に大きな手間がかかり、 また、自分で組み立てた関数形では、系を上手く記述できない場合も多い.このため、 過去の研究からおおよそ上手く系を記述できるポテンシャル関数形はわかっている 場合には、これを選択すると良い.よって、過去の代表的なポテンシャル関数形を用 いるいう指針のもとにポテンシャル関数形を決定することになる.ただし、「ポテン シャルパラメータセットの評価/選択」工程に詳しく述べるが、再現性をしたい物性 を再現できなかった場合にはポテンシャル関数形の修正も含めて考える必要がある.

共有結合系に関してはボンドオーダ型ポテンシャル関数形が適していることがわ かっている. Si のための Tersoff ポテンシャル [3][4] や C のための Brenner ポテンシャ ル [6] のボンドオーダ型ポテンシャルなどが挙げられる. また, 共有結合にはクラス タ型ポテンシャル関数形が使える場合がある. Si のための SW ポテンシャルはクラ スタ型ポテンシャル関数形 [17] が代表的である.

金属結合系に関しては EAM 型ポテンシャル関数形が適していることがわかっている. EAM 型ポテンシャルには Daw と Baskes による EAM ポテンシャル [1], Finnis Sinclair ポテンシャル [18][19], MEAM ポテンシャル [2], Mishin ポテンシャル [7][8][9][10] をはじめ, 数多くの種類があり, 2 体ポテンシャル関数形, 部分電子密度関数形, 原子 埋め込み関数形それぞれについて関数形を選択する必要がある.

イオン結合系に関しては、純粋なイオン結合のためには2体ポテンシャル関数に電 荷項を加えた Beest-Kramer-Santeen[20] ポテンシャルや Born-Mayer-Huggins[21] ポ テンシャルが適していることがわかっている.

金属結合にイオン結合が混じっているような場合には, EAM ポテンシャルに電荷 項を加え [22], 共有結合にイオン結合が混じっているような場合にはボンドオーダ型 ポテンシャルやクラスタ型ポテンシャルに電荷項 [23][24] を加える. 電荷項に関して も移動電荷型 [22][23], 固定電荷型 [24] がある.

3.4 合わせ込み物性の選択/収集における指針

この工程は、合わせ込み物性を選択、収集する工程であり、「合わせ込み物性の選 択」副工程、「合わせ込み物性の収集」副工程からなる.以降、詳しく説明を行う.

3.4.1 合わせ込み物性の選択における指針

まず,合わせ込む物性を大きく以下の2つに分けることを行う.即ち,

• ポテンシャル関数にロバスト性を与えるための物性 (Standard Fitting Data)

計算の目的に応じて重要となる物性のための物性 (Optional Fitting Data)

の2種である. つまり, 合わせ込む物性を Standard Fitting Data と Optional Fitting Data に分けて, それぞれの機能を満たすようにする, という指針のもとに, 合わせ込む物 性の選択を行う副工程となる. 以降, それぞれの物性に関して詳しく説明を行う. ま た, 合わせ込み物性に関して, 合わせ込みにおける閾値を設定しておくと, と最後に ポテンシャルパラメータセットを選ぶ際に便利になる.

Standard Fitting Data

系を構成する原子配置が決まれば、ポテンシャルエネルギは一意に決まるが、ポテ ンシャルエネルギは陽に原子配置に依存しているわけではない. ポテンシャル関数形 によって、その種類は異なるが、直接的には原子配置から計算される原子間距離、配 位数,結合角などの局所原子環境に依存する.つまり,原子間ポテンシャルは局所原 子環境の関数であるといえる.このため、古典分子動力学計算における局所原子環境 の変化に対してロバスト性を確保するためには、局所原子環境を変数としたポテン シャルエネルギ曲線を再現できなくてはならない.よって、基本的には広範におよぶ 局所原子環境を含んだ構造におけるポテンシャルエネルギを Standard Fitting Data と すれば、局所原子環境の変化に対してのロバスト性が高まる.ただし、多数合わせ込 むとはいえ、離散的なポテンシャルエネルギを合わせるだけでは、ポテンシャルエネ ルギ曲線の再現が難しい局所原子環境も存在する.例えば、結合距離や平衡原子体積 に依存したポテンシャルエネルギ曲線を合わせ込んでも、いくつかの点でのみポテ ンシャルエネルギを合わせ込むと、エネルギ曲線が波打ってしまったり、極小点の位 置がずれてしまうということが起こる.この場合,エネルギの極小値(1階微分がゼ ロ)と2階微分値に相当する物性を合わせ込むことによってポテンシャルエネルギ 曲線を再現することが容易になる. 先ほど述べた平衡原子体積に関するポテンシャル エネルギ曲線を再現するためには、平衡状態におけるポテンシャルエネルギ、平衡原 子体積,体積弾性率をStandard Fitting Data として用いることによってポテンシャル エネルギ曲線を再現することができる.よって、広範におよぶ局所原子環境を含んだ 構造におけるポテンシャルエネルギ/またはそれを再現するための微分値を Standard Fitting Data として選択する、という指針になる.本研究で実際に原子間ポテンシャル 開発を行った EAM 型ポテンシャル関数やボンドオーダ型ポテンシャル関数を用い た場合には、Standard Fitting Data は平衡構造の格子定数、凝集エネルギ、体積弾性率、 弾性定数,原子体積に依存したエネルギ曲線多形構造の格子定数,凝集エネルギ,原 子体積に依存したエネルギ曲線となった.

このように原子間ポテンシャルが依存する局所原子環境の変化についてロバスト 性を高めておくことによって、合わせ込みに用いた局所原子環境とかけ離れた局所原 子環境と遭遇するのを避けることができるようになる.逆に言えばいくらたくさん の原子構造の構造パラメータとエネルギを合わせ込んだとしても、それらの含む局 所原子環境が類似のものであれば、十分な合わせ込みを行ったとはいえない.

合わせ込みにおいては非常に多くの回数に渡ってそのエネルギを計算する必要が ある. このため、ごく少数の代表原子のエネルギを計算するだけで、全体のエネルギ を計算することができる対称性の高い原子構造の物性が合わせ込みに適している. 特 に内部構造パラメータを持たず、格子定数が1種だけの構造は非常に高速にエネルギ を計算することができるため、合わせ込む物性として用いるのに最適である. 加えて、 対称性の高い原子構造は第一原理計算も容易である. 以下, 具体的に Standard Fitting Data に用いている構造の説明を行う. 単元系結晶構造としては

- ダイマ
- 単層グラファイト構造
- ダイヤモンド構造
- SC 構造
- BCC 構造
- BCT 構造
- FCC 構造
- Ideal HCP 構造
- HCP 構造

を用いている. Table 3.1 にこれら合わせ込みに用いる単元系結晶構造の局所原子環 境のうち,代表的な配位数と結合角を示す.X元素とY元素を含む2元系結晶構造の うち,ダイヤモンド系構造(以降,ダイヤモンド型2元系構造)としては

- Diamond 型 X₇Y 構造
- Diamond 型 X₅Y₃ 構造
- ZnS 構造
- Diamond 型 X₃Y₅ 構造
- Diamond 型 XY₇ 構造

を提案している.

正方格子 (Simple Cubic:SC) 系構造 (以降, SC型2元系構造) としては

- SC 型 X₇Y 構造
- SC 型 X₆Y₂ 構造
- NaCl 構造
- SC 型 X₂Y₆ 構造
- SC 型 XY₇ 構造

を提案している.

体心立方格子 (Body Centered Cubic:BCC) 系構造 (以降, BCC 型 2 元系構造) としては

- BCC 型 X₁₄Y₂ 構造
- BCC 型 X₁₂Y₄ 構造
- BCC 型 X₁₀Y₆構造
- CsCl 構造
- BCC 型 X₆Y₁₀ 構造
- BCC 型 X₄Y₁₂ 構造
- BCC 型 X₂Y₁₄ 構造

を提案している.

面心立方格子 (Face Centered Cubic:FCC) 系構造 (以降, FCC型2元系構造) としては

- FCC 型 X₃Y 構造
- FCC 型 X₂Y₂ 構造
- FCC 型 XY₃ 構造

を提案している.

架橋型構造(以降,架橋型2元系構造)としては

- 架橋型グラファイト構造 (b-GRAPHITIC)
- 架橋型ダイヤモンド構造 (b-DIAMOND)
- 架橋型正方格子型構造 (b-SC)
- 架橋型体心立方格子構造 (b-BCC)

• 架橋型面心立方格子構造 (b-FCC)

を提案している.

等配合構造(以降,等配合2元系構造)としては

- ダイマ型構造 (h-DIMER)
- 直鎖型構造 (h-CHAIN)
- 等配合グラファイト型構造(h-GRAPHITIC)

を提案している. ZnS, NaCl, CsCl, A₂B₂FCC も等配合 2 元系構造に含まれるが, これ らは便宜上先に述べた系統の構造に含むものとする. その他に

- Cu_2Mg $\mathbb{Z}X_2Y$
- Cu_2Mg $\mathbb{Z} XY_2$

(以降 Cu₂Mg 型 2 元系構造) を合わせ込みに用いている. Table 3.2, Table 3.3 にそれ ぞれこれら合わせ込みに用いる 2 元系結晶構造の局所原子環境のうち, 結合角と代 表的な配位数を示す. 単元系と異なり, 配位数や結合角を算出するための近接原子の 原子種も局所原子環境に含まれることに注意が必要である. これらの構造をすべて Standard Fitting Data として使うわけではなく, ポテンシャル関数形や安定構造に応 じて, 選んで用いる. 詳細な原子の図については付録 B に載せたので, そちらを参照 していただきたい.

Table 3.1: Coordination numbers between the nearest neighbor atoms and bond angles between the nearest neighbor bonds for polytypes.

| | coordination number | bond angles [degree] |
|-----------|---------------------|----------------------|
| Dimer | 1 | |
| Chain | 2 | 180 |
| Graphitic | 3 | 120 |
| Diamond | 4 | 109.5 |
| SC | 6 | 90,180 |
| BCC | 8 | 70.5,109.5,180 |
| BCT | 10 | * |
| FCC | 12 | 60,90,120,180 |

*Because bond angles for BCT structures are changed as correspond to c/a ratio, they are not displayed.

Table 3.2: Bond angles of various crystals. θ_{ijk} inclates the angle of the bonds between ij and ik.

|).5 |
|-----|
| |
| |
| |
| |
| |

| structure | | coordination numbers* | | | | | |
|--------------------|------------------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|--|--|
| | | Z_{XX}/Z_X | Z_{XY}/Z_X | Z_{YY}/Z_{Y} | Z_{YX}/Z_{Y} | | |
| h-DIMER | XY | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | | |
| h-CHAIN | XY | 0/2 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | | |
| h-GRAPHITIC | XY | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | | |
| b-GRAPHITIC | X_2Y_3 | 0/3 | 3/3 | 0/2 | 2/2 | | |
| b-GRAPHITIC | X_3Y_2 | 0/2 | 2/2 | 0/3 | 3/3 | | |
| b-DIAMOND | XY_2 | 0/4 | 4/4 | 0/2 | 2/2 | | |
| b-DIAMOND | X_2Y | 0/2 | 2/2 | 0/4 | 4/4 | | |
| b-SC | XY_3 | 0/6 | 6/6 | 0/2 | 2/2 | | |
| b-SC | X_3Y | 0/2 | 2/2 | 0/6 | 6/6 | | |
| b-BCC | XY_4 | 0/8 | 8/8 | 0/2 | 2/2 | | |
| b-BCC | X_4Y | 0/2 | 2/2 | 0/8 | 8/8 | | |
| b-FCC | XY_6 | 0/12 | 12/12 | 8/10 | 2/10 | | |
| b-FCC | X_6Y | 8/10 | 2/10 | 0/12 | 12/12 | | |
| DIAMOND | X ₇ Y | 3/4, 4/4 | 1/4, 0/4 | 0/4 | 4/4 | | |
| DIAMOND | X_5Y_3 | 1/4, 4/4 | 3/4, 0/4 | 0/4 | 4/4 | | |
| ZnS | XY | 0/4 | 4/4 | 0/4 | 4/4 | | |
| DIAMOND | X_3Y_5 | 0/4 | 4/4 | 1/4 , 4/4 | 3/4, 0/4 | | |
| DIAMOND | XY_7 | 0/4 | 4/4 | 3/4, 4/4 | 1/4, 0/4 | | |
| SC | X ₇ Y | 4/6, 6/6 | 2/6, 0/6 | 0/6 | 6/6 | | |
| SC | X_6Y_2 | 4/6 | 2/6 | 0/6 | 6/6 | | |
| NaCl | XY | 0/6 | 6/6 | 0/6 | 6/6 | | |
| SC | X_2Y_6 | 0/6 | 6/6 | 4/6 | 2/6 | | |
| SC | XY_7 | 0/6 | 6/6 | 4/6, 6/6 | 2/6, 0/6 | | |
| BCC | $X_{14}Y_2$ | 6/8, 8/8 | 2/8, 0/8 | 0/8 | 8/8 | | |
| BCC | $X_{12}Y_4$ | 4/8, 8/8 | 4/8, 0/8 | 0/8 | 8/8 | | |
| BCC | $X_{10}Y_6$ | 2/8, 8/8 | 6/8, 0/8 | 0/8 | 8/8 | | |
| CsCl | XY | 0/8 | 8/8 | 0/8 | 8/8 | | |
| BCC | $X_{6}Y_{10}$ | 0/8 | 8/8 | 2/8, 8/8 | 6/8, 0/8 | | |
| BCC | X_4Y_{12} | 0/8 | 8/8 | 4/8, 8/8 | 4/8, 0/8 | | |
| BCC | X_2Y_{14} | 0/8 | 8/8 | 6/8, 8/8 | 2/8, 0/8 | | |
| Cu ₂ Mg | X_2Y | 6/12 | 6/12 | 4/16 | 12/16 | | |
| Cu_2Mg | XY_2 | 4/16 | 12/16 | 6/12 | 6/12 | | |
| FCC | X ₃ Y | 8/12 | 4/12 | 0/12 | 12/12 | | |
| FCC | X_2Y_2 | 4/12 | 8/12 | 4/12 | 8/12 | | |
| FCC | XY_3 | 0/12 | 12/12 | 8/12 | 4/12 | | |

Table 3.3: Coordination numbers of various crystals.

* Z_X is total coordination number of atomic species X and Z_{XY} is number of atomic species Y included in Z_X .

Optional Fitting Data

原子間ポテンシャルは合わせ込んでいない物性の再現は保証されない. このため, 計算目的に応じた原子間ポテンシャルの作成を実現するために,計算対象としてい る系特有の物性,計算対象としている現象,もしくはそれに密接に関連した物性を Optional Fitting Data として選択する必要がある. 例えば,欠陥生成エネルギ,表面 エネルギ,反応経路,系に特有な結晶の物性など融点温度,アモルファス構造などが Optional Fitting Data に相当すると考えられる.

3.4.2 合わせ込み物性の収集における指針

合わせ込む物性の収集に関しては、次のような指針を取る. ほとんど確定している ような信頼性のある実験値のある物性については実験値を用いる. これに対して、バ ラッキが大きいなど信頼性の低い実験値や、実験値のない仮想的な構造の物性は第 一原理計算を行い、存在する実験値と整合するように変換して(内挿値、相対値など) 用いる.

本研究では、第一原理計算に商用ソフトウェアである擬ポテンシャル法平面波密度 汎関数法 (Density Functional Theory: DFT) パッケージ Vienna Abinitio Simulation Package[25][26] (VASP) を用いている. 擬ポテンシャル法を用いた平面波密度汎関 数法は第一原理計算の中では内殻を凍結した状態として扱うため、比較的高速であ り、また、平面波を用いることで、周期的な計算に向くために、固体系の計算に適して いるからである.しかしながら,擬ポテンシャル法を用いた平面波密度汎関数法では 内殻の効果を正しく扱えない、このため、内殻の効果によるシフトを相殺できるため 相対的なエネルギは正確に計算できるものの、絶対的なエネルギについては正確に 計算することができない. このため、実験値の存在する安定構造のエネルギは実験値 を合わせ込みに用い、実験値の存在しない構造のエネルギは実験値の存在する構造 からの反応エネルギも合わせ込みに用いる.また、一般的に擬ポテンシャル法を用い た平面波密度汎関数法では格子定数を正しく見積もることができない. 例えば,交換 相関項に LDA を用いると、格子定数は短く見積もられ、GGA を用いると、格子定数 は長めに見積もられる.このため、実験値の存在する安定構造の格子定数が合うよう に、スケーリング因子を決定し、同様の第一原理計算の長さにかかわる物性をスケー リングする. さらに、擬ポテンシャル法を用いた平面波密度汎関数法においては、体 積弾性率や弾性定数も最大10%程度のずれが出るといわれている.このため、本研究 において,実験値の存在する体積弾性率や弾性定数は実験値を用いるが,実験値の存 在しない体積弾性率や弾性定数は第一原理計算によって算出し、これが実験値と矛盾 しないようにスケーリングした値を用いる.即ち,単元系においては、通常安定構造 Sの体積弾性率は実験値が存在するため、ある構造多形 Pの合わせ込みに用いる体

積弾性率 B_P^{fit} は

$$B_P^{fit} = B_P^{DFT} \frac{B_S^{Exp}}{B_S^{DFT}}$$
(3.1)

として決定する. ここで, B_S^{MD} は実験から得られた安定構造 S の体積弾性率, B_S^{DFT} は第一原理計算から得られた安定構造 S の体積弾性率である.

n 元系 (元素 A_1, A_2, \ldots, A_n が含まれる) において, このうちいくつかの元素の体積 弾性率が実験値と大きく異なっていた場合, 組成比が $(r_1: r_2: \ldots: r_n)$ の材料 M の 合わせ込みに用いる体積弾性率 B_M^{fit} は

$$B_{M}^{fit} = B_{M}^{DFT} \frac{\sum_{i=1}^{n} r_{i} B_{A_{i}}^{MD}}{\sum_{i=1}^{n} r_{i} B_{A_{i}}^{DFT}}$$
(3.2)

として決定する. ここで, $B_{A_i}^{MD}$ は単元系ポテンシャルを用いて算出した A_i の基準構造の体積弾性率, $B_{A_i}^{DFT}$ は第一原理計算から得られた A_i の基準構造の体積弾性率である. これは単元系元素の体積弾性率を基準としたが, 多元系元素の体積弾性率の実験値が存在する場合は, それを基準とすることも可能である.

ー般的におおよその体積依存のエネルギ曲線は Rose ら [27] による関数を用いて 表現することができる.エネルギ *E^{Rose}*(*r*)は代表的な原子間距離*r*を引数として,

$$E^{Rose}(r) = E_0 \left[1 + \alpha * (r) \right] e^{-\alpha^*(r)}$$
(3.3)

となる.ただし,

$$\alpha^*\left(r\right) = \sqrt{\frac{9B\Omega}{E_0}} \left(\frac{r}{r_0} - 1\right) \tag{3.4}$$

のように表現できる. ここで, r は原子間距離, r_0 は平衡原子間距離, B は体積弾性率, Ω は平衡原子体積, E_0 は平衡状態における凝集エネルギである. このため,体積弾性 率が異なれば,平衡体積からずれた体積におけるエネルギもずれることになってし まう. このため,体積弾性率を単元系の場合,式 (3.1)を,多元系の場合,式 (3.2)を用 いてスケーリングした場合,エネルギについてもそれにあわせて変換を行う.式 (3.3) において第一原理計算によって得られた体積弾性率 B^{DFT} を用いて計算したエネル ギ $E^{Rose,DFT}(r)$ とスケーリングされた体積弾性率 B^{scale} を用いて計算したエネルギ $E^{Rose,scale}(r)$ を用いて,代表的な原子間距離がrである平衡状態からずれた体積にお けるエネルギE(r)を

$$E(r) = \left(E_0^{exp} + \Delta E^{DFT}(r)\right) \frac{E^{Rose,scale}(r)}{E^{Rose,DFT}(r)}$$
(3.5)

のように変換する. ここで, E_0^{exp} は実験から得られた平衡状態における凝集エネル ギ, $\Delta E^{DFT}(r)$ は第一原理計算から得られた平衡状態に対する相対エネルギである.

3.5 ポテンシャルパラメータの最適化における指針

ポテンシャルパラメータ最適化はポテンシャルパラメータセットにおける各ポテ ンシャルパラメータを成分としたベクトル空間において、原子間ポテンシャルを用い た算出した物性と合わせ込みに用いる物性の差を最小化する最小化問題に帰着させ ることができる.よって、多次元最適化手法を用いて、合わせ込みに用いる物性を再 現するようにポテンシャルパラメータを最適化する工程となる.以下、用いる数値最 適化手法と最適化関数の定義に関する指針について述べる.

3.5.1 数值最適化手法

ポテンシャルパラメータセットのように大きな次元のベクトルの属するベクトル 空間における最適化においては、最急降下法や共役勾配法に代表されるようなある-つのベクトルからスタートして、少しずつベクトルを変化させていく最適化手法を 用いた場合にはスタートした地点近くの局所安定で止まってしまうことが多い. こ のような局所安定に陥ってしまうというような問題を回避するため、局所安定点から 脱出できるような最適化手法を用いる. このような局所安定点が脱出できるような 最適化手法の中でも、多点からスタートできる遺伝的アルゴリズムがポテンシャル合 わせ込みに向いている. また、遺伝的アルゴリズムには、以前得たポテンシャルパラ メータセットからリスタートすることができるという利点もある.

3.5.2 最適化関数の定義

 n_{fit} 種類の物性を合わせ込みに用いるときの、それぞれの合わせ込みに用いる物性の値を $P_1^{fit}, \ldots, P_{n_{fit}}^{fit}$ とする。このとき、あるポテンシャルパラメータセット $(pp_1, \ldots, pp_{n_{pp}})$ を用いて計算される合わせ込みに用いる物性の値を $P_1^{pot}, \ldots, P_{n_{fit}}^{pot}$ とすれば、このポテンシャルパラメータセットの最適化関数は

$$\sum_{i=1}^{n_{fit}} \sum_{j=1}^{\infty} w_{ij} \left| P_i^{pot} - P_i^{fit} \right|^j$$
(3.6)

とすることができる. ここで w_{ij} は i 番目の物性の合わせ込みに用いた値と, 原子間 ポテンシャルを用いて算出された値の差の絶対値を j 乗した値に関する重み係数と なる. この重みは係数は調整する必要がある. また, ある物性値に関して, ある値以 下, もしくはある値以上としたい場合には 2.3.4 節において説明した不等式制約条件 を導入する. これによって, 原子間ポテンシャルの再現する物性を閾値内に収 めることができる場合もある.

Standard Fitting Data において主に使われる物性は単純な結晶構造の格子定数,内部構造パラメータ,凝集エネルギ,体積弾性率,弾性定数などである.また,Optional

Fitting Data において主に使われる物性は系に特有の結晶構造(多くの場合複雑な結 晶構造)の格子定数,内部構造パラメータ,凝集エネルギ,体積弾性率,弾性定数,非 結晶構造の平衡状態における原子構造と生成エネルギ,とそれに加えて,統計量にか かわる物性値(例えば,融点温度,アモルファス構造のRDFなど)である.このうち, 瞬時に計算できる物性のみを式(3.6)における最適化関数に用いる.Standard Fitting Data はほぼ瞬時に算出できる物性に設定してあるので,多くの場合,合わせ込みに用 いる物性のうち,Optional Fitting Data から,非常に複雑な結晶構造の物性と統計量と 密接にかかわる物性を除いた物性となる.このため,Optional Fitting Data を

- Optional Fitting Data のうち計算時間の短い物性 (Optional Fitting Data (A))
- Optional Fitting Data のうち計算時間のかかる物性 (Optional Fitting Data (B))

に2種類に分けて説明を行う.以降,これらの高速な計算手法について解説する.

対称性の高い構造の物性算出

対称性を持ち, n 個の原子を含む原子構造 S が n^S_L 種の格子定数と n^S_I 種の内部構 造パラメータで定義可能であるとする.本研究では,このような対称性の高い原子構 造の平衡状態におけるエネルギ,格子定数,弾性定数,体積弾性率,原子体積依存のエ ネルギ曲線を Standard Fitting Data として採用している.ここでは,このような構造 S の物性の算出法について述べる.

まず,構造 *S*内にある *n* 個の各原子の局所原子環境を調べることによって,これら *n* 個の原子を t(< n) 種類の原子タイプに判別する. ここで, $i(1 \neq i \leq t)$ 番目の原子タ イプが n_i^t 個ずつ存在したとする. つまり, これらの総和は原子数 ($\sum_i^t n_i^t = n$)となる. さらに, *i* 番目の原子タイプが持つ全結合を b_i 種類の結合タイプに分類する. ここで, *i* 番目の原子タイプが持つ *j* 番目の結合タイプが $n_{i,j}^b$ 個ずつ存在したとする. また, *i* 番目の原子タイプが持つ *j* 番目の結合タイプのエネルギは $E_{i,j}^b$ とすれば, よって, 系 のエネルギ Φ は

$$\Phi = \frac{1}{2} \sum_{i}^{t} \left[n_{i}^{t} \sum_{j} \left(n_{i,j}^{b} \times E_{i,j}^{b} \right) \right]$$
(3.7)

のように表現できる. このため, 系全体のポテンシャルエネルギは $\sum_i n_i^t \times n_i^b$ 種類の 結合のエネルギのみを計算すれば良いことになる. ここで, 原子構造 S は n_L^S 種の格 子定数と n_I^S 種の内部構造パラメータで定義可能であるから, これらのパラメータさ え決まれば各結合タイプのエネルギ $E_{i,j}^b$ を算出することが出来る. つまり, 構造 S の エネルギは格子定数が $L_1^S, \ldots, L_{n_L}^S$, 内部構造パラメータが $I_1^S, \ldots, I_{n_I}^S$ さえ与えれば, 式 (3.7) を用いて, ポテンシャルエネルギを算出することが出来る. よって, 平衡状態 における格子定数を算出するためには, これらの構造パラメータを引数とし, 式 (3.7) を目的関数として、多次元最適化手法で目的関数(エネルギ)を最小化すればよい. このときの格子定数の値が平衡格子定数,目的関数の値を平衡状態における凝集エネル ギとなる.特に、BCCやFCCをはじめ、多くの基礎的な結晶がそうであるように1種 類の格子定数だけで原子構造を表現できる対称性の非常に高い結晶の場合、引数が1 種類の格子定数だけになるから、直線探索手法で目的関数を最小化することができる.このため、非常に高速な物性算出が可能となる.

次に弾性的性質の算出について述べる.原子間ポテンシャルを用いて,解析的に体 積弾性率や弾性定数を算出することも可能であるが,そのためには2階微分の計算が 必要となるため,ポテンシャル関数形によってはコーディングの手間が大きく,特に ポテンシャル関数形を頻繁に変更するような場合には,余り向かない.そこで,多く の場合2.1.8節で述べた変形テストによって平衡構造を変形させたときの圧力から体 積弾性率や弾性定数を求める.ダイヤモンド格子について例を述べると,内部変位を 持たず,格子定数が1種類Lだけの立方晶であり,その格子マトリックスは,

$$\boldsymbol{h} = \begin{bmatrix} L & 0 & 0 \\ 0 & L & 0 \\ 0 & 0 & L \end{bmatrix}$$
(3.8)

となる. この結晶構造の平衡構造を求めるには格子定数 L を最適化するだけでよいから, 直線探索で平衡格子定数 L_{eq} を求めることができる. ダイヤモンド格子のような z 軸, x 軸が共に 4 次の対称軸の場合, 弾性定数は

| C_{11} | C_{12} | C_{12} | 0 | 0 | 0 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| C_{12} | C_{11} | C_{12} | 0 | 0 | 0 |
| C_{12} | C_{12} | C_{11} | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | C_{44} | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | C_{44} | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C_{44} |

のようになり, C_{11}, C_{12}, C_{44} のみとなる. まず, 平衡構造に引張りひずみ $\epsilon_x = \epsilon$ のみを 与え, C_{11}, C_{12} を求める. このときの格子は

$$\begin{bmatrix} (1+\epsilon)L_{eq} & 0 & 0\\ 0 & L_{eq} & 0\\ 0 & 0 & L_{eq} \end{bmatrix}$$
(3.10)

となり,また,内部構造パラメータはゼロである.このため,ひずみベクトルは

| ϵ | | |
|------------|-------|----|
| 0 | | |
| 0 | (2.11 | |
| 0 | (3.1) | .) |
| 0 | | |
| 0 | | |

となるから,

$$\begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{yz} \\ \tau_{zx} \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} = \frac{1}{\epsilon} \begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{31} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} \\ C_{21} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$
(3.12)

となり, $C_{11} = \frac{\sigma_{11}}{\epsilon}, C_{12} = C_{21} = \frac{\sigma_{22}}{\epsilon}$ が求まる.

次に, 平衡構造にせん断ひずみ $\gamma_{xy} = \tau$ のみを与え, C_{44} を求める. このときの格子は

$$\begin{bmatrix} L_{eq} & (\tau)L_{eq} & 0\\ 0 & L_{eq} & 0\\ 0 & 0 & L_{eq} \end{bmatrix}$$
(3.13)

となり,また,内部構造パラメータが1種類発生するため,まず,格子を固定したまま, 内部構造パラメータを最適化し,原子位置を最適化する.このとき,ひずみベクトルは

| 0 | |
|------------------------|--------|
| 0 | |
| 0 | (3.14) |
| 0 | (3.14) |
| 0 | |
| $\lfloor \tau \rfloor$ | |

となるから,

| $\left[\begin{array}{c}\sigma_x\\\sigma_y\\\sigma_z\\\tau_{yz}\\\tau_{zx}\\\tau_{xy}\end{array}\right]$ | $=rac{1}{	au}$ | $\left[egin{array}{c} \sigma_{11} & \sigma_{22} & \sigma_{33} & \sigma_{23} & \sigma_{23} & \sigma_{31} & \sigma_{12} & $ |] = | $\left[\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ C_{66} \end{array} \right]$ | (3.15 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|

となり, $C_{66} = C_{44} = \frac{\sigma_{12}}{\tau}$ が求まる.

このように結晶構造の平衡状態におけるエネルギや弾性定数は非常に限れらたパ ラメータで表現することができる.このため,瞬時の計算が可能であり,簡単に多く の結晶構造を合わせ込みに用いることができる.

対称性の低い構造の物性算出

まったく対称性のない原子構造では、含まれる原子数をnとすれば、格子マトリックスの自由度も含めると、構造は3n+9自由度を持つことになる.対称性の低い構造でも同様に大きな自由度を持つことになる.このような大きな自由度を持った構造を多次元最適化法を用いて、構造を緩和することは非常に長い時間がかかるため、合わせ込みプロセス中に組み入れることは現実的ではない.そこで、対称性の低い構造のエネルギを合わせ込むためには、合わせ込みによって得られる代表的なポテンシャルパラメータを用いて構造緩和を行う作業を繰り返す手法を用いる.作業を繰り返すことによって次第に、ポテンシャルパラメータと緩和された構造が収束して行き、最終的には、緩和された構造のエネルギを合わせ込みに用いることが出来るようになる.

具体的に対称性の低い構造 S^{ns} のエネルギを合わせ込む作業を説明する.まず,1 回目のポテンシャル合わせ込み作業を行い,ポテンシャルパラメータセットを得る. このうちの1つのポテンシャルパラメータセットを用いて,第一原理計算によって S^{ns} を緩和した S_0^{ns} の構造の緩和計算を行い,緩和された原子座標とセルを得る.こ こで得られた構造を S_1^{ns} とする.次に, S_1^{ns} のエネルギ(合わせ込み中で緩和計算は行 わない)を合わせ込みの物性に含めて,2回目のポテンシャル合わせ込み作業を行い, ポテンシャルパラメータセットを得る.このうちの1つポテンシャルパラメータセッ トを用いて, S_1^{ns} 構造の緩和計算を行い,緩和された原子座標とセルを得る.ここで得 られた構造を S_2^{ns} とする.この作業を n_f 回繰り返して,構造 S_{nf}^{ns} を得る.ここで,合 わせ込み作業において得られるポテンシャルパラメータセットがほぼ収束していた ら, $n_f + 1$ 回目の合わせ込み作業でも、構造 S_{nf}^{ns} は、合わせ込み作業中における候補 のポテンシャルパラメータセットを用いて緩和された構造となる.このように、緩和 された構造のエネルギを合わせ込みに用いることが出来るようになる.

上記のような手法のために,第一原理計算から得られた構造とはやや異なる構造 になることも有り得るが,最低限エネルギだけは合わせ込むことが出来る.

3.5.3 許容範囲にあるポテンシャルパラメータセットの選別

3.5.2 節で述べたように Standard Fitting Data と Optional Fitting Data (A) のみを用 いて、ポテンシャルパラメータ最適化を行っている. このため、この段階では統計量に 関わる物性をはじめとする計算時間のかかる物性 (Optional Fitting Data (B))の再現 性に関しては未知である. そこで、作成した多数のポテンシャルパラメータセットか ら (Optional Fitting Data(B) も含めて) 合わせ込みに用いた物性値に関して、なるべく 設定した閾値内で再現できているような複数のポテンシャルパラメータセットを選 び出す. 必ずしも合わせ込みに用いた全ての物性値に関して、閾値内で再現できるわ けではないが、その場合もなるべく多くの物性を閾値内で再現できるポテンシャルパ ラメータセットを選ぶ.得られるポテンシャルパラメータセットの数は,高々数100,数1000程度であり,統計量の算出にもそれほど多くの時間を要すことはない.

ただし, 闇雲にポテンシャルパラメータセットを作成したとしても, Optional Fitting Data (B) を閾値内で再現できるポテンシャルパラメータセットを作成できる保証はな い. このため, 感度解析やシミュレイティッドアニーリングのような手法を行い, ポテ ンシャルパラメータ最適化に用いていない Optional Fitting Data (B) の再現を目指す.

感度解析によるポテンシャルパラメータ最適化に直接は用いていない物性の再現は 以下のように行う.開発した複数のポテンシャルパラメータセットを調べて、Optional Fitting Data (B) のうち再現できなかった物性 M_B^o に影響の強いポテンシャルパラメー P_c を発見する.そして、ポテンシャルパラメータ P_c の値を固定し、Standard Fitting Data と Optional Fitting Data (A) を用いて、ポテンシャルパラメータ最適化をやり直 す.ポテンシャルパラメータ P_c の値が異なるポテンシャルパラメータセットを複数 生成し、 M_B^o を再現できるポテンシャルパラメータセットがあるかを調べる.

シミュレイティッドアニーリングのような手法によるポテンシャルパラメータ最 適化に直接は用いていない物性の再現は以下のように行う.まず,開発した複数のポ テンシャルパラメータセットを調べて,この中では M_B^o を比較的再現できるポテン シャルパラメータを発見する.次に,このポテンシャルパラメータを初期遺伝子とし て遺伝的アルゴリズムを再スタートして、主に突然変異(少しだけパラメータを変 更することに対応)を利用して,近傍ののポテンシャルパラメータセットを生成す る.そして,これらの中に M_B^o を再現できるポテンシャルパラメータセットがあるか を調べる.

3.6 ポテンシャルパラメータセットの評価/選択における 指針

前の工程までに、複数のポテンシャルパラメータセットを得られているため、これ らの再現する物性を評価を行って、この中から最終的に用いるポテンシャルパラメー タセットを選び出す工程となる.ただし、評価が悪ければ、これまでの工程を修正し て、ポテンシャルパラメータを再フィッティングすることもあり得る.

理想的な場合には、ここで、複数の性質の近いポテンシャルパラメータセットのみ が得られている.これらを用いて分子動力学計算を行っても、計算結果は大きく変化 しないため、どれを選んでも構わないということになる.しかしながら、最終的に一 つのポテンシャルパラメータセットを選ぶ必要性はあり、その場合、筆者は最も重要 と考えている物性の再現性が最も高いポテンシャルパラメータセットを選ぶ、もしく は、最適化関数の値の最も良いものを選ぶなどの基準を用いている.

ここで、閾値内で合わせ込みに用いた物性を再現できるポテンシャルパラメータ セットを得られていなかった場合は、ポテンシャル関数形を修正する、もしくは、合わ せ込みに用いる物性を減らすという修正を行うことによって、ポテンシャルパラメー タを再度開発することが望ましい.前者はポテンシャル関数形が不適であると考え、 より適切なポテンシャル関数形を選びなおすということである.後者は、一部の重要 でない物性、もしくは、どうしても再現できない物性は合わせ込みに用いないとして、 無視するということである.

逆に、大きく性質の異なるポテンシャルパラメータセットが得られてしまった場合 には、これらを用いて分子動力学計算を行うと、大きく異なる計算結果が出てしまう ことになる.このため、なるべく性質の近いポテンシャルパラメータセットが得られ るように合わせ込みに用いる物性を増加させることが望ましい.

3.7 結言

本章ではポテンシャル作成手法の全工程と各工程における指針の提示を行った.提 案するポテンシャル手法は計算目的の設定,ポテンシャル関数の選択,合わせ込む物 性の選択/収集,ポテンシャルパラメータ最適化,ポテンシャルパラメータセットの評 価/選択の5工程からなる.

計算目的を設定する工程では、対象とする計算系と重要となる物性を具体的にす ることを指針とする.通常、原子間ポテンシャルにはどうしても適用範囲が存在する と考えられる.このため、解析者は計算目的を明確に設定し、その目的に合致する原 子間ポテンシャルを用意する必要性がある.

ポテンシャル関数形を決定する工程においては、結合形態を良く表すポテンシャル 関数を用いる.その際、従来研究による代表的なポテンシャル関数形を活用すること が重要な指針となる.

合わせ込む物性の選択する工程における指針は、ロバスト性を確保する合わせ込 み物性 (Standard Fitting Data) と計算目的に応じて重要となる物性 (Optional Fitting Data)を選択することである. また、物性ごとにポテンシャル評価における許容閾値 の設定を行う. 合わせ込む物性を収集する工程において信頼性のある実験値と第一 原理計算からデータ収集することを指針とする.

ポテンシャルパラメータの最適化工程においては、遺伝的アルゴリズムを用いて、 Standard Fitting Data と Optional Fitting Data のうち計算時間の短い Optional Fitting Data (A) の再現性を目的関数にしてポテンシャルパラメータ最適化を行い、複数の ポテンシャルパラメータセットを作成することを指針とする. その中から Standard Fitting Data と Optional Fitting Data(Optional Fitting Data(B) も含めて) がなるべく許 容閾値内にあるセットを選ぶ.

ポテンシャルパラメータセットの評価/選択工程においては、同様の性質のポテン シャルパラメータセットが得られた場合はそれを選ぶ、もし、1つも許容できるポテ ンシャルパラメータセットがない場合には関数形の修正または合わせ込み物性を削 除することが指針となる. 逆に, 性質の大きく異なるポテンシャルパラメータセット が得られた場合には合わせ込み物性を追加するということが指針となる.

第4章 共有結合単元系への適用

-弾性定数と融点を再現する Si 系のための原子間ポテンシャルの開発-

4.1 緒言

4.1.1 工学的な背景

半導体分野では古典分子動力学シミュレーションを用いた計算が盛んに行われて おり、最も基本的な半導体材料であるシリコンに関する計算も数多くなされている. しかし、古典分子動力学シミュレーションにおいて用いられる原子間ポテンシャルは 原子間の相互作用を経験的な関数で記述するため、完全には原子間の相互作用を再現 することができない. このため、シリコンにおいても、様々な特徴を持った原子間ポ テンシャルが提案され、なかでもSWポテンシャル[17]、Tersoff ポテンシャル[3][4]、 EDIP[28] などが広く用いられている. Tersoff ポテンシャルは、結合エネルギが原子 の局所環境に依存するというボンドオーダの考え方[29] に基づいて開発されている. 中でもT3 ポテンシャルパラメータセットを採用した Tersoff ポテンシャル(以降、T3 ポテンシャル) 合わせ込まれたシリコン多形の凝集エネルギと格子定数(もしくは平 衡ボンド長さ)のみならず、アモルファス、欠陥、表面の特性も再現できることで知ら れている[30][31].

T3 ポテンシャルを用いた計算はこれまで数多くなされてきた. Kitabatake ら [32] は照射による欠陥生成/消滅, Motooka らはアモルファス化 [33], 固相エピタキシャル 成長 [34] の計算を行い, Nordlund ら [35] はインプランテーションによるシリコン基 板におけるカスケードダメージ生成について研究を行っている. Weber ら [36] は a-Si/ (001) c-Si 界面における結晶化プロセスについて, その基礎的構造を明らかにして いる. Marqués ら [37] は結晶のアモルファス化に対する Bond-defect 濃度の影響を調 べ, ある一定上の Bond-defect 濃度でアモルファス化が生じることを示した. Izumi ら は様々な手法で作成したアモルファスシリコンのオーダパラメータの評価 [38], シリ コン表面応力と表面弾性定数の計算 [39], アモルファスシリコンにおける均質核生成 [40], c-Si/a-Si 界面の評価 [41] を行っている.

しかしながら, T3 ポテンシャルにはダイヤモンド構造について, 弾性定数と融点が 実験値とは大きく離れているという欠点がある. このため, T3 ポテンシャルを用い た固相エピタキシャル成長の計算[34]においては, 結晶化速度と温度の関係を定量 的に評価することができず、また、表面や界面における弾性定数の評価[39][41]においても弾性定数を定量的に議論することが難しいものとなっている.

4.1.2 ポテンシャル作成分野における背景と目的

Marqués et al. [37] や Baskes [42] が指摘しているように、古典分子動力学法におい て、融点は簡単な手順では求まらず、長時間の固液2相系の分子動力学計算が必要と なる. このような理由から融点を直接合わせ込みに含めるのは難しく、これまで開発 されたきた原子間ポテンシャルは一般的に、エネルギや構造パラメータ、弾性的性質 にくらべて融点の再現性は低かった.

本章では、本研究で提案している原子間ポテンシャル作成手法の枠組みを用いて、 融点を再現できるような共有結合単元系のための原子間ポテンシャル作成手法を開 発する.そして、この原子間ポテンシャル開発手法を適用することによって、シリコン 単元系のダイヤモンド構造の融点を再現する原子間ポテンシャルの作成を行う.こ れによって、本研究で提案した原子間ポテンシャル作成の枠組みの共有結合単元系に 対する適用性を確かめることを目的とする.また、同時に提案したポテンシャル作成 手法の枠組みを用いて、融点という物性を再現を可能とするような原子間ポテンシャ ル作成手法を開発できるかを確かめることも目的とする.

4.1.3 T3 ポテンシャル

オリジナルの Tersoff ポテンシャル関数形において, 全エネルギ Φ は以下のように 表現されている,

$$\Phi = \frac{1}{2} \sum_{i} \sum_{j(\neq j)} \phi_{ij}(r_{ij}), \qquad (4.1)$$

$$\phi_{ij}(r_{ij}) = f_c(r_{ij}) \left[A \exp\left(-\lambda_1 r_{ij}\right) - b_{ij} B \exp\left(-\lambda_2 r_{ij}\right) \right], \tag{4.2}$$

$$f_c(r) = \begin{cases} 1, & r \le R_1 \\ \frac{1}{2} \left[1 + \cos\left(\pi \frac{r - R_1}{R_2 - R_1}\right) \right], & R_1 < r < R_2 \\ 0, & r \ge R_2 \end{cases}$$
(4.3)

ここで r_{ij} は i 原子と j 原子との原子間距離, A, B, λ_1 , λ_2 , R_1 , R_2 はポテンシャルパ ラメータ, $f_c(r_{ij})$ は原子間距離に依存するカットオフ関数, b_{ij} は式 (4.4) に示す有効 配位数に依存した i 番, j 番原子間のボンドオーダである. つまり, T3 ポテンシャル関 数はもっとも単純には原子間距離とボンドオーダに依存するポテンシャル関数であ るといえる. ボンドオーダ b_{ij} は以下のように計算される,

$$b_{ij} = \left(1 + \xi_{ij}^{\eta}\right)^{-\delta},\tag{4.4}$$

$$\xi_{ij} = \sum_{k \neq i,j} f_c(r_{ij}) g(\theta_{ijk}) \exp\left[\alpha \left(r_{ij} - r_{ik}\right)^\beta\right],\tag{4.5}$$

$$g(\theta) = g_{org}(\theta) = a \left\{ 1 + \frac{c^2}{d^2} - \frac{c^2}{d^2 + (h - \cos \theta)^2} \right\},$$
(4.6)

ここで, θ_{ijk} は原子 ij 間の結合と原子 ik 間の結合なす角, η , δ , α , β , a, c, d, h, はポテ ンシャルパラメータを表している. $\beta \ge \eta \times \delta$ はそれぞれ $3 \ge 0.5$ に固定されている.

式 (4.4) における ξ_{ij} はボンド ij を配位数 1 と仮定したときの j 原子を除いた i 原 子の配位数に相当し、単純に考えれば i 原子のカットオフ距離内にある j 原子以外の 原子数を数えることによって算出することができる. Tersoff はこの ξ_{ij} を有効配位数 と定義し、2 種の新たな効果を導入した. 1 つは、近接原子間における異なるボンド長 さの差 (i.e. $r_{ij} - r_{ik}$)を表現する項 (式 (4.5) における exponential 項)の導入であ り、もう 1 つは、結合角に対する依存性を表現する項 (式 (4.6)、以降、角度依存項)の 導入である.

この有効配位数 ξ_{ij} は結合エネルギの局所環境依存性を表現するボンドオーダ項 b_{ij} を通じて, ポテンシャルエネルギに反映される. b_{ij} は Abell[29] によって提案され た, δ を系に依存するパラメータとしたときのボンドオーダ b_{ij} と配位数 Z の関係,

$$b_{ij} \propto Z^{-\delta},$$
(4.7)

に基づき,式(4.4)のように定式化されている.ボンドオーダの配位数依存曲線の形 状はηとδによって調整することができる[43].

Tersoff ポテンシャル関数は原子間距離とボンドオーダに依存するポテンシャル関数で,ボンドオーダは配位数と結合角に依存するから,最終的には原子間距離,結合角,配位数に依存するポテンシャル関数であるといえる.

T3 ポテンシャルは実験から得られたダイヤモンド構造の格子定数,平衡状態における凝集エネルギ,体積弾性率,また,シリコンの平面状グラファイト構造,SC構造, BCC構造,FCC構造,それぞれの平衡状態における凝集エネルギの第一原理計算による値[44][45]を再現するようパラメータを合わせ込んでいる.加えて,ダイヤモンド構造の弾性定数が実験値と20%以内で一致するように合わせ込んでいる.

しかしながら, T3 ポテンシャルにおけるダイヤモンド構造の融点(2396K[37])は 実験値(1687K[46])よりもかなり高く, また, ダイヤモンド構造の体積弾性率は再 現できるものの, 弾性定数については Table 4.8 に具体的な値が示されているように, *C*₁₁, *C*₁₂, *C*₄₄ ともに実験値とは 10% から 15% 程度離れた値となっており, 特に *C*₁₂ と *C*₄₄ の大小関係が実験値とは逆転しているという問題点がある.

4.2 ELAST, MELT ポテンシャルの開発

本章では、カットオフ関数に改良を加えた Tersoff ポテンシャル関数形を用いた2 種のポテンシャルパラメータセットの開発を行う.1 つ目はダイヤモンドシリコン の弾性定数を合わせ込んだ ELAST ポテンシャルパラメータセット,2つ目はダイヤ モンドシリコンの弾性定数と融点をを合わせ込んだ MELT ポテンシャルパラメータ セットである.

4.2.1 計算目的の設定

本章では何か目的があって古典分子動力学計算を用いた解析を行うわけではない ので、実際に目的設定をすることができない.このため、計算の目的はあくまで仮定 の目的であるとする.ELAST ポテンシャルパラメータセットについては、弾性的性 質が重要となる系であると仮定する.MELT ポテンシャルパラメータセットについ ては、弾性的性質と融解現象が重要な系であると仮定する.このように仮定すると、 ELAST ポテンシャルにおいては弾性定数を再現し、MELT ポテンシャルにおいては 弾性定数と融点を再現する必要があることになる.

4.2.2 ポテンシャル関数形の決定

4.1.3 節で述べた Tersoff ポテンシャル関数形を用いて ELAST ポテンシャルパラ メータセットと MELT ポテンシャルパラメータセットの開発を行うが, カットオフ 関数にだけは改良を加える.式(4.3)で示したカットオフ関数は原子間距離 r に関し て2階微分が不連続であるため, Murty[47]が提案した2階微分が連続であるカット オフ関数を用いる.具体的には以下のカットオフ関数形を用いる.

$$f_{c}(r) = \begin{cases} 1, & r \leq R_{1} \\ \frac{1}{2} + \frac{9}{16} \cos\left(\pi \frac{r-R_{1}}{R_{2}-R_{1}}\right) - \frac{1}{16} \cos\left(3\pi \frac{r-R_{1}}{R_{2}-R_{1}}\right), \\ R_{1} < r < R_{2} \\ 0, & r \geq R_{2} \end{cases}$$
(4.8)

さらに、オリジナルの結合角依存項と等価であるが、わかりやすいように変形した 結合角依存項を用いる、オリジナルの結合角依存項 $g_{org}(\theta)$ は以下のように $g_{trans}(\theta)$ に変形できる.

$$g(\theta) = g_{trans}(\theta) = c_1 + \frac{c_2 (h - \cos \theta)^2}{c_3 + (h - \cos \theta)^2},$$
(4.9)

ここで, c_1 , c_2 , c_3 , h, はポテンシャルパラメータである. なお, 式 (4.9) は $c_1 = a$, $c_2 = ac^2/d^2$, $c_3 = d^2$ と置き換えると, 式 (4.6) に示したオリジナルの結合角依存項 $g_{org}(\theta)$ に変形することができる.

また, 関数の柔軟性を高めるために $\beta = 3$, $\eta \times \delta = 0.5$ の制約条件は削除する.

4.2.3 合わせ込み物性の選択

本章で用いるポテンシャル関数は結合距離,結合角, 配位数に依存するポテンシャル関数形であるから, ELAST ポテンシャルパラメータセット, MELT ポテンシャル パラメータセット開発のためには, これらを幅広く含む構造のエネルギを Standard Fitting Data として用いる必要がある.体的に合わせ込みに用いたのは,ダイマの結 合エネルギと平衡ボンド長さ,さらに,直鎖の凝集エネルギと平衡ボンド長さ,平面 状単層グラファイト,ダイヤモンド, SC, BCC, FCC 各構造の凝集エネルギと格子定 数である. Table 4.1 に示すように合わせ込みに用いる構造には広範な結合角と配位 数が含まれている. このため, これらは結合角と配位数という局所原子環境のための Standard Fitting Data に相当することになる.

Table 4.1: Coordination numbers between the nearest neighbor atoms and bond angles between the nearest neighbor bonds for silicon polytypes used for fitting.

| | coordination number | bond angles [degree] |
|-----------|---------------------|----------------------|
| Dimer | 1 | |
| Chain | 2 | 180 |
| Graphitic | 3 | 120 |
| Diamond | 4 | 109.5 |
| SC | 6 | 90, 180 |
| BCC | 8 | 70.5, 109.5, 180 |
| FCC | 12 | 60, 90, 120, 180 |

また、弾性的性質を再現するため、ダイヤモンド構造の C_{11} , C_{12} , C_{44} , $C_{44}^0 - C_{44}$, ζ を合わせ込みに用いる. C_{11} , C_{12} , C_{44} は弾性定数, ζ は Kleinman の内部変位パラメー タ、 C_{44}^0 は内部変位の影響を含まない C_{44} の成分である. C_{44}^0 と ζ は弾性定数ではない ものの弾性的性質に強く影響する [48] ために合わせ込みに用いることとした. また、 弾性定数を再現すれば体積弾性率も再現できるため、Murnaghan の式を用いれば、平 衡点付近の体積依存のエネルギ曲線もおおよそ再現できることになる. このため、 こ れらは結合距離という局所原子環境のための Standard Fitting Data に相当することに なる.

さらに MELT ポテンシャルではダイヤモンドシリコンの融点を合わせ込みに用い ることになる. Marqués et al. [37] Baskes [42] が指摘しているように, 古典分子動力 学において融点を計算するにはある程度の規模の大きさ (シリコンなら少なくとも 1000 個程度) の長時間 (数 nsec 程度) の固液 2 層計算が必要となる. このため, 直接合 わせ込みに用いることはほぼ不可能であり, Optional Fitting Data (B) として用いる.

4.2.4 合わせ込み物性の収集

実験結果の存在するダイマの平衡結合長,結合エネルギ,ダイヤモンド構造の格子 定数,凝集エネルギ,弾性定数,融点に関しては実験値を用いる.そのほかの仮想的 な構造の物性は第一原理計算から得る.Tersoff が合わせ込みに用いた第一原理計算 [44][45]においては、ブリルアンゾーンの既約領域(IBZ)内にk点が数十点程度で ある.合わせ込む物性値の精度を高めるため,IBZ内に数千点程度のk点を持つよう な精度を高い第一原理計算を新たに行う.

まず、シリコンの直鎖、平面状単層グラファイト構造、ダイヤモンド構造、SC構造、 BCC構造、FCC構造それぞれの平衡ボンド長さと凝集エネルギの算出を行う. イオ ンコアと価電子の相互作用は PAW 法 [49][50] によって記述し、平面波のカットオフ を 450eV とし、交換相関項にはスピンを考慮した局所密度近似 (Local Spin Density Approximation: LSDA)を用いた. 単位格子あたりの原子数は直鎖で1個、グラファイ ト構造で 2個、ダイヤモンド構造で 2個、SC構造で 1個、BCC構造で 2個、FCC構造 で 1個である. Monkhorst-Pack の特殊点法 [51] を用いて、直鎖で 45×1×1、グラファ イト構造で 35×35×1、ダイヤモンド構造で 45×45×45、SC構造で 45×45×45、 BCC構造で 45×45×45、FCC構造で 45×45×45 のk点グリッドでk点の発生を 行った.

 $C_{11}, C_{12}, C_{44}, \zeta$ に関しては実験値が存在するため、実験値を合わせ込みに用いる が、内部変位のないせん断変形状態というのは仮想的な構造であるため、 $C_{44}^0 - C_{44}$ の 値は第一原理計算によって算出する.単位格子あたりの原子を8個とし、11×11×11 のk点グリッドでk点の発生を行った.圧力が0.00001[GPa]以下になるまで格子の 等方緩和計算を行って、格子定数を算出し、0.1%せん断ひずみを与え、緩和しないと きの圧力をひずみで割ることによって弾性定数 C_{44}^0 を算出し、0.1%せん断ひずみを 与え、緩和したときの圧力をひずみで割ることによって弾性定数 C_{44} を算出し、その 差を計算することによって $C_{44}^0 - C_{44}$ を決定した.

交換相関項に LDA (LSDA も含む)を用いたのは、GGA に比べて弾性的性質の再 現性が高かったためである.しかしながら、LSDA も含めて LDA を用いた計算では 通常凝集エネルギの絶対値を大きめに算出し、格子定数を短く算出してしまうため、 第一原理計算によって取り扱われた構造については、それぞれのダイヤモンド構造に 対する相対的な凝集エネルギと、ダイヤモンド構造の格子定数が実験値に合うよう にスケーリングした格子定数(もしくは平衡ボンド長さ)を用いる.

4.2.5 ポテンシャルパラメータの最適化

EALST ポテンシャルパラメータセットを得るために, 4.2.4 節で述べたような手法 で算出した物性値を Standard Fitting Data として, これらの物性を再現できるように 遺伝的アルゴリズムを用いて, ポテンシャルパラメータの最適化を行った.

4.2.6 結果

ELAST ポテンシャルパラメータセットと MELT ポテンシャルのパラメータセット の値を Table 4.2 に示す. Tersoff による制約条件 ($\beta = 3 \ge \eta \times \delta = 0.5$) を除いたに もかかわらず, ELAST ポテンシャルパラメータセットは T3 ポテンシャルパラメータ セットと比較的近い値となった. これに対し, MELT ポテンシャルパラメータセットに おいては, $\beta = 1$ and $\eta \times \delta = 1.3$ となり, Tersoff による制約条件 ($\beta = 3 \ge \eta \times \delta = 0.5$) とは大きく離れた値となった.

Table 4.2: Potential parameters for ELAST potential and MELT potential.

| | ELAST | MELT | Т3 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| A[eV] | 1884.3288 | 2868.1799 | 1830.8 |
| B[eV] | 451.68053 | 123.00877 | 471.18 |
| $\lambda_1[1/Å]$ | 2.5105461 | 3.1086970 | 2.4799 |
| $\lambda_2[1/Å]$ | 1.7322451 | 1.4102230 | 1.7322 |
| η | 0.71493555 | 0.69968166 | 0.78734 |
| $\eta\times\delta$ | 0.50000000 | 1.30000000 | 0.5 |
| α | 0.00000000 | 1.80000000 | 5.1975 |
| β | _ | 1 | 3 |
| c_1 | 0 | 0 | 0.0000010999 |
| c_2 | 139147.88 | 68928.296 | 42.150 |
| C_3 | 1000000.0 | 1000000.0 | 262.99 |
| h | -0.50792836 | -0.50866445 | -0.59826 |
| $R_1[Å]$ | 2.55 | 2.9 | 2.7 |
| $R_2[\mathring{A}]$ | 3.25 | 3.2 | 3.0 |
| | | | |

ELAST ポテンシャルと MELT ポテンシャルを用いて算出されたダイヤモンドシリコンの物性値を Table 4.3 に示す.

ELAST ポテンシャルについては凝集エネルギ,格子定数,弾性定数 C_{11} , C_{12} , C_{44} , 内部変位 ζ が実験値と良い一致を見せた. $C_{44}^0 - C_{44}$ については第一原理計算値より もわずかに大きくなったもののその精度はT3 ポテンシャルよりは改善した. 合わせ 込みに用いていないダイヤモンドシリコンの融点に関しては実験値やT3 ポテンシャ ルよりも高い値となった.

MELT ポテンシャルについては凝集エネルギ,格子定数,弾性定数 C_{11}, C_{12}, C_{44} ,内 部変位 ζ が実験値と良い一致を見せた. $C_{44}^0 - C_{44}$ と ζ については第一原理計算によ る値よりもわずかに大きくなったものの T3 ポテンシャルよりは第一原理計算による

Table 4.3: Physical properties of diamond silicon calculated using ELAST potential and MELT potential. E_0 , a, C_{ij} , ζ and T_m are cohesive energy, lattice constant, elastic constants, Kleinman's internal strain parameter and the melting point, respectively. C_{44}^0 is the theoretical value obtained for C_{44} in the absence of internal displacement, and C_{44}^* is defined by $C_{44}^0 - C_{44}$.

| | $Exp^{a}(LSDA^{b})$ | ELAST | MELT | T3 |
|------------------------------|---------------------|--------|--------|----------------|
| E_0 [eV/atom] | -4.63 | -4.630 | -4.630 | -4.630 |
| a[Å] | 5.429 | 5.429 | 5.429 | 5.432 |
| <i>C</i> ₁₁ [GPa] | 167 | 164.6 | 163.8 | 142.5 |
| C ₁₂ [GPa] | 65 | 66.3 | 67.8 | 75.4 |
| C_{44} [GPa] | 81 | 80.9 | 82.0 | 69.0 |
| C_{44}^0 [GPa] | (106) | 122.0 | 125.4 | 118.8 |
| C_{44}^* [GPa] | (30) | 41.1 | 43.5 | 49.8 |
| ζ | 0.533^{c} | 0.5826 | 0.6191 | 0.6746 |
| $T_m[\mathbf{K}]$ | 1687^{d} | 2809 | 1992 | 2396 ± 5^{e} |

^a Reference [30] and therein

^b is obtained in this work using VASP.

 c Reference [52] .

 d Reference [46] .

 e Reference [37] .

値に近い値となった.ダイヤモンドシリコンの融点に関しては1990Kとなり,T3ポテンシャルによる融点よりは改善したものの,実験値(1687K)[46]とはまだ差が残った

ELAST ポテンシャルと MELT ポテンシャルを用いて算出されたシリコン多形の 平衡状態における凝集エネルギを Table 4.4 に示す. 凝集エネルギに関しては合わせ 込みに用いたダイヤモンド構造に対する相対エネルギを示している. Table 4.4 にお いては X ポテンシャルの誤差を以下のように定義している.

 $\left|\frac{E_{rel}^{DFT} - E_{rel}^X}{E_{rel}^{DFT} + E_{ref}^{Exp}}\right| \times 100,\tag{4.10}$

ここで, E_{rel}^{DFT} , E_{rel}^{X} はそれぞれ第一原理計算による相対エネルギと X ポテンシャルを用いて算出された相対エネルギ, E_{ref}^{Exp} は参照エネルギとして用いられるダイヤモンドシリコンの実験における凝集エネルギである.

単層平面型グラファイト構造, SC 構造, BCC 構造, FCC 構造に関しては ELAST ポ テンシャル, MELT ポテンシャルともに第一原理計算によって得られた相対エネルギ を再現している. ただし, ダイマのエネルギに関しては実験値より 0.16 eV/atom 小さ くなり, 直鎖のエネルギに関しては第一原理計算による値より 0.11 eV/atom 小さく なった. しかしながら, ダイマと直鎖はダイヤモンド構造に比べて非常にエネルギが 高く, バルクシリコンにおいてはほぼ出現しない構造であるため, この程度のずれは 問題にならないと考えられる.

Table 4.4: The relative energies of polytypes of silicon calculated using ELAST potential and MELT potential in eV/atom.

| | $LSDA^{a}(exp^{b})$ | ELAST | Error [%] | MELT | Error [%] | T3 |
|-----------|---------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| Dimer | (3.01) | 3.354 | 21.235 | 3.354 | 21.245 | 3.297 |
| Chain | 2.260 | 2.523 | 11.066 | 2.516 | 10.797 | 2.254 |
| Graphitic | 0.772 | 0.805 | 0.856 | 0.807 | 0.889 | 0.718 |
| Diamond | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SC | 0.276 | 0.322 | 1.059 | 0.302 | 0.599 | 0.318 |
| BCC | 0.435 | 0.397 | 0.905 | 0.433 | 0.041 | 0.433 |
| FCC | 0.449 | 0.444 | 0.113 | 0.433 | 0.361 | 0.724 |

^{*a*} is obtained in this work using VASP.

^b References [30].

ELAST ポテンシャルと MELT ポテンシャルを用いて算出されたシリコン多形の 平衡状態における平衡結合長はを Table 4.4 に示したように良く再現されている.

Table 4.5: The bond lengths of polytypes of silicon calculated using ELAST potential and MELT potential in Å.

| | Scaled LSDA ^{a} (exp ^{b}) | ELAST | Error [%] | MELT | Error [%] | T3 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| Dimer | (2.246) | 2.312 | 2.939 | 2.320 | 3.273 | 2.295 |
| Chain | 2.192 | 2.388 | 8.963 | 2.380 | 8.590 | 2.342 |
| Graphitic | 2.241 | 2.312 | 3.186 | 2.320 | 3.521 | 2.304 |
| Diamond | 2.351 | 2.351 | 0.000 | 2.351 | 0.000 | 2.352 |
| SC | 2.513 | 2.541 | 1.102 | 2.503 | 0.413 | 2.544 |
| BCC | 2.650 | 2.672 | 0.838 | 2.694 | 1.663 | 2.671 |
| FCC | 2.712 | 2.732 | 0.715 | 2.736 | 0.872 | 2.773 |

^{*a*} is obtained in this work using VASP.

^b References [30].

ELAST ポテンシャルと MELT ポテンシャルを用いて算出されたシリコン多形の 原子体積依存の凝集エネルギ曲線をそれぞれ Fig. 4.1 と Fig. 4.2 に示す.

空孔生成エネルギと自己挿入欠陥生成エネルギを Table 4.6 に示す. 両ポテンシャルともにおおよそ T3 ポテンシャルと同様の精度で再現できていることがわかる.

ELAST ポテンシャルにおいて、ダイヤモンドシリコンの弾性定数を再現できたということははダイヤモンドシリコンの弾性定数はオリジナルの Tersoff ポテンシャル 関数でも再現できることを示している. T3 ポテンシャルにおいて、弾性定数を精度 良く再現できなかったのは、合わせ込み時に 20%もの誤差を許容したことが原因で あると予測される. ELAST ポテンシャルにおいて、ダイヤモンドシリコンの融点を 再現で汚かったということははダイヤモンドシリコンの融点はオリジナルの Tersoff ポテンシャル関数でも再現できないということを示している.

4.3 MOD ポテンシャルの開発

4.2 節においては、Tersoff ポテンシャル関数を用いた場合、ダイヤモンドシリコン の融点をできないということがわかった.このため、「ポテンシャルパラメータセットの評価/選択」工程の指針で述べたようにポテンシャル関数形の修正を行い、再フィ ティングすることによって、融点の再現性を高めることを目指す.本節で開発する修 正 Tersoff ポテンシャルを MOD ポテンシャルと呼ぶこととする.



Fig. 4.1: Cohesive energy as a function of atomic volume for ELAST potential.



Fig. 4.2: Cohesive energy as a function of atomic volume for MELT potential.

Table 4.6: Formation energies for vacancy and self-interstitial defects calculated using ELAST potential and MELT potential in eV.

| | ELAST | MELT | T3 | LDA (GGA) |
|--------------------|-------|------|------|------------------------------------|
| Vacancy(relaxed) | 4.11 | 3.86 | 3.70 | $3.3-4.3^a \ 3-4^b \ 3.29^c$ |
| Vacancy(unrelaxed) | 4.29 | 4.30 | 4.10 | $4.5^b \ 3.65^c$ |
| Tetragonal | 4.56 | 3.94 | 3.44 | $3.7-4.8^a \ 5-6^b \ 3.43(4.07)^d$ |
| Hexagonal | 5.04 | 4.61 | 4.60 | $4.3-5.0^a \ 4-5^b \ 3.31(3.80)^d$ |
| Bond Centered | 6.76 | 6.59 | 5.86 | $4-5^{b}$ |
| Split<110> | 5.42 | 4.45 | 4.39 | $3.31(3.84)^d$ |

^{*a*} Reference [53] and references therein.

^b Reference [30] and references therein.

^c Reference [54].

^d Reference [55].

4.3.1 計算目的の設定

MOD ポテンシャルも MELT ポテンシャルと同様に弾性的性質と融解現象が重要 な系であると仮定する. このように仮定すると,弾性定数と融点を再現する必要があ ることになる.

4.3.2 ポテンシャル関数形の決定

MOD ポテンシャルでは、結合角依存項を改良した修正 Tersoff ポテンシャル関数形 を新たに用いる. 極小点付近の関数形状をフレキシブルに細かに調節できるようにし ながらも、結合角依存項の形状は Tersoff ポテンシャル関数形と相似形状となるよう に、式 (4.6) に示したオリジナルの結合角依存項 $g_{org}(\theta)$ を次の式 (4.11) から式 (4.13) の $g_{org}(\theta)$ のように改良する.

$$g(\theta) = g_{mod}(\theta) = c_1 + g_o(\theta) g_a(\theta), \qquad (4.11)$$

$$g_o(\theta) = \frac{c_2 (h - \cos \theta)^2}{c_3 + (h - \cos \theta)^2},$$
(4.12)

$$g_a(\theta) = 1 + c_4 \exp\left[-c_5 \left(h - \cos\theta\right)^2\right],\tag{4.13}$$

ここで, c_1 , c_2 , c_3 , c_4 , c_5 , h, はポテンシャルパラメータである. なお, 式 (4.11) は $c_1 = a$, $c_2 = ac^2/d^2$, $c_3 = d^2$, $c_4 = 0$ と置き換えると, 式 (4.6) に示したオリジナルの $g_{org}(\theta)$
に変形することができる. また, 関数の柔軟性を高めるために Tersoff が設けた $\beta = 3$, $\eta \times \delta = 0.5$ という制約条件も削除した.

ELAST ポテンシャル, MELT ポテンシャル同様に式 (4.8) において示したカットオ フ関数には Murty[47] の提案したカットオフ関数を用いる.

4.3.3 合わせ込み物性の選択/収集

MOD ポテンシャルパラメータセット作成のためには、シリコン多形 (ダイマ,直鎖 構造、平面上単層グラファイト構造、ダイヤモンド構造、SC構造、BCC構造、FCC構造) の凝集エネルギ、格子定数 (もしくは平衡結合長)、ダイヤモンドシリコンの弾性定数 を Standard Fitting Data として用いる. また、ダイヤモンドシリコンの融点を Optional Fitting Data (B) として用いる. このうち、ダイマとダイヤモンド構造の物性値に関し ては実験値を用い、その他の物性値に関しては第一原理計算から得た.

4.3.4 ポテンシャルパラメータの最適化

4.2.5 節で述べたのと同様に遺伝的アルゴリズムを用いてポテンシャルパラメータ の最適化を行った. 遺伝的アルゴリズムによって得られた多数のポテンシャルパラ メータセットについて感度解析を行ったところ, ポテンシャルパラメータ h とポテ ンシャルパラメータ c4 が融点と強く関わっていることが示唆された. このため, 様々 なhと c4 の組み合わせに対して, h と c4 を固定してパラメータ最適化を行い, これら の中から融点を良く再現するパラメータセットを選んでいる. xy 方向の格子長さを 固定し, z 方向の圧力がゼロになるようにして, 温度一定で固液 2 相系の分子動力学 計算を行い, 固液界面位置が平衡になる温度を融点としている. この融点の求め方に ついてはマクロな融点に対応する融点を精度良く求められることが実証されている. 以前は T3 ポテンシャルによるダイヤモンドシリコンの融点は, 結晶が融解する温度 として, 3000K[4] と言われていたが, この固液 2 層系の平衡温度を測る手法を用いる ことによって 2396K[37] へと修正された. また, 融点の実験値 [46] は半導体に用いら れる純度 99.99999999% でほぼ無欠陥の FZ ウェハの値であり, 完全結晶の分子動力 学のモデルでも計算可能であると考えられる.

4.3.5 結果

新たに開発したポテンシャルパラメータを Table 4.7 に示し, 参考のために T3 ポテンシャルのポテンシャルパラメータも同時に示す.

また,角度依存項 $g(\theta)$ の形状をFig. 4.3 に示す.新たに開発したポテンシャルの角 度依存項の関数形状はT3 ポテンシャルの角度依存項の関数形状と類似の形状であ るが, $g_a(\theta)$ 項の影響で極小点付近における形状が若干鋭くなっている.

| | MOD | T3 |
|----------------------|-------------|--------------|
| A[eV] | 3281.5905 | 1830.8 |
| B[eV] | 121.00047 | 471.18 |
| $\lambda_1[1/Å]$ | 3.2300135 | 2.4799 |
| $\lambda_2[1/Å]$ | 1.3457970 | 1.7322 |
| η | 1.0000000 | 0.78734 |
| $\eta \times \delta$ | 0.53298909 | 0.5 |
| α | 2.3890327 | 5.1975 |
| β | 1 | 3 |
| c_1 | 0.20173476 | 0.0000010999 |
| c_2 | 730418.72 | 42.150 |
| C_3 | 1000000.0 | 262.99 |
| c_4 | 1.0000000 | 0 |
| C_5 | 26.000000 | |
| h | -0.36500000 | -0.59826 |
| $R_1[Å]$ | 2.7 | 2.7 |
| $R_2[\mathring{A}]$ | 3.3 | 3.0 |

Table 4.7: Potential Parameters for MOD potential.



Fig. 4.3: Normalized angular-dependent terms of our proposed potential and the T3 potential.

新たに開発したポテンシャルパラメータを用いて算出したダイヤモンド構造の物 性を Table 4.8 に示す. 凝集エネルギと格子定数は合わせ込み時に実験値に合うよう スケーリングしているため,本研究で開発したポテンシャルは実験値を完全を再現し ている. 弾性定数 C_{11}, C_{12}, C_{44} ,内部変位パラメータ ζ については,T3 ポテンシャル とは異なり,ほぼ実験値を再現している. 弾性定数 $C_{44}^0 - C_{44}$ については,第一原理計 算で算出した値より,やや大きな値となったが,T3 ポテンシャルに比べれば大きく改 善している. 融点に関しては実験値をほぼ再現している.

| | $Exp.^{a}(LSDA^{b})$ | MOD | T3 |
|------------------------------------|----------------------|--------|--------------|
| $\overline{E_0 \text{ [eV/atom]}}$ | -4.63 | -4.630 | -4.630 |
| a [Å] | 5.429 | 5.429 | 5.432 |
| C ₁₁ [GPa] | 167 | 166.4 | 142.5 |
| C ₁₂ [GPa] | 65 | 65.3 | 75.4 |
| C ₄₄ [GPa] | 81 | 77.1 | 69.0 |
| C_{44}^{0} [GPa] | (106) | 120.9 | 118.8 |
| C_{44}^* [GPa] | (30) | 43.8 | 49.8 |
| ζ | 0.533^{c} | 0.5526 | 0.6746 |
| $T_m[\mathbf{K}]$ | 1687^{d} | 1681 | 2396 ± 5^e |

Table 4.8: Physical properties of diamond silicon calculated using MOD potential.

^a Reference [30] and references therein.

^b is obtained in this work using VASP.

^c Reference [52].

^d Reference [46].

^e Reference [37].

新たに開発したポテンシャルパラメータを用いて算出したシリコン多形の平衡状態における凝集エネルギと平衡ボンド長さをそれぞれ Table 4.9 と Table 4.10 に示す. ただし、エネルギ値に関しては、第一原理計算との比較のためにダイヤモンド構造に対する相対値とした.また、Table 4.9 において合わせ込みに用いた凝集エネルギからの誤差は式(4.10)で定義したものを用いた.

平面状単層グラファイト構造, SC 構造, BCC 構造, FCC 構造に関しては, 高い精度 で第一原理計算による値を再現できていることがわかる. ただし, ダイマのエネルギ に関しては実験値より 0.16 eV/atom 小さくなり, 直鎖のエネルギに関しては第一原 理計算による値より 0.11 eV/atom 小さくなった. しかしながら, ダイマと直鎖はダイ ヤモンド構造に比べて非常にエネルギが高く, バルクシリコンにおいてはほぼ出現 しない構造であるため, この程度のずれは問題にならないと考えられる. 平衡ボンド

| Table 4.9: | Relative | energies | of | silicon | polytypes | calculated | using | MOD | potential | in |
|------------|----------|----------|----|---------|-----------|------------|-------|-----|-----------|----|
| eV/atom. | | | | | | | | | | |

| | $LSDA^{a}(exp^{b})$ | MOD | Error [%] | T3 |
|-----------|---------------------|-------|-----------|-------|
| Dimer | (3.01) | 2.842 | 10.374 | 3.297 |
| Chain | 2.260 | 2.155 | 4.434 | 2.254 |
| Graphitic | 0.772 | 0.802 | 0.766 | 0.718 |
| Diamond | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SC | 0.276 | 0.308 | 0.732 | 0.318 |
| BCC | 0.435 | 0.438 | 0.061 | 0.433 |
| FCC | 0.449 | 0.447 | 0.030 | 0.724 |
| | | | | |

^{*a*} is obtained in this work using VASP.

^b Reference [30] and references therein.

| | Scaled LSDA ^{a} (exp ^{b}) | MOD | Error[%] | T3 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|
| Dimer | (2.246) | 2.216 | 1.327 | 2.295 |
| Chain | 2.192 | 2.330 | 6.313 | 2.342 |
| Graphitic | 2.241 | 2.321 | 3.556 | 2.304 |
| Diamond | 2.351 | 2.351 | 0.000 | 2.352 |
| SC | 2.513 | 2.498 | 0.624 | 2.544 |
| BCC | 2.650 | 2.633 | 0.645 | 2.671 |
| FCC | 2.712 | 2.722 | 0.364 | 2.773 |

Table 4.10: Bond lengths of silicon polytypes calculated using MOD potential in Å.

^{*a*} is obtained in this work using VASP.

^b Reference [30] and references therein



Fig. 4.4: Cohesive energy as a function of atomic volume for MOD potential.

長さに関しても、おおむね再現できていることがわかる.

空孔生成エネルギと自己挿入欠陥生成エネルギを Table 4.11 に示す. おおよそ T3 ポテンシャルと同様の精度で再現できていることがわかる.

4.4 考察

4.2 節, 4.3 節における結果から MELT ポテンシャルを用いた計算では再現できな かった融点が MOD ポテンシャルを用いた計算では再現できたのは結合角依存項を改 良したことに要因があると予測される.実際に, MOD ポテンシャル作成時には融点 について結合角依存項に含まれるポテンシャルパラメータ c4 に関して感度が高かっ たため, 融点を再現を行った.この予測を確かめるため, ダイヤモンドシリコンの融 点のポテンシャルパラメータ c4 についての依存性について調べた.ダイヤモンドシ リコンの融点のポテンシャルパラメータ c4 についての依存性を Fig. 4.5 に示す.

ポテンシャルパラメータ h, c_5, R_1, R_2 については MOD ポテンシャルと同じ値と し、そのほかのパラメータは、シリコンの凝集エネルギと平衡ボンド長さの配位数依 存性と弾性的性質を再現するように決定した. Fig. 4.5 に示すように融点は c_4 の増加 にしたがって単調に下がった. このため、 $g_a(\theta)$ 項が融点に強く影響を及ぼしている ことがわかる.

Table 4.11: Formation energies for vacancy and self-interstitial defects calculated using MOD potential in eV.

| | MOD | T3 | LDA (GGA) |
|--------------------|------|------|------------------------------------|
| Vacancy(relaxed) | 2.82 | 3.70 | $3.3-4.3^a \ 3-4^b \ 3.29^c$ |
| Vacancy(unrelaxed) | 2.85 | 4.10 | $4.5^b \ 3.65^c$ |
| Tetragonal | 3.27 | 3.44 | $3.7-4.8^a \ 5-6^b \ 3.43(4.07)^d$ |
| Hexagonal | 4.13 | 4.60 | $4.3-5.0^a \ 4-5^b \ 3.31(3.80)^d$ |
| Bond Centered | 5.03 | 5.86 | $4-5^{b}$ |
| Split<110> | 3.57 | 4.39 | $3.31(3.84)^d$ |

^a Reference [53] and references therein.

^b Reference [30] and references therein.

^c Reference [54].

^{*d*} Reference [55].



Fig. 4.5: Dependence of melting point on potential parameter c_4 was shown. The potential potential parameters h, c_5 , R_1 and R_2 are identical to those of our proposed potential shown in Table 4.7. The other parameters are optimized so that coordination dependence and elastic properties can be reproduced.

4.5 結言

提案したポテンシャル作成の枠組みを用いて,共有結合単元系であるシリコンの ための3種類のボンドオーダ型原子間ポテンシャルを開発した.3種類ともにダイヤ モンドシリコンの平衡格子定数,凝集エネルギ,弾性定数,シリコン多形の格子定数, 凝集エネルギを Standard Fitting Data として採用した.3種類のポテンシャルはそれ ぞれ(1)Tersoff ポテンシャル関数形を用いて Optional Fitting Data は用いない ELAST ポテンシャル,(2)Tersoff ポテンシャル関数形を用いて,ダイヤモンドシリコンの融点 を Optional Fitting Data (B) とした MELT ポテンシャル,(3) 結合角依存項を修正した Tersoff ポテンシャル関数形を用いて,ダイヤモンドシリコンの融点を Optional Fitting Data (B) とした MOD ポテンシャルである.提案したポテンシャルはすべて,シリコ ン多形の凝集エネルギと平衡格子定数を再現した.また, ELAST ポテンシャル(元々 融点を合わせ込んではいない) と MELT ポテンシャルはダイヤモンドシリコンの融 点を再現できなかったものの MOD ポテンシャルは再現することができた.これらの ことは提案した枠組みが共有結合単元系への適用できるということと,融点の合わ せ込みができるということを示している.

第5章 共有結合2元系への適用

–拡散現象とクラスタリング現象を再現する Si-B 系のための原子間ポテンシャルの開発–

5.1 緒言

5.1.1 工学的な背景

B は Si の p 型半導体において, 最も広く用いられている不純物であり, それが故 に, Si-B 系においては様々な技術的課題が存在しているからである. 例えば, イオ ンインプランテーションによる導入後のアニーリングによる B 原子の過渡増速拡散 (Transiend Enhanced Diffusion:TED)[56] や電気的に不活性な領域を生じさせる Si-B クラスタ [57] などである. このため, 第一原理計算によって, Si 中における B の拡散 経路の解明 [58] やクラスタ構造 [59][60] の解明が行われているが, 拡散やクラスタ 生成という問題は小規模の計算では取り扱うことが難しいために静的な計算にとど まっている. このため, もう少し大きな規模の時間スケールと空間スケールを取り扱 うことにできる古典分子動力学による解析が求められており, そのための拡散やク ラスタ生成を取り扱うことのできる原子間ポテンシャルが必要とされている.

5.1.2 ポテンシャル作成における背景と目的

これまでの多元系共有結合系の主だった原子間ポテンシャルには、2種類のポテン シャル関数形がある.1つは、単元系のポテンシャルパラメータをベースに、ごく少数 のポテンシャルパラメータを付け加えることによって多元系ポテンシャルパラメー タを決定するポテンシャル関数形 (例えば、Tersoff による SiC 系ポテンシャル [5])、 もう1つは多元系ポテンシャルパラメータを単元系ポテンシャルパラメータ個別に 決定するポテンシャル関数形 (例えば、Nakamura らによる InGaAsAI 系ポテンシャル [61]) である.前者については、簡易に作成できるものの合わせ込むポテンシャルパラ メータが少ないために、合わせ込める物性値の種類が少なく、高い精度の原子間ポテ ンシャルを作成することは難しい.後者については、多くの種類の物性値を合わせ込 むことはできる. このため、本章では、後者のポテンシャルパラメータを個別に決定 する手法を用いる.しかしながら、その作成手法はまだ確立されていないというのが 現状である. そこで、本研究で提案している原子間ポテンシャル作成手法の枠組みを適用する ことによって、拡散現象やクラスタリング現象を再現できるような共有結合2元系の 原子間ポテンシャル作成手法(ただし、ポテンシャルパラメータを個別に決定する手 法)の開発を行う.そして、この原子間ポテンシャル作成手法を共有結合2元系であ る Si-B 系に適用することによって、拡散現象、クラスタリング現象を再現できるよう な Si-B 系原子間ポテンシャルを作成する.本章では、この作成された Si-B 系原子間 ポテンシャルを評価することによって本研究で提案した原子間ポテンシャル作成の 枠組みの共有結合2元系に対する適用性を確かめることを目的とする.また、同時に 提案したポテンシャル作成手法の枠組みを用いて拡散現象やクラスタリング現象を 再現することのできるような原子間ポテンシャル作成手法を開発できるかを Si-B 系 を用いて確かめることも目的とする.

5.2 Si-B 系原子間ポテンシャルの開発

Si-B 系ポテンシャルパラメータは Si 同種原子間ポテンシャルパラメータ, B 同種 原子間ポテンシャルパラメータ, SiB 異種原子間ポテンシャルパラメータからなるが, Si 単元系には既存の T3 ポテンシャルを用いるため,本章で開発するポテンシャルパ ラメータは, B 同種原子間ポテンシャルパラメータと SiB 異種原子間ポテンシャルパ ラメータの2種である.

5.2.1 計算目的の設定

本章で開発する Si-B 系は Si 中の B 原子の拡散, B 原子のクラスタリング現象を模擬する古典分子動力学計算を行うことを目的として設定する.

5.2.2 ポテンシャル関数形の決定

前章の4.1.3 節でも述べたように共有結合系においては Tersoff によって開発され たボンドオーダ型環境依存原子間ポテンシャルの適合性が高く,これまで数多くの計 算例が存在する. Si-B 系も主として共有結合であるため, Tersoff ポテンシャル関数形 を多元系にも適用できる形で拡張した以下に示すポテンシャル関数形を用いる.

$$\Phi = \frac{1}{2} \sum_{i} \sum_{j(\neq i)} \phi_{ij} \tag{5.1}$$

$$\phi_{ij} = E_{ij}^{rep} - E_{ij}^{cov} \tag{5.2}$$

$$E_{ij}^{rep} = f_{c,a_i a_j} \left(r_{ij} \right) A_{a_i a_j} \exp\left(-\lambda_{1,a_i a_j} r_{ij} \right)$$
(5.3)

$$E_{ij}^{cov} = f_{c,a_i a_j} \left(r_{ij} \right) b_{ij} B_{a_i a_j} \exp\left(-\lambda_{2,a_i a_j} r_{ij}\right)$$
(5.4)

$$f_{c,ab}\left(r\right) = \begin{cases} 1, & r \leq R_{1,ab} \\ \frac{1}{2} + \frac{9}{16}\cos\left(\pi \frac{r - R_{1,ab}}{R_{2,ab} - R_{1,ab}}\right) - \frac{1}{16}\cos\left(3\pi \frac{r - R_{1,ab}}{R_{2,ab} - R_{1,ab}}\right), \\ R_{1,ab} < r < R_{2,ab} \\ 0. & r \geq R_{2,ab} \end{cases}$$
(5.5)

ここで, *i*, *j* は系はそれぞれ *i* 番原子, *j* 番原子, *a_i* は *i* 番原子の原子種, *r_{ij}* は *i* 番原 子, *j* 番原子間の距離 *a*, *b* はそれぞれ原子種 *a*, 原子種 *b* を表している. $A_{ab} = A_{ba}$, $B_{ab} = B_{ba}$, $\lambda_{1,ab} = \lambda_{1,ba}$, $\lambda_{2,ab} = \lambda_{2,ba}$, $R_{1,ab} = R_{1,ba}$, $R_{2,ab} = R_{2,ba}$ は原子種 *a*, *b* に依 存するパラメータである. b_{ij} は式 (5.6) に示す有効配位数に依存した *i* 番, *j* 番原子間 のボンドオーダである. つまり, T3 ポテンシャル関数はもっとも単純には原子間距離 とボンドオーダに依存するポテンシャル関数であるといえる. ボンドオーダ b_{ij} は以 下のように計算される,

$$b_{ij} = \left(1 + \zeta_{ij}^{\eta_{a_i a_j}}\right)^{-\delta_{a_i a_j}}$$
(5.6)

$$\zeta_{ij} = \sum_{k(\neq i,j)} f_{c,a_i a_k} (r_{ik}) \left\{ c_{1,a_i a_j a_k} + \frac{c_{2,a_i a_j a_k} \left(h_{a_i a_j a_k} - \cos\theta_{ijk}\right)^2}{c_{3,a_i a_j a_k} + \left(h_{a_i a_j a_k} - \cos\theta_{a_i a_j a_k}\right)^2} \right\}$$
(5.7)

ここで, k は系は k 番原子を表している. θ_{ijk} は i 番原子, j 番原子間のボンドと i 番 原子, k 番原子間のボンドのなす角度を表す. η_{ab} , δ_{ab} , $R_{e,ab} = R_{e,ba}$ は原子種 a, b に依 存するパラメータ, $\alpha_{abc} = \alpha_{acb}$, $\beta_{abc} = \beta_{acb}$, $c_{1,abc}$, $c_{2,abc}$, $c_{3,abc} = c_{3,acb}$, $h_{abc} = h_{acb}$ は 原子種 a, b, c に依存するパラメータである. 4.1.3 節において示したボンドーダの算 出法と考え方は同じであるが, 多元系であるため, 近接原子を数える際, 有効配位数 への寄与が中心原子と近接原子の2つの原子の原子種の組み合わせによって異なり, 結合角の効果を取り込む際, 角度依存の効果が結合角をなす3つの原子の原子種の組 み合わせによって異なる. このため, 4.1.3 節において述べたT3 ポテンシャル関数同 様と原子間距離, 結合角, 配位数に依存するポテンシャル関数であるが, 多元系であ るためにそれに加えて, 結合角をなす3つの原子の原子種, 配位数を数える際におけ る中心原子と近接原子の2つの原子の原子種の組み合わせも局所原子環境として考 慮する必要がある.

Windl ら [59] の計算のように本来バルク中において B は帯電しているが, 中性の 状態のみを取り扱った Alippi ら [60] の計算と, 帯電している状態も考慮した Windl らの計算を比較しても, 一部例外はあるものの, 同一置換ボロン原子数のときに, 格 子間シリコン原子が増加するほどバインディングエネルギが増加する傾向は変わら ず, 帯電によるそれほど劇的な影響はないと考えられる. このため, 電荷の影響を考 慮していない.

5.2.3 B同種原子間パラメータ作成のための合わせ込み物性の選択

B-B 同種原子間ポテンシャルパラメータ作成のためには、ボロン多形構造 (Dimer, Graphitic, Diamond, SC, BCC, BCT, FCC) の平衡状態における格子定数と凝集エネルギ、ダイヤモンドボロンの体積弾性率, SC ボロンの弾性定数 C₁₁, C₁₂ である. Table 5.1 に示したようにこれら合わせ込みに用いたボロン多形構造は幅広い配位数と結合角を含んでおり, Standard Fitting Data に相当する.

| | coordination number | bond angles [degree] |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Dimer | 1 | |
| Chain | 2 | 180 |
| Graphitic | 3 | 120 |
| Diamond | 4 | 109.5 |
| SC | 6 | 90, 180 |
| BCC | 8 | 70.5, 109.5, 180 |
| BCT | 10 | $41.8, 69.1, 82.7, 97.3, 110.9, 138.2, 180.0^a$ |
| FCC | 12 | 60, 90, 120, 180 |

Table 5.1: Coordination number and bond angles of polytypes of boron.

^{*a*}Bond angles of BCT structure are those for equilibrium a/c ratio=0.56 obtained from first-priciples calculation.

5.2.4 Si-B 異種原子間パラメータ作成のための合わせ込み物性の選択

5.2.2 節でも述べたように、Tersoff ポテンシャル関数形を2元系用に拡張した場合 にもオリジナルのTersoff ポテンシャル関数形同様、結合長、配位数、結合角に依存す るが、単元系の場合と異なるのはこれらの局所原子環境がそれを構成する原子種に も依存する点である.結合角の種類が /Si-B-B、/Si-B-Si、/B-Si-Si、/B-B-Si の4種類 存在する.また、配位数についても、ある原子に結合している Si 原子の数とB 原子の 数を合わせたトータルの配位数だけではなく、トータルの配位数のうちの Si 原子の 割合、B 原子の割合も有効な局所原子環境となる.このため、4 種類の結合角と総配 位数と配位数の内訳についてもそれぞれ広範に合わせ込む必要がある.具体的には 等配合構造、架橋型2元系構造、ダイヤモンド型2元系構造、SC型2元系構造、BCC 型2元系構造、A2B2FCCを除くFCC型2元系構造、の平衡状態における格子定数、凝 集エネルギを合わせ込みに用いた.ダイヤモンド系2元系構造以外は内部構造パラ メータを持たず、格子定数は1種のみである.ダイヤモンド系構造のみは安定構造に 近い重要な構造であるため、内部パラメータを1種持つ構造も合わせ込みに用いる. A_2B_2 FCC を除いたのは FCC 構造が Si-B 系にとって重要な構造ではなく,格子定数 が2種類あるために計算負荷が重くなるためである. これらの構造は, Table 5.2 に示 したように原子種の組み合わせごとの結合角,原子種の組み合わせごとの配位数を 幅広い範囲で含み,これらの局所原子環境に関する Standard Fitting Data に相当する. 合わせ込みに用いる弾性的性質は第一原理計算から得るのだが,結晶対称性を除去 すると,ZnS 構造は安定ではなくなり,わずかに Tetragonal な構造が安定となる. こ のため弾性定数の成分は $C_{11}, C_{33}, C_{12}, C_{13}, C_{44}, C_{66}$ となるが,合わせ込みにおいて, Tetragonal ZnS 構造を安定させるのは難しいため,ZnS 構造の弾性定数 C_{11}, C_{12} をそ れぞれは Tetragonal 構造の C_{11} と C_{33} の間の値 (おおよそ 80GPa-130GPa) となるように合わせ込む. また, 構造の不安定 になり,計算が収束しなかったために,弾性定数のせん断成分を計算することはでき なかった.また, b-DIAMOND 構造 (SiB₂) の体積弾性率も合わせ込みに用いる.

| structur | | | coordination | numbers* | | bond angles [degree] | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| suuctui | c | 7 | Za: p/Za: | | 7 | Agupp | A D a La L | Aavavb | Appai |
| h-DIMER | SiB | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | • S1BB | •B5151 | | •BBSi |
| h-CHAIN | SiB | 0/2 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 180 | 180 | | |
| h-GPAPHITIC | SiB | 0/2 | 3/3 | 0/2 | 3/3 | 120 | 120 | | |
| - GRAPHITIC | SiaBa | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 2/2 | 120 | 120 | | |
| b-GRAPHITIC | Si ₂ B ₃ | 0/2 | 2/2 | 0/2 | 3/3 | 180 | 120 | | |
| b-DIAMOND | SiB- | 0/2 | 4/4 | 0/2 | 2/2 | 100.5 | 120 | | |
| b-DIAMOND | Sio B | 0/2 | 2/2 | 0/2 | 1/1 | 180 | 100 5 | | |
| b-DIAMOND | Si2 B | 0/2 | 6/6 | 0/4 | 4/4 | 00.180 | 109.5 | | |
| b-SC | Sib3 | 0/0 | 2/2 | 0/2 | 6/6 | 180 | 00 180 | | |
| b PCC | SI3 D | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 70 5 100 5 180 | 180 | | |
| b BCC | Sib4 | 0/8 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 180 | 70 5 100 5 180 | | |
| b-BCC | Sig B | 0/12 | 12/12 | 8/10 | 2/10 | 60 00 120 180 | 180 | | 60 120 |
| b FCC | Sib6 | 8/10 | 2/10 | 0/10 | 12/10 | 180 | 60 00 120 180 | 60 120 | 00, 120 |
| DIAMOND | 516 B | 2/4 4/4 | 2/10 | 0/12 | 12/12 | (100.5) | (100.5) | (100.5) | |
| DIAMOND | 517 D | 3/4, 4/4 | 2/4 0/4 | 0/4 | 4/4 | (109.5) | (109.5) | (109.3) | |
| DIAMOND | 515 53 | 1/4, 4/4 | 5/4, 0/4 | 0/4 | 4/4 | (109.5) | (109.5) | (109.3) | |
| ZnS | SIB | 0/4 | 4/4 | 0/4 | 4/4 | 109.5 | 109.5 | | (100.5) |
| DIAMOND | S13B5 | 0/4 | 4/4 | 1/4,4/4 | 3/4, 0/4 | (109.5) | (109.5) | | (109.5) |
| DIAMOND | SiB ₇ | 0/4 | 4/4 | 3/4, 4/4 | 1/4, 0/4 | (109.5) | (109.5) | | (109.5) |
| SC | S17B | 4/6, 6/6 | 2/6, 0/6 | 0/6 | 6/6 | 180 | 90, 180 | 90 | |
| SC | S16B2 | 4/6 | 2/6 | 0/6 | 6/6 | 180 | 90, 180 | 90 | |
| NaCl | SiB | 0/6 | 6/6 | 0/6 | 6/6 | 90, 180 | 90, 180 | | |
| SC | Si_2B_6 | 0/6 | 6/6 | 4/6 | 2/6 | 90, 180 | 180 | | 90 |
| SC | SiB ₇ | 0/6 | 6/6 | 4/6, 6/6 | 2/6, 0/6 | 90, 180 | 180 | | 90 |
| BCC | $Si_{14}B_2$ | 6/8, 8/8 | 2/8, 0/8 | 0/8 | 8/8 | 180 | 70.5, 109.5, 180 | 70.5, 109.5 | |
| BCC | $Si_{12}B_4$ | 4/8, 8/8 | 4/8, 0/8 | 0/8 | 8/8 | 109.5 | 70.5, 109.5, 180 | 70.5, 180 | |
| BCC | $Si_{10}B_6$ | 2/8, 8/8 | 6/8, 0/8 | 0/8 | 8/8 | 70.5, 109.5, 180 | 70.5, 109.5, 180 | 70.5, 109.5 | |
| CsCl | SiB | 0/8 | 8/8 | 0/8 | 8/8 | 70.5, 109.5 180 | 70.5, 90, 109.5 180 | | |
| BCC | Si_6B_{10} | 0/8 | 8/8 | 2/8, 8/8 | 6/8, 0/8 | 70.5, 109.5, 180 | 70.5, 109.5, 180 | | 70.5, 109.5 |
| BCC | Si_4B_{12} | 0/8 | 8/8 | 4/8, 8/8 | 4/8, 0/8 | 70.5, 109.5, 180 | 109.5 | | 70.5, 180 |
| BCC | Si_2B_{14} | 0/8 | 8/8 | 6/8, 8/8 | 2/8, 0/8 | 70.5, 109.5, 180 | 180 | | 70.5, 109.5 |
| FCC | Si ₃ B | 8/12 | 4/12 | 0/12 | 12/12 | 90, 180 | 60, 90, 120, 180 | 60, 120 | |
| FCC | SiB ₃ | 0/12 | 12/12 | 8/12 | 4/12 | 60, 90, 120, 180 | 90, 180 | | 60, 120 |
| * Z _{Si} is total co | ordination nu | mber of atomic sp | ecies Si and Z _{Si} | B is number of a | atomic species B | included in Z_{Si} . θ_i | is the angle of the bo | nds between ij : | and <i>ik</i> . |

Table 5.2: Coordinations and bond angles of various crystals.

本章で開発するポテンシャルは Si 中における B の拡散現象と B のクラスタリング 現象の再現を目的としているため, Optional Fitting Data (A) としては Fig. 5.1 に示す Jeong ら [58] によって特定されたバルクシリコン中における 1 個の B 原子の安定構 造, 準安定構造 (以降, SiB 拡散構造) それぞれのエネルギ, また, Fig. 5.2 に示す Windl ら [59] もしくは Alippi ら [60] によって特定されたバルクシリコン中において複数の B 原子がクラスタリングした構造 (以降, SiB クラスタ構造) のエネルギを合わせ込み に用いる.



Fig. 5.1: B diffusion structures (left) and Si-B cluster structures (right) used for fitting. (A) indicates structures identified by Alippi et al. [60]



Fig. 5.2: SiB cluster structures were identified by Windl et al. [59]

5.2.5 合わせ込み物性の収集

Si-B 系における基礎的な物性値は少ないため, VASP[25][26] を用いた第一原理計算によって, 合わせ込みに用いる物性を得た.

合わせ込みに用いる物性は平面波密度汎関数法パッケージ VASP を用いて算出した. イオンコアと荷電子の相互作用はウルトラソフト型擬ポテンシャル[62][63] を用い, 平面波のカットオフを 275eV とし, 交換相関項には Perdew と Wang による一般 化密度勾配近似 GGA[64] を用い, 電子スピンを考慮した. Monkhorst-Pack の特殊点法 [51] による K 点を発生している. 一般的に GGA はスピンを考慮すれば平衡ボン ド長さや凝集エネルギを比較的正確に算出できるものの, それでも実験値を完全に 再現することはできない. このため, シリコンとボロンの凝集エネルギが実験値と合うように、第一原理計算と合うようにシフトさせる必要がある.

単位格子あたりの Si 原子数が N_{Si} で、単位格子あたりの B 原子数が N_B である $Si_{N_{Si}}B_{N_B}$ のエネルギはは以下の式 (5.8)のように算出した.

$$E_{Si_{N_{Si}}B_{N_{B}}}^{fit} = E_{Si_{N_{Si}}B_{N_{B}}}^{DFT} - N_{Si} \times E_{Si}^{DFT} - N_{Si} \times E_{B}^{DFT} + N_{Si} \times E_{Si}^{exp} + N_{B} \times E_{B}^{exp}$$
(5.8)

ここで、 $E_{Si_{N_{Si}}B_{N_{B}}}^{fit}$ は合わせ込みに用いるエネルギ、 $E_{Si_{N_{Si}}B_{N_{B}}}^{DFT}$ は第一原理計算から得 られたエネルギ、 E_{Si}^{DFT} は第一原理計算から得られた Si 原子 1 個あたりのエネルギ、 E_{Si}^{exp} は実験から得られた Si 原子 1 個あたりのエネルギ、 E_{B}^{DFT} は第一原理計算から 得られた B 原子 1 個あたりのエネルギ、 E_{B}^{exp} は実験から得られた B 原子 1 個あたり のエネルギである. Si 原子 1 個あたりのエネルギはダイヤモンド構造の値を用いる. (以降, この式を用いて算出した値を表などにおいては Shifted GGA を呼ぶ.)しかし ながら、ボロンに関しては参照とするべき実験的に得られる単純なバルク B 結晶構 造もしくはバルク Si-B 結晶構造が見つからなかったため GGA の値をそのまま用い る (e.g. $E_{B}^{DFT} = E_{B}^{exp}$). 平衡ボンド長さに関しては、実験値が合うように第一原理計 算による平衡ボンド長さスケーリングした値を用いるが、凝集エネルギと同様に参 照とするべき単純なバルク SiB 結晶構造、 バルク B 結晶構造が見つからなかった ため、すべて一様に Si のダイヤモンド構造の格子定数が合うようにスケーリングを 行った.

5.2.6 ポテンシャルパラメータの最適化

5.2.3 節, 5.2.4 節で挙げた物性を再現できるように遺伝的アルゴリズムを用いてポ テンシャルパラメータ最適化を行い, 多数のポテンシャルパラメータセットを生成 し, この中からもっとも最適化関数の値の優れたポテンシャルパラメータセットを選 んだ.

5.3 結果

5.3.1 得られたポテンシャルパラメータ

Table 5.4, Table 5.5 に遺伝的アルゴリズムを用いて行ったポテンシャルパラメータ 最適化によって得られたポテンシャルパラメータを示す.また,T3 ポテンシャルパラ メータを本章で用いたポテンシャル関数に用いることができるように変換したポテ ンシャルパラメータを用いた.

Table 5.3: Developed potential parameters. Upper and Lower show two-body and threebody parameters, respectively.

| | Si-Si | Si-B | B-Si | B-B |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| A | 1830.80 | 2950.58 | 2950.58 | 668.926 |
| В | 471.180 | 34.7505 | 34.7505 | 70.5639 |
| λ_1 | 2.47990 | 4.12560 | 4.12560 | 3.31111 |
| λ_2 | 1.73220 | 1.03934 | 1.03934 | 1.43284 |
| η | 0.787340 | 1.19517 | 1.62428 | 4.70000 |
| δ | 0.635050 | 0.418351 | 0.436657 | 0.114895 |
| R_1 | 2.70000 | 2.50000 | 2.50000 | 2.30000 |
| R_2 | 3.00000 | 2.80000 | 2.80000 | 2.60000 |
| Re | 2.35100 | 1.93547 | 1.93547 | 1.66400 |

| | Si-Si-Si | Si-Si-B | Si-B-Si | Si-B-B | B-Si-Si | B-Si-B | B-B-Si | B-B-B |
|----------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| α | 5.19750 | 1.52454 | 1.52454 | 1.26696 | 0.591417 | 0.00000 | 0.00000 | 1.05655 |
| β | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| c_1 | 0.00000109990 | 0.0395044 | 0.00972762 | 0.289093 | 0.163401 | 0.183975 | 0.423288 | 0.156837 |
| c_2 | 42.1496 | 0.841482 | 0.207208 | 4.01630 | 4.55827 | 2.79992 | 6.44202 | 0.293175 |
| c_3 | 262.991 | 0.936212 | 0.936212 | 7.89849 | 5.48655 | 4.31922 | 4.31922 | 0.0000252061 |
| h | -0.598260 | -0.428488 | -0.428488 | -0.646383 | -0.700000 | -0.453158 | -0.453158 | 0.370000 |

5.3.2 結晶の再現性

Table 5.6 に開発したポテンシャルを用いて計算した SiB 結晶構造の平衡結合長さ と平衡状態における凝集エネルギを示す. 凝集エネルギは SiB-h-CHAIN, SiB₄b-BCC and SiB₆b-FCC 構造の凝集エネルギを除いて, 合わせ込みに用いた値 (Shifted GGA) から 0.1 eV/atom 以内の値となっている. SiB-h-CHAIN, SiB₄b-BCC and SiB₆b-FCC 構造に関しても合わせ込みに用いた値 (Shifted GGA) から 0.2 eV/atom 以内の値と なっている.

| | Si-Si | Si-B | B-Si | B-B |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| A | 1830.8000 | 2950.5760 | 2950.5760 | 668.9258 |
| B | 471.1800 | 34.7505 | 34.7505 | 70.5639 |
| λ_1 | 2.4799 | 4.1256 | 4.1256 | 3.3111 |
| λ_2 | 1.7322 | 1.0393 | 1.0393 | 1.4328 |
| η | 0.7873 | 1.1952 | 1.6243 | 4.7000 |
| δ | 0.6350 | 0.4184 | 0.4367 | 0.1149 |
| R_1 | 2.7000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.3000 |
| R_2 | 3.0000 | 2.8000 | 2.8000 | 2.6000 |
| Re | 2.3510 | 1.9355 | 1.9355 | 1.6640 |

Table 5.4: Developed potential parameters for two body terms.

Table 5.5: Developed potential parameters for three body terms.

| - | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| | Si-Si-Si | S-Si-B | Si-B-Si | Si-B-B | B-Si-Si | B-Si-B | B-B-Si | B-B-B |
| p | 5.19750 | 1.52454 | 1.52454 | 1.26696 | 1.26696 | 0.00000 | 0.00000 | 1.05655 |
| q | 3.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
| c_1 | 0.00000 | 0.03950 | 0.00973 | 0.28909 | 0.16340 | 0.18397 | 0.42329 | 0.15684 |
| c_2 | 42.14956 | 0.84148 | 0.20721 | 4.01630 | 4.55827 | 2.79992 | 6.44202 | 0.29318 |
| c_3 | 262.99109 | 0.93621 | 0.93621 | 7.89849 | 5.48655 | 4.31922 | 4.31922 | 0.00003 |
| h | -0.59826 | -0.42849 | -0.42849 | -0.64638 | -0.70000 | -0.45316 | -0.45316 | 0.37000 |
| | | | | | | | | |

また、平衡結合長も B-CHAIN, SiB-h-CHAIN, CsCl, SiB₄b-BCC 構造を除いて、合わせ込みに用いた値 (scaled GGA) から 0.05^A 以内の値となっている.

Table 5.7 に開発したポテンシャルを用いて計算した結晶構造の弾性的性質を示す. おおよそ第一原理計算による値を再現している.

5.3.3 SiB 拡散構造の再現性

Table 5.8 に開発したポテンシャルを用いて緩和した拡散構造の凝集エネルギと B_s-Si^T_i構造に対する相対エネルギを示す.すべての SiB 拡散構造の組成は Si₆₄B₁ で あるため、最も基本的な構造 B_s-Si^T_i に対する相対エネルギで評価することが有効と なる. B_s-Si^T_i構造と B^{S'}_{inty}構造に関しては第一原理計算とわずかにエネルギが異な リ, 0.7eV ほど離れた値となっているがが、全般的に凝集エネルギ、B_s-Si^T_i構造に対す る相対エネルギの傾向はほぼ再現できており、第一原理計算とは 0.3eV 以内の差に収 まっている.また、開発したポテンシャルを用いて緩和した後の拡散構造は第一原理 計算によって緩和した拡散構造をほぼ再現できた.

5.3.4 クラスタ構造の再現性

Table 5.9 に開発したポテンシャルを用いて緩和したクラスタ構造の凝集エネルギ とバインディングエネルギを示す. B₄I₃ 構造と B₄I₄ 構造を除いてほぼ凝集エネルギ, バインディングエネルギを再現できている. バインディングエネルギの定義は, Alippi ら [60] 同様,

$$E_b[B_n I_m] = \{ E[B_n I_m] - N_{Si} \mu_{Si} - N_B \mu_B \} - mE_f$$
(5.9)

とした. ここで, $E[B_nI_m]$ はトータルエネルギ, $N_{Si(B)}$ が Si(B) 原子の数, μ_{Si} が Si(B) 原子のケミカルポテンシャル, E_f 自己挿入型欠陥の生成エネルギである. Si 原子の ケミカルポテンシャルはダイヤモンド Si 結晶のエネルギ, B 原子のケミカルポテン シャルはダイヤモンド Si 結晶のうち, 1 個 B 原子に置換した構造の Si のケミカルポ テンシャルを除いたエネルギとしている. バインディングエネルギは B₃I₃, B₄I₃, B₄I₄ 構造を除き, 第一原理計算による値と 1.0eV 以内に収まっている. しかしながら, B₄I₄ 構造のバインディングエネルギだけは第一原理計算によるバインディングエネルギ よりも 4 eV 大きくなった. また, 開発したポテンシャルを用いて緩和した後のクラ スタ構造は第一原理計算によって緩和したクラスタ構造をほぼ再現できた. Table 5.6: Cohesive energies and equilibrium bond lengths used for fitting and those calculated using developed potential.

| | | Cohesive Energy [eV] | | Eq. bond length $\begin{bmatrix} \lambda \end{bmatrix}$ | |
|-------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| | | Conesive Energy [ev] | | (Lattice Constant) | |
| | | New Pot. | Shifted GGA | New Pot. | Shifted GGA |
| DIMER | В | -1 900 | -1 851 | 1 643 | 1 602 |
| CHAIN | B | -3 782 | -4 806 | 1.645 | 1.531 |
| GRAPHITE | B | -5 175 | -5 168 | 1.673 | 1.551 |
| DIAMOND | B | -5 463 | -5 463 | 1.073 | 1.072 |
| SC | B | -5 244 | -5 276 | 1.743 | 1.745 |
| BCC | B | -4.862 | -4.612 | 2.056 | 1 991 |
| BCT | B | -5.478 | -5 563 | 1.649 | 1.551 |
| bei | D | 5.470 | 5.505 | 2 239 | 2 190 |
| FCC | В | -4.974 | -4.978 | 2.103 | 2.018 |
| h-DIMER | SiB | -1.831 | -2.027 | 1.886 | 1.907 |
| h-CHAIN | SiB | -3.324 | -3.670 | 1.909 | 1.800 |
| h-GRAPHITIC | SiB | -4.599 | -4.692 | 1.929 | 1.945 |
| b-GRAPHITIC | Si ₂ B ₂ | -3.802 | -4.019 | 1.921 | 1.879 |
| b-GRAPHITIC | Si ₂ B ₂ | -3.865 | -3.882 | 1.917 | 1.867 |
| b-DIAMOND | SiB ₂ | -3.948 | -3.948 | 1.937 | 1.937 |
| b-DIAMOND | Si ₂ B | -3.895 | -3.725 | 1.941 | 1.925 |
| b-SC | SiB ₃ | -3.864 | -3.846 | 1.971 | 1.989 |
| b-SC | Si ₂ B | -3.936 | -3.949 | 1.988 | 2.051 |
| b-BCC | SiB₄ | -3.969 | -4.635 | 2.004 | 1.952 |
| b-BCC | Si₄B | -4.389 | -4.330 | 1.872 | 2.225 |
| b-FCC | SiB ₆ | -4.485 | -4.804 | 2.147 | 2.069 |
| b-FCC | Si ₆ B | -3.989 | -4.085 | 2.594 | 2.573 |
| DIAMOND | Si ₇ B | -4.772 | -4.741 | (5.227) | (5.227) |
| DIAMOND | Si_5B_3 | -4.993 | -5.020 | (4.787) | (4.832) |
| ZnS | SiB | -5.139 | -5.142 | 1.972 | 2.022 |
| DIAMOND | Si ₃ B ₅ | -5.243 | -5.242 | (4.419) | (4.496) |
| DIAMOND | SiB ₇ | -5.417 | -5.688 | (4.152) | (4.099) |
| SC | Si ₇ B | -4.279 | -4.261 | 2.494 | 2.452 |
| SC | Si ₆ B ₂ | -4.313 | -4.347 | 2.420 | 2.372 |
| NaCl | SiB | -4.746 | -4.922 | 2.091 | 2.146 |
| SC | Si ₂ B ₆ | -4.907 | -4.910 | 2.006 | 2.046 |
| SC | SiB ₇ | -5.023 | -5.025 | 1.964 | 1.969 |
| BCC | $\overline{\text{Si}_{14}\text{B}_2}$ | -4.186 | -4.025 | 2.570 | 2.594 |
| BCC | $Si_{12}B_4$ | -3.989 | -4.040 | 2.545 | 2.533 |
| BCC | Si10B6 | -4.080 | -4.116 | 2.486 | 2.442 |
| CsCl | SiB | -4.340 | -4.261 | 2.377 | 2.533 |
| BCC | Si_6B_{10} | -4.282 | -4.263 | 2.340 | 2.276 |
| BCC | Si_4B_{12} | -4.373 | -4.284 | 2.194 | 2.203 |
| BCC | Si_2B_{14} | -4.464 | -4.406 | 2.097 | 2.100 |
| FCC | Si ₃ B | -3.941 | -3.799 | 2.593 | 2.580 |
| FCC | SiB ₃ | -4.524 | -4.524 | 2.215 | 2.198 |

| property | structure | | New Pot. | GGA |
|-----------------|-----------|---------|----------|---------|
| В | SC | В | 236 | 229 |
| C ₁₁ | SC | В | 407 | 398 |
| C_{12} | SC | В | 150 | 144 |
| В | DIAMOND | В | 172 | 179 |
| C ₁₁ | DIAMOND | В | 172 | |
| C_{12} | DIAMOND | В | 172 | |
| C_{44} | DIAMOND | В | 0 | |
| В | b-DIAMOND | SiB_2 | 38 | |
| C ₁₁ | b-DIAMOND | SiB_2 | 41 | 35 |
| C_{12} | b-DIAMOND | SiB_2 | 36 | 43 |
| C_{44} | b-DIAMOND | SiB_2 | 7 | |
| В | ZnS | SiB | 129 | 127 |
| C ₁₁ | ZnS | SiB | 171 | 160-180 |
| C_{12} | ZnS | SiB | 108 | 80-130 |
| C_{44} | ZnS | SiB | 79 | |

Table 5.7: Elastic properties of Si-B crystals in GPa. B indicates bulk modulus and C_{ij} indicates elastic constant.

Table 5.8: Energies of B diffusion structures

| Cohesive I | Energy [eV] | Relative Energy [eV] | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| New Pot. | GGA | New Pot. | GGA | |
| -299.16 | -299.20 | 0.00 | 0.00 | |
| -298.32 | -299.02 | 0.84 | 0.18 | |
| -298.66 | -298.41 | 0.50 | 0.79 | |
| -298.47 | -298.84 | 0.70 | 0.36 | |
| -299.36 | -299.13 | -0.19 | 0.07 | |
| -298.35* | -298.64 | 0.81 | 0.56 | |
| -298.39 | -298.88 | 0.77 | 0.32 | |
| -298.70 | -298.66 | 0.46 | 0.54 | |
| -299.15 | -299.11 | 0.01 | 0.09 | |
| -297.89* | -298.66 | 1.27 | 0.54 | |
| | Cohesive I New Pot. -299.16 -298.32 -298.66 -298.47 -299.36 -298.35* -298.39 -298.70 -299.15 -297.89* | Cohesive Energy [eV]New Pot.GGA-299.16-299.20-298.32-299.02-298.66-298.41-298.47-298.84-299.36-299.13-298.35*-298.64-298.39-298.88-298.70-298.66-299.15-298.66 | Cohesive Energy [eV] Relative E New Pot. GGA New Pot. -299.16 -299.20 0.00 -298.32 -299.02 0.84 -298.66 -298.41 0.50 -299.36 -299.13 -0.19 -298.35* -298.64 0.81 -298.39 -298.88 0.77 -298.70 -298.66 0.46 -299.15 -299.11 0.01 | |

| | Cohesive Energy [eV] | | Binding Energy [eV] | |
|----------------------------|----------------------|---------|---------------------|--------|
| | New Pot. | GGA | New Pot. | GGA |
| В | -297.25 | -297.26 | 0.00 | 0.00 |
| BI | -299.16 | -299.20 | -0.73 | -0.88 |
| BI_2 | -301.50 | -302.08 | -1.89 | -2.70 |
| BI_3 | -304.26 | -305.55 | -3.47 | -5.11 |
| B_2 | -297.56 | -297.50 | 0.61 | 0.70 |
| B_2I | -302.09 | -302.13 | -2.73 | -2.87 |
| B_2I_2 | -302.45 | -303.75 | -1.92 | -3.43 |
| B_2I_3 | -306.50 | -307.75 | -4.79 | -6.37 |
| B_3 | -297.90 | -297.67 | 1.20 | 1.47 |
| B_3I | -302.53 | -303.95 | -2.24 | -3.75 |
| B_3I_2 | -306.63 | -306.72 | -5.16 | -5.46 |
| $B_3I_2(A)$ | -306.46 | -306.31 | -4.99 | -5.05 |
| B_3I_3 | -308.19 | -309.95 | -5.54 | -7.63 |
| \mathbf{B}_4 | -298.24 | -297.80 | 1.80 | 2.28 |
| B_4I | -303.57 | -304.17 | -2.36 | -3.03 |
| B_4I_2 | -310.41 | -309.46 | -8.02 | -7.26 |
| $B_4I_2(A)$ | -308.24 | -308.74 | -5.85 | -6.54 |
| B_4I_3 | -309.18 | -311.87 | -5.61 | -8.61 |
| $\mathbf{B}_4\mathbf{I}_4$ | -311.52 | -315.28 | -6.77 | -10.95 |
| B_5 | -298.55 | -297.91 | 7.04 | 7.74 |

Table 5.9: Energies of cluster structures.

B diffusion structures were identified by Jeong et al. [58] (A) incdicates structures identified by Alippi et al. [60] Other cluster structures were identified by Windl et al. [59] * indicates an unstable structure.

5.4 開発した原子間ポテンシャルを用いた古典分子動力 学計算

5.4.1 格子間 Si による B の拡散

開発したポテンシャルを用いて、Si 中の B 拡散の計算を行う. 1000 個の Si ダイヤ モンド結晶の 1 個の Si 原子を B 原子に置換した構造 (B 構造) と 1000 個の Si ダイヤ モンド結晶の 1 個の Si 原子を B 原子に置換し, さらにランダム位置に格子間 Si 原子 を 1 個挿入した構造 (BI 構造) をそれぞれ 1400K, 1600K, 1800K, 2000K になるまで 0.1K/fsec で昇温し (T3 ポテンシャルにおけるダイヤモンドシリコンの融点は 2396K), それぞれその温度で 2.16nsec アニールする. 計算条件としては XYZ 方向周期境界条 件, 時間積分法は速度ベルレ法, 単位格子 27.5Å × 27.5Å × 27.5Å, NVT アンサンブ ル,時間ステップは 0.54fs である. 平均 2 乗変位は以下のように長時間の平均を取っ て計算する.

$$< R^{2}(t) > = \frac{1}{N_{s}} \sum_{l=0}^{N_{s}-1} \frac{1}{N} \sum_{\alpha=1}^{N} \left(\boldsymbol{r}^{\alpha} \left(t + t_{0} + l\Delta\tau \right) - \boldsymbol{r}^{\alpha} \left(t_{0} + l\Delta\tau \right) \right)^{2}$$
 (5.10)

ここで, N は系の原子数, N_s は計算ステップ数, t_0 が基準時間, $\Delta \tau$ はタイムステップ である.

Fig. 5.3, Fig. 5.4 に計算時間の後半 1.08nsec の B 構造, BI 構造それぞれの平均自乗 変位を示す. ただし, BI 構造に関しては格子間 Si 原子の初期位置がランダムとして いるので, 5 ケース計算を行い, その平均値と標準偏差を表示している. Fig. 5.3 から わかるのように B 構造においては B 原子はまったく拡散をしなかった. これに対し, Fig. 5.4 のように BI 構造においては B 原子の拡散が起こり, 1800K までは温度が上 がるほど, 平均自乗変位が増加したが, 2000K における平均自乗変位が 1800K の平均 自乗変位よりも減少した.

原子レベルにおいては格子間位置にある B 原子が置換位置にある Si 原子を格子間 位置に蹴り出し,代わりに格子間 B 原子が置換位置に入り込む.その後, B 原子が格 子間位置へと移動し,蹴りだされていた格子間 Si 原子が元の置換位置に戻るという 拡散経路を多数観察することができた.この拡散経路はこれまで第一原理計算で提 案されてきたキックアウトメカニズムによる拡散経路であると考えられる.

2000K における平均自乗変位が 1800K の平均自乗変位よりも減少したのは, 高温 であるために B 原子が置換位置, Si 原子が格子間位置にあるときに, この Si-B 結合 が切れて, Si 原子が単独で格子拡散してしまうことが多かったのが要因である.

5.4.2 Si-B クラスタの形成

1000 個の Si ダイヤモンド結晶の 4 個の Si 原子を B 原子に置換し, さらにランダ ム位置に格子間 Si 原子を 1 個挿入した構造 (B₄I 構造), 格子間 Si 原子を 2 個挿入し



Fig. 5.3: Mean square displacement of substitutional boron atom for B structure as a function of time with no interstitial silicon atoms.



Fig. 5.4: Mean square displacement of substitutional boron atom for BI strucure as a function of time with intersitial silicon atoms.

た構造 (B₄I₂ 構造), 格子間 Si 原子を 3 個挿入した構造 (B₄I₃ 構造) をそれぞれ 5 ケー スずつ 1800K になるまで 0.1K/fsec で昇温し, 1800K 温度で 2.16nsec アニールした. Fig. 5.6,Fig. 5.7,Fig. 5.8, にそれぞれ, B₄I 構造, B₄I₂ 構造, B₄I₃ 構造におけるボロン 原子のトータルの時間 10psec あたりの平均自乗変位を 100psec ごとに示す. 加えて Fig. 5.5, 前節で計算した 1800K でアニールした BI 構造におけるボロン原子のトー タルの時間 10psec あたりの平均自乗変位を 100psec ごとに示す.

BI構造においてはすべてのケースにおいて,最初はほとんどボロン原子の平均自 乗変位が0のケースもあるが,時間が進むにつれ,ほぼ一様に10psecあたり10-20Å 程度の平均自乗変位となっている.最初はシリコン原子とボロン原子がペアを作る まで,シリコン原子が単独で拡散するが,ペアを作った後はキックアウトメカニズム によって拡散することを示している.ただし,case3においては,一度Si-Bペアが切 れることによってボロン原子の平均自乗変位が一度ゼロになるが,再度ペアを作って 拡散が再開されている.

B₄I 構造において, case1, case3, case4 では, ほぼ一様に 10psec あたり 10-20Å 程度 の平均自乗変位となっており, アニメーションを見ると, この時間帯にはクラスタ が生成されておらず, 1 個のボロン原子がそれぞれシリコン原子とペアを作り, 拡散 をしている. この値はほぼ BI 構造の値と同じとなっており, Si-B がペアを作って拡 散していることと矛盾しない. B₄I 構造の case2, case5 においてはクラスタが生成さ れ, ボロン原子が動きにくくなっている.

B₄I₂構造において, case1, case2, case3の一部の時間帯で, 最大 20-35^A 程度の平均 自乗変位となっている. アニメーションを見ると, この時間帯にはクラスタが生成 されておらず, 2個のボロン原子がそれぞれシリコン原子とペアを作り, 拡散をして いる. それ以外ではクラスタが生成され, より低い平均自乗変位の値を示している.

B₄I₃構造において, case2, case5の一部の時間帯で, 最大 35-50Å 程度の平均自乗変 位となっている. アニメーションを見ると, この時間帯にはクラスタが生成されて おらず, 3 個のボロン原子がそれぞれシリコン原子とペアを作り, 拡散をしている. そ れ以外ではクラスタが生成され, より低い平均自乗変位の値を示している.

B₄I 構造, B₄I₂ 構造, B₄I₃ 構造におけるボロンの拡散を比較すると, 平均自乗変位の 最大値は格子間シリコン原子が増加するほど大きくなっている. TED はイオン打ち 込みにおける格子間 Si 原子の濃度上昇による B 原子の拡散係数が劇的な向上である と言われており, この実験結果と一致する計算結果となっている. 反面, 格子間シリコ ン原子が増加するほどクラスタを生成し, 拡散が停止してしまうケースが増加する.



Fig. 5.5: Mean square displacement of substitutional boron atom for BI structure every 100 pico second.



Fig. 5.6: Mean square displacement of substitutional boron atom for B_4I structure every 100 pico second.



Fig. 5.7: Mean square displacement of substitutional boron atom for B_4I_2 structure every 100 pico second.



Fig. 5.8: Mean square displacement of substitutional boron atom for B_4I_3 structure every 100 pico second.

5.5 結言

提案したポテンシャル作成手法を用いて,共有結合2元系であるSi-B系のための 原子間ポテンシャルを作成した.ポテンシャル関数形には拡張型Tersoffポテンシャ ル関数形を採用した.Si単元系ポテンシャルパラメータには既存のT3ポテンシャル パラメータを採用した.B単元系ポテンシャルパラメータを開発するためには安定 構造の格子定数,凝集エネルギ,弾性定数,体積弾性率,多形構造の格子定数,凝集エ ネルギ,体積弾性率をStandard Fitting Data として採用した.Si-B2元系ポテンシャル パラメータを作成するためには,広範な配位数と結合角を含む構造の格子定数,生成 エネルギ,体積弾性率をStandard Fitting Data として採用し,拡散におけるSi中のB 準安定構造の生成エネルギ,代表的なSi中のBクラスタリング構造と生成エネルギ をOptional Fitting Data (A) として採用した.開発した原子間ポテンシャルは合わせ 込みに用いた物性をほぼ再現し,Si中のB拡散現象Si中のBクラスタリング現象の 傾向を再現することができた.これらのことは提案した枠組みが共有結合2元系へ の適用できるということと,提案した枠組みを用いることによって拡散現象,クラス タリング現象の再現できる原子間ポテンシャルを開発できることを示している.

第6章 金属結合2元系への適用

-アモルファス構造金属を再現するZr-Ni系のための原子 間ポテンシャルの開発-

6.1 緒言

6.1.1 工学的な背景

通常の合金の金属液体を凝固させる場合、1×10⁸から1×10¹⁰K/sec 程度以上の冷却 速度でなければ、結晶に凝固してしまうことが知られている[65]. これに対し、Fe基、 Co基, Ni 基などのアモルファス合金の金属液体の場合, 1×10⁵K/sec 程度以上の冷却 速度であれば、アモルファス相を作ることができる. アモルファス合金は通常の金属 材料に比べて、強度や剛性に優れているのだが、通常の金属より遅い冷却速度といっ ても、 1×10^{5} K/sec の冷却速度を得るためには、 μm 程度の厚さの薄帯などの非常に小 さな形状である必要があり、実用分野は非常に限られるものとなっていた、しかしな がら、これらのアモルファス金属に比べてもさらに過冷却液体構造の安定である金属 の組成が発見され、これらの金属は0.1から100K/sec 程度の冷却速度でアモルファ ス相を得ることができる. このため, mm 以上のの大きな形状を作成できるようにな り、実用における可能性が大きく高まった.これら非常に安定な過冷却液体構造を持 つ金属を金属ガラスと呼ぶ.ただし、金属ガラスの生成機構については未だわかって いない点も多く、このため、分子レベルにおいて生成のダイナミクスを扱うことの出 来る古典分子動力学法が解析手法として有効であるとされている.また、新たな金 属ガラス探索において、多くの合金の組み合わせを実験的に試さねばならないが、こ れらの手間を軽減するためにも古典分子動力学法によるスクリーニングが期待され ている. Zr-Ni-Al, Zr-Cu-Al, Zr-Ni-Cu-Al, Zr-Ti-Ni-Cu-Al などのZr 基金属ガラスは 高いガラス形成能をもつ金属ガラスであり、その形成メカニズムを明らかにするた めの出発点として Zr-Ni 系アモルファス金属の分子動力学シミュレーションが重要 であると考えられる、しかしながら、現在までZr-Niアモルファス金属を正確に再現 できる原子間ポテンシャルは開発されておらず、これらZr基金属ガラスの定量的評 価を行うための古典分子動力学計算はまだ難しい状況にある.

6.1.2 ポテンシャル作成における背景と目的

原子半径と混合エネルギの合わせ込みが容易であることから,アモルファス金属の ための分子動力学計算には2体ポテンシャルが多く用いられてきた[66][67].しかし ながら,原子半径と混合エネルギの合わせ込みができないために,その適用範囲は定 量的な計算に限られきた[66][68][67].2体ポテンシャルの1つである Lennard-Jones ポテンシャルを用いた計算においては,アモルファス金属の特徴を表す RDF を定量 的には再現できなかった[69].

EAM ポテンシャルは、金属を想定して定式化がなされており、また、ポテンシャル パラメータが多いために、より多くの物性を再現することができる、このため、EAM ポテンシャルは定量的にアモルファス金属・金属ガラスを表現することができると いわれている[66][67]. EAM ポテンシャルにおいては、これまで多くの2元系ポテン シャルが開発されてきているが、これら大きく2つに分かれており、単元系ポテンシャ ルパラメータを用いて2元系ポテンシャルパラメータを決定する手法を2元系ポテ ンシャルパラメータを個別に決定する手法である. Genelarized EAM (以降, GEAM) [70][71] ポテンシャルや Finnis-Sinclair ポテンシャルなどでは単元系ポテンシャルパ ラメータを用いて、2元系ポテンシャルパラメータを決定し、EAM ポテンシャルの1 種である Mishin ポテンシャルでは、単元系ポテンシャルパラメータによらず、2元系 ポテンシャルパラメータを個別に決定している [9][10].2 元系を定量的に再現する ための原子間ポテンシャルを開発するためには、多くの物性の合わせ込みが可能で ある個別にポテンシャルパラメータを決定する手法が望ましく, Mishin らがいくつ かの2元系でポテンシャルパラメータを開発している. また, GEAM ポテンシャルも 単元系さえ開発すれば、その組み合わせは自由に計算できる EAM ポテンシャルであ るが、GEAM ポテンシャルを用いてもアモルファス構造の RDF の傾向は再現できて も、正確な形状を再現することができなかった [72].

そこで、本章では、本研究で提案したポテンシャル作成手法の枠組みを用いて、ア モルファス構造を再現できるような2元系 EAM ポテンシャル作成手法を開発する. そして、この2元系 EAM ポテンシャル作成手法をZr-Ni 系に適用することによって、 アモルファス構造を再現するようなZr-Ni 系原子間ポテンシャルを作成する.本章で は、この作成された Zr-Ni 系原子間ポテンシャルを評価することによって提案したポ テンシャル作成手法の枠組みの金属単元系、金属2元系への適用性を確かめることを 目的とする.また、同時に提案したポテンシャル作成手法の枠組みを用いて、アモル ファス構造を再現することができるようなポテンシャル作成手法を開発できるかを 確かめることも目的とする.

6.2 Zr-Ni系ポテンシャルの開発

Zr-Ni 系ポテンシャルパラメータは Zr 同種原子間ポテンシャルパラメータ, Ni 同 種原子間ポテンシャルパラメータ, ZrNi 異種原子間ポテンシャルパラメータからな る. 本章ではこの3種のポテンシャルパラメータを開発する.

6.2.1 計算目的の設定

本章では目的のある古典分子動力学計算を用いた解析を行うわけではないので,実際に目的設定をすることができない.このため,計算の目的はあくまで仮定の目的であるとする.本章で開発する Zr-Ni 系ポテンシャルはアモルファス構造が重要となる計算系であると仮定する.このように仮定すれば,本章で開発する Zr-Ni 系ポテンシャルはアモルファス構造を再現する必要があることになる.

6.2.2 ポテンシャル関数形の決定

以下に本章において提案する関数形を示す. このポテンシャル関数形は GEAM ポ テンシャルを元に改良を行った関数形である. 系全体のエネルギ E を次のように 2 体ポテンシャル関数 $\phi(r)$ と埋め込み関数 $F(\rho)$ によって表すことが出来る.

$$E = \frac{1}{2} \sum_{i} \sum_{j(\neq i)} \phi_{a_i a_j} (r_{ij}) + \sum_{i} F_{a_i} (\rho_i).$$
(6.1)

ここで, i, j はそれぞれシミュレーション系における i 番原子, j 番原子, r_{ij} は i 番原 子と j 番原子との間の原子間距離, a_i は i 番原子の原子種を示す.

2体ポテンシャル関数の柔軟性を高めるため、GEAM ポテンシャルと異なり、本研究で提案するポテンシャルでは異種原子間のパラメータは全て個別に決定される. このような概念は Mishin らによる EAM ポテンシャル [9][10] と同様である. 結合をなす原子種とその結合距離に依存する 2体ポテンシャル関数部 $\phi(r)$ は次のように表すことが出来る.

$$\phi_{ab}(r) = f_{\kappa,ab}(r) A_{ab} \exp\left[-\alpha_{ab}\left(\frac{r}{r_{e,ab}} - 1\right)\right]$$

$$-f_{\lambda,ab}(r) B_{ab} \exp\left[-\beta_{ab}\left(\frac{r}{r_{e,ab}} - 1\right)\right]$$

(6.2)

$$f_{\kappa,ab}\left(r\right) = \begin{cases} 1, & r \leq \kappa_{ab}r_{e,ab} \\ \frac{1}{1 + \left(\frac{r}{r_{e,ab}} - \kappa_{ab}\right)^{N_{\kappa,ab}}}, & r > \kappa_{ab}r_{e,ab} \end{cases}$$
(6.3)

$$f_{\lambda,ab}\left(r\right) = \begin{cases} 1, & r \leq \lambda_{ab} r_{e,ab} \\ \frac{1}{1 + \left(\frac{r}{r_{e,ab}} - \kappa_{ab}\right)^{N_{\kappa,ab}}}, & r > \lambda_{ab} r_{e,ab} \end{cases}$$
(6.4)

ここで、 $A_{ab} = A_{ba}$, $B_{ab} = B_{ba}$, $\alpha_{ab} = \alpha_{ba}$, $\beta_{ab} = \beta_{ba}$, $r_{e,ab} = r_{e,ba}$, $N_{\kappa,ab} = N_{\kappa,ba}$, $N_{\lambda,ab} = N_{\lambda,ba}$ は原子種 a, b に依存するポテンシャルパラメータ(以降, これらをまと めて2体パラメータ)である. 式 (6.3) で表される反発項のカットオフと式 (6.4) で表 される結合項のカットオフの減衰区間の幅はそれぞれ $N_{\kappa,ab}$, $N_{\lambda,ab}$ によって調節でき るようにした. また, $r_{e,a}$ については原子種 a の単元系の最安定構造の平衡原子間距 離にするという制約を取り払った.

埋め込み関数 $F(\rho)$ は次のように表すことが出来る. まず, i 番原子の場所における 局所電子密度 ρ_i は近接原子 j からの部分電子密度 $f_{a_i}(r_{ij})$ の寄与の和となる.

$$\rho_{i} = \sum_{j,(\neq i)} f_{e,a_{j}a_{i}} f_{a_{j}}(r_{ij}), \qquad (6.5)$$

$$f_a(r) = f_{\lambda,aa}(r) \exp\left[-\beta_{aa}\left(\frac{r}{r_{e,aa}} - 1\right)\right].$$
(6.6)

ただし,

 $f_{e,aa} = 1, \tag{6.7}$

$$f_{e,ab} = \frac{1}{f_{e,ba}} \tag{6.8}$$

の条件を課す. *f_{e,ab}* は原子種 *a*, *b* に依存する 2 体パラメータであり, 原子種 *a* に対す る原子種 *b* の相対的な電子密度を表す. この局所電子密度は近接原子の数と, 中心原 子と近接原子との結合距離, 近接原子の原子種の内訳に依存している.

埋め込み関数 $F(\rho)$ は3種の関数の接合することによって表される.

$$\rho_{o,a} = T_{o,a}\rho_{e,a},\tag{6.9}$$

$$\rho_{n,a} = T_{n,a}\rho_{e,a},\tag{6.10}$$

$$F_{a}(\rho) = \sum_{i=0}^{3} F_{n_{i},a} \left(\frac{\rho}{\rho_{n,a}} - 1\right)^{i}, \rho < \rho_{n,a}$$
(6.11)

$$F_{a}(\rho) = \sum_{i=0}^{3} F_{i,a} \left(\frac{\rho}{\rho_{e,a}} - 1\right)^{i}, \rho_{n,a} \le \rho < \rho_{o,a}$$
(6.12)

$$F_{a}\left(\rho\right) = F_{e,a}\left[1 - \ln\left\{\left(\frac{\rho}{\rho_{s,a}}\right)^{\eta_{a}}\right\}\right]\left(\frac{\rho}{\rho_{s,a}}\right)^{\eta_{a}} \cdot \rho_{o,a} \le \rho$$

$$(6.13)$$

ここで、 $\rho_{e,a}$, $\rho_{s,a}$, $T_{n,a}$, $T_{a,a}$, $F_{n_i,a}$ $(i = 0 \sim 3)$, $F_{i,a}$ $(i = 0 \sim 3)$ は原子種 *a* に依存するポ テンシャルパラメータ(以降, 単体パラメータ)である. これらのパラメータは3種の 関数(式 (6.11), 式 (6.12), 式 (6.13))の値と1階微分,2階微分が連続させるように決定 する. また、 $F_{n_1,a} = 0$ の制約は取り払った. 埋め込み関数は中心原子の原子種, 局所 電子密度 ρ に依存するため, 局所電子密度の依存する局所原子環境を考慮すると、こ のポテンシャル関数形は結合距離と結合をなす原子種, 配位数とその原子種の内訳に 依存するといえる. 単元系に関しては以下のパラメータを採用した場合、

| $ ho_{e,a} = rac{ ho_{e,a}^{GEAM}}{f_{e,a}^{GEAM}},$ | (6.14) |
|----------------------------------------------------------|--------|
| $\rho_{s,a} = \frac{\rho_{s,a}^{GEAM}}{f_{e,a}^{GEAM}},$ | (6.15) |
| $A_{aa} = A_a^{GEAM},$ | (6.16) |
| $B_{aa} = B_a^{GEAM},$ | (6.17) |
| $\alpha_{aa} = \alpha_a^{GEAM},$ | (6.18) |
| $\beta_{aa} = \beta_a^{GEAM},$ | (6.19) |
| $r_{e,aa} = r_{e,a}^{GEAM},$ | (6.20) |
| $\kappa_{aa} = \kappa_a^{GEAM},$ | (6.21) |
| $\lambda_{aa} = \lambda_a^{GEAM},$ | (6.22) |
| $N_{\kappa,ab} = 20$ | (6.23) |
| $N_{\lambda,ab} = 20$ | (6.24) |
| $f_{e,ab} = \frac{f_{e,a}^{GEAM}}{f_{e,b}^{GEAM}}$ | (6.25) |
| $T_{o,a} = 1.15,$ | (6.26) |
| $T_{n,a} = 0.85,$ | (6.27) |

本章で用いるポテンシャル関数形は Zhou らによって提案されている GEAM ポテン シャル [70][71] と等価となる. ここで, 右肩に *GEAM* がついているパラメータはオ リジナルのポテンシャルパラメータである.

6.2.3 Ni 同種原子間パラメータ作成のための合わせ込み物性の選択

6.2.2 節でも述べたように本章で用いるポテンシャル関数形は配位数と結合距離に 依存するため、Standard Fitting としてはこれらを広範に含む系のエネルギを合わせ 込みに用いる必要がある.具体的には DIAMOND 型 Ni, SC 型 Ni, BCC 型 Ni, FCC 型 Ni, HCP 型 Ni の凝集エネルギ,格子定数、FCC 構造 Ni の弾性定数、SC 型 Ni, BCC 型 Ni, FCC 型 Ni の体積弾性率を採用した.また、BCC 型 Ni 構造と FCC 型 Ni 構造に関 しては、平衡原子体積の70%-130%の体積依存のエネルギ曲線も合わせ込みに用いる.

これら合わせ込みに用いる多形構造は幅広い配位数を含む.また,体積弾性率,弾 性定数,体積依存のエネルギ曲線も合わせ込みに用いるため,結合長の変化に対して も十分に広い範囲を合わせ込みことと等価になる.

また, FCC型 Ni 構造の欠陥生成エネルギを Optional Fitting Data (A) として用いる.

6.2.4 Zr 同種原子間パラメータ作成のための合わせ込み物性の選択

6.2.2 節でも述べたように本章で用いるポテンシャル関数形は配位数と結合距離に 依存するため、Standard Fitting としてはこれらを広範に含む系のエネルギを合わせ 込みに用いる必要がある.具体的には DIAMOND 型 Zr, SC 型 Zr, BCC 型 Zr, FCC 型 Zr, HCP 型 Zr の凝集エネルギ,格子定数,HCP 構造 Zr の弾性定数,SC 型 Zr, BCC 型 Zr, FCC 型 Zr, HCP 型 Zr の体積弾性率また,BCC 型 Zr, FCC 型 Zr, HCP 型 Zr に関し ては、平衡原子体積の70%-130%の体積依存のエネルギ曲線も合わせ込みに用いた.

これら合わせ込みに用いる多形構造は幅広い配位数を含む.また,体積弾性率,弾 性定数,体積依存のエネルギ曲線も合わせ込みに用いるため,結合長の変化に対して も十分に広い範囲を合わせ込むことと等価になる.

また, HCP型Zrの欠陥生成エネルギをOptional Fitting Data (A) として用いる.

6.2.5 ZrNi 異種原子間ポテンシャルパラメータ作成のための合わせ 込み物性の選択

本章で用いる原子間ポテンシャルは EAM ポテンシャルであり,2 元系ポテンシャルは2種の原子種間における2体ポテンシャルと2種の原子の電子密度比を決定す る必要がある.

本章で用いるポテンシャル関数形は配位数と結合長に依存するため、Standard Fitting としてはこれらを広範に含む系のエネルギを合わせ込みに用いる必要がある.また、 配位数の場合、2種の元素があるため、配位数の値だけでなく、近接原子の原子種の内 訳も重要となる.このため、SC型2元系構造、BCC型Zr₁₄Ni₂を除くBCC型2元系 構造(後に述べるが物性算出のための第一原理計算が収束しなかったため)、FCC型2 元系構造、Cu₂Mg型2元系構造、構造それぞれの平衡状態における格子定数と単元系 からの生成エネルギ、FCC型Zr₃Ni、FCC型ZrNi₃、Cu₂Mg型Zr₂Ni、Cu₂Mg型ZrNi₂ の体積弾性率を合わせ込みに用いた.生成エネルギはSC系構造、BCC系構造、FCC 系構造の基底構造をそれぞれSC型NiとSC型Zr、BCC型NiとBCC型Zr、FCC型 NiとFCC型Zrとした.それ以外の構造は単元系の最安定構造であるFCC型Niと HCP型Zrを基底構造とした。

Table 6.1 に示すようにこれら合わせ込みに用いる結晶構造は幅広い第1近接原子 を含み、その内訳の原子種も幅広い.ただし、Table 6.1 で示した配位数は第1近接原 子のもののみであるが、本章で用いるポテンシャルのカットオフは長く、第2近接原 子以降も大きな影響を及ぼす.このため、はっきりと配位数の局所原子環境を幅広く 含んでいるとはいえない.結合距離の局所原子環境については、体積弾性率、弾性定 数、エネルギ曲線を合わせ込んでおり、また、体積弾性率、弾性定数、体積依存のエネ ルギ曲線も合わせ込みに用いるため、結合長の変化に対しても十分に広い範囲を合 わせ込むことと等価になる.

| Structure | | Coordination Number* | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Z_{ZrZr}/Z_{Zr} | Z_{ZrNi}/Z_{Zr} | $\mathbf{Z}_{NiNi}/\mathbf{Z}_{Ni}$ | $\mathbf{Z}_{NiZr}/\mathbf{Z}_{Ni}$ |
| SC | Zr ₇ Ni | 4/6, 6/6 | 2/6, 0/6 | 0/6 | 6/6 |
| SC | Zr_6Ni_2 | 4/6 | 2/6 | 0/6 | 6/6 |
| NaCl | ZrNi | 0/6 | 6/6 | 0/6 | 6/6 |
| SC | Zr_2Ni_6 | 0/6 | 6/6 | 4/6 | 2/6 |
| SC | ZrNi7 | 0/6 | 6/6 | 4/6, 6/6 | 2/6, 0/6 |
| BCC | $Zr_{12}Ni_4$ | 4/8, 8/8 | 4/8, 0/8 | 0/8 | 8/8 |
| BCC | $Zr_{10}Ni_6$ | 2/8, 8/8 | 6/8, 0/8 | 0/8 | 8/8 |
| CsCl | ZrNi | 0/8 | 8/8 | 0/8 | 8/8 |
| BCC | Zr ₆ Ni ₁₀ | 0/8 | 8/8 | 2/8, 8/8 | 6/8, 0/8 |
| BCC | Zr_4Ni_{12} | 0/8 | 8/8 | 4/8, 8/8 | 4/8, 0/8 |
| BCC | Zr_2Ni_{14} | 0/8 | 8/8 | 6/8, 8/8 | 2/8, 0/8 |
| FCC | Zr ₃ Ni | 8/12 | 4/12 | 0/12 | 12/12 |
| FCC | Zr_2Ni_2 | 4/12 | 8/12 | 4/12 | 8/12 |
| FCC | ZrNi ₃ | 0/12 | 12/12 | 8/12 | 4/12 |
| Cu ₂ Mg | Zr ₂ Ni | 6/12 | 6/12 | 4/16 | 12/16 |
| Cu_2Mg | $ZrNi_2$ | 4/16 | 12/16 | 6/12 | 6/12 |

Table 6.1: Coordination numbers of various Zr-Ni binary crystals.

 Z_{Zr} is total coordination number of atomic species Zr and Z_{ZrNi} is number of atomic species Ni included in Z_{Zr} .

また Optional Fitting Data (A) として, FCC-*A*₃*B*₁ 構造, FCC-*A*₂*B*₂ 構造, FCC-*A*₁*B*₃ 構造, それぞれの Octahedral 型 Zr 挿入型欠陥, Octahedral 型 Ni 挿入型欠陥, Zr 原子に 対する (100)Split 型 Zr 挿入型欠陥 (以降, Zr-Zr-Split), Ni 原子に対する (100)Split 型 Zr 挿入型欠陥 (以降, Zr-Ni-Split), Zr 原子に対する (100)Split 型 Ni 挿入型欠陥 (以降, Ni-Zr-Split), Ni 原子に対する (100)Split 型 Ni 挿入型欠陥 (以降, Ni-Ni-Split), 空孔欠 陥構造の欠陥生成エネルギを合わせ込みに用いた.

Optional Fitting Data (B) として, アモルファス Zr₇₀Ni₃₀ の RDF を合わせ込みに用 いた. また, ZrNi 合金の安定構造である Al₂Cu 型 Zr₂Ni 構造, Fe₂P 型 Zr₂Ni 構造, CrB 型 ZrNi 構造とこの原子種を入れかえた Al₂Cu 型 ZrNi₂ 構造, Fe₂P 型 ZrNi₂ 構造, の 格子定数, エネルギ, 体積弾性率を Optional Fitting Data (B) とした. Optional Fitting Data (A) としなかったのは, これらの構造は格子定数や内部構造パラメータの数が多 く, 計算時間が長くなってしまうためである.

6.2.6 合わせ込み物性の収集

実験値の存在する Ni-FCC の凝集エネルギ,格子定数,体積弾性率,弾性定数,空 孔生成エネルギ,Zr-HCP の凝集エネルギ,格子定数,体積弾性率,弾性定数,空孔生 成エネルギ,Zr₇₀Ni₃₀ のアモルファス構造の RDF, Cu2Mg 型 ZrNi₂ 構造の格子定数, Ti2Ni 構造の格子定数,CrB 構造の格子定数以外は平面波密度汎関数法パッケージ VASP[25][26]を用いた第一原理計算によって求め,それ以外の HCP 構造の物性は実 験から得た.

第一原理計算の計算条件はイオンコアと価電子の相互作用は PAW 法 [49][50] に よって記述し、平面波のカットオフを 400eV、交換相関項にはスピンを考慮した Perdew、 Burke, Ernzerhof による GGA[73] を用いた. k 点は Monkhorst-Pack の特殊点法 [51] を用いて、発生を行った. Methfessel-Paxton 法 [74] によって、波動関数の Smearing を 行い、Smearing の幅を一様に 0.2eV とした.

平面波密度汎関数法を用いた第一原理計算においては、正しく凝集エネルギの絶対 値を算出することができない. このため、凝集エネルギについてはは、基底構造のエ ネルギに関しては実験値を用い、その他の構造のエネルギに関しては、基底構造から の生成エネルギを合わせ込みに用いる.本章における基底構造は Ni-FCC と Zr-HCP となる.

平面波密度汎関数法を用いた第一原理計算においては、正しく格子定数を算出す ることができない. このため、Ni単元系についてはNi-FCCの格子定数が合うように スケーリングし、Zr単元系についてはZr-HCPの原子体積が合うようにスケーリング し、Zr-Ni2元系についてはZrNi₂-Cu₂Mg構造の格子定数が合うようにスケーリング している.

また、本章で行った第一原理計算においては、Zr単元系に関してはTable 6.3 に示すように弾性的性質をほぼ再現するが、Ni単元系に関してはTable 6.4 にに示すように

実験値からおおよそ10%程度乖離する. このため, Ni 単元系における体積弾性率に関 しては Ni-FCC の体積弾性率が実験値と合うように式(3.1)を用いて, スケーリング を行う. このため, 実験値から1%程度の範囲に収まる, Zr 単元系に関しても Zr-HCP の体積弾性率が実験値と合うように式(3.1)を用いて, スケーリングを行う. 加えて Zr-Ni 2 元系に関しても基準となる Ni の体積弾性率がスケーリングされるため, 式 (3.1)を用いて, 第一原理計算を用いて得られた Zr-Ni2 元系の体積弾性率を変換して 合わせ込みに用いている. さらに, エネルギ曲線に関してもスケーリングした体積 弾性率を式(3.5)に用いて, スケーリングした体積弾性率と矛盾のないように変換を 行う.

Zr₇₀Ni₃₀のRDFはMatsubaraらによる実験によるRDF[75]を用いる. このRDFは Spring-8のBL04B2ビームラインにおけるX線回折装置で測定したデータである.

6.2.7 ポテンシャルパラメータの最適化

遺伝的アルゴリズムを用いてポテンシャルパラメータの最適化を行った.Zr単元系 ポテンシャルパラメータとNi 単元系ポテンシャルパラメータの算出のためにはそれ ぞれの Standard Fitting Data と Optinal Fitting Data (A) を用いて合わせ込みを行った. Zr-Ni-2 元系ポテンシャルパラメータは Standard Fitting Data と Optinal Fitting Data (A)を合わせ込んだ複数のポテンシャルパラメータセットの中から Optional Fitting Data (B)の再現性の高いポテンシャルパラメータセットを選んだ. Zr₇₀Ni₃₀のアモル ファスはメルトクエンチ (MQ) 法によって得る. Zr₇₀Ni₃₀ 組成にした Zr 原子 350 個, Ni 原子 150 個からなる FCC 構造を, NVT アンサンブルで, 5000K まで昇温し, 5000K で 0.216nsec 保ち, NPT アンサンブルで, これを 4×10¹²K/sec で冷却した後, 500K に おいて、2.16nsec アニールした、500K でアニールしたのは、おおよそどのようなポテ ンシャルパラメータセットでも 300K, 400K, 500K, 600K, 700K の各温度でアニール すると 500K で最もエネルギが低くなったためである.1回の計算ではアモルファス の RDF は再現できず、複数のポテンシャルを作成した結果、fe.ZrNi がアモルファス の RDF について影響を及ぼすことが確認されたため、様々な $f_{e,ZrNi}$ の値を持つポテ ンシャルパラメータセットを作成し、この中からアモルファスの RDF を再現するこ とのできるポテンシャルパラメータセットを得た.

6.3 結果

6.3.1 ポテンシャルパラメータ

合わせ込みの結果, Zr 単元系ポテンシャルパラメータ, Ni 単元系ポテンシャルパラ メータ, Zr-Ni2 元系ポテンシャルパラメータを得た. 得られたポテンシャルパラメー タをを Table 6.2 に示す.

| parameters | Zr-Zr | Ni-Ni | Zr-Ni |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| f_e | 1.00000 | 1.00000 | 0.21500 |
| r_e | 3.79237 | 2.32685 | 2.55111 |
| $ ho_e$ | 29.14275 | 11.18498 | |
| $ ho_s$ | 27.00354 | 12.30348 | |
| α | 6.74927 | 9.55109 | 5.25817 |
| β | 3.58856 | 3.65055 | 2.94328 |
| A | 0.21965 | 0.41953 | 0.72302 |
| В | 0.37834 | 0.51023 | 0.82486 |
| κ | 0.14252 | 0.74640 | 0.49908 |
| λ | 0.71208 | 0.95262 | 1.34103 |
| n_{κ} | 39.36483 | 20.00000 | 28.47463 |
| n_{λ} | 17.43996 | 20.00000 | 31.59732 |
| F_{n0} | -4.48115 | -2.88854 | |
| F_{n1} | -0.23628 | -0.03351 | |
| F_{n2} | 1.60210 | 0.19877 | |
| F_{n3} | -2.64277 | -2.65627 | |
| F_0 | -4.48697 | -2.88988 | |
| F_1 | -0.14233 | 0.00000 | |
| F_2 | 1.64714 | 0.26867 | |
| F_3 | -0.62197 | 0.17390 | |
| η | 0.71160 | 0.70541 | |
| F_e | -4.56219 | -2.88266 | |
| $\frac{\rho_n}{\rho_e}$ | 0.96976 | 0.92771 | |
| $\frac{\rho_o}{\rho_e}$ | 1.57419 | 1.32697 | |

Table 6.2: Developed Potential Parameters for Zr-Ni Systems.
Zr-Zr, Ni-Ni, Zr-Ni の 2 体ポテンシャル関数部 $\Phi_{ZrZr}(r)$, $\Phi_{NiNi}(r)$, $\Phi_{ZrNi}(r)$ Fig. 6.1 に示す.



Fig. 6.1: Φ_{ZrZr} , Φ_{ZrNi} and Φ_{NiNi} as a function of bond length.

Zr の部分電子密度 $f_{Zr}(r)$, Ni の部分電子密度 $f_{Ni}(r)$ をそれぞれ, Fig. 6.2 Fig. 6.3 に示す.

Zr の埋め込み電子関数 $F_{Zr}(\rho)$, Ni の埋め込み電子関数 $F_{Ni}(\rho)$ の形状をそれぞれ Fig.6.4, Fig.6.5 に示す. ともに接続点 $T_n = \frac{\rho_n}{\rho_e}$, $T_o = \frac{\rho_o}{\rho_e}$ において滑らかに接続してい る様子がわかる.

Zr の埋め込み電子関数の電子密度による1階微分 $\frac{dF_{Zr}(\rho)}{d\rho}$, Ni の埋め込み電子関数の電子密度による1階微分 $\frac{dF_{Ni}(\rho)}{d\rho}$ の形状をそれぞれ Fig.6.6, Fig.6.7 に示す. ともに接続点 $T_n = \frac{\rho_n}{\rho_e}$, $T_o = \frac{\rho_o}{\rho_e}$ において滑らかに接続している様子がわかる

Zrの埋め込み電子関数の電子密度による2階微分 $\frac{d^2 F_{Zr}(\rho)}{d\rho^2}$, Niの埋め込み電子関数の電子密度による2階微分 $\frac{d^2 F_{Ni}(\rho)}{d\rho^2}$ の形状をそれぞれ Fig.6.8, Fig.6.9 に示す. ともに接続点 $T_n = \frac{\rho_n}{\rho_e}$, $T_o = \frac{\rho_o}{\rho_e}$ において接続しているが, 滑らかではなく, 3 階微分は連続していないことがわかる.

6.3.2 合わせ込みに用いた結晶の物性値と欠陥の物性値の再現性

Table 6.3 に開発した原子間ポテンシャルを用いて算出した HCP 型 Zr の物性値を 示す.凝集エネルギ,格子定数, c/a 比,体積弾性率,弾性定数,空孔生成エネルギがほ ぼ合わせ込みに用いた物性値と一致している.比較のために Ackland ら [76]の Zr 系 ポテンシャルの結果も示す.弾性定数の再現性でわずかに劣っているものの,今回開



Fig. 6.2: f_{Zr} as a function of interatomic distance.



Fig. 6.3: f_{Ni} as a function of interatomic distance.



Fig. 6.4: F_{Zr} as a function of electron density.



Fig. 6.5: F_{Ni} as a function of electron density.



Fig. 6.6: $\frac{dF_{Zr}}{d\rho}$ as a function of electron density.



Fig. 6.7: $\frac{dF_{Ni}}{d\rho}$ as a function of electron density.







Fig. 6.9: $\frac{d^2 F_{Ni}}{d\rho^2}$ as a function of electron density.

発したZr系ポテンシャルはAcklandらの原子間ポテンシャルほぼ同等の再現性を示している.

| Table 0.5. Material Properties for TiCr ZI. | | | |
|---------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------|
| Crystal | EAM | Exp. ^a (GGA) | Ackland et al. ^b |
| Lattice Constant A[Å] | 3.237 | 3.2312 | 3.249 |
| Lattice Constant C[Å] | 5.149 | 5.1477 | 5.172 |
| Cohesive Energy [eV/atom] | -6.250 | -6.25 | -6.25 |
| Bulk Modulus [GPa] | 96.7 | 96.6 (97.4) | 105 |
| C ₁₁ [GPa] | 127.0 | 144 | 150 |
| C ₁₂ [GPa] | 68.2 | 74 | 85 |
| C ₁₃ [GPa] | 88.4 | 67 | 76 |
| C ₃₃ [GPa] | 175.1 | 166 | 175 |
| C ₅₅ [GPa] | 29.6 | 33.4 | 33.2 |
| Vacancy Formation Energy [eV] | 1.74 | 1.70 | 1.786 |

Table 6.3: Material Properties for HCP Zr.

^aReferences [77] and references therein

^aReferences [76]

Table 6.4 に開発した原子間ポテンシャルを用いて算出した FCC 型 Ni の物性値を 示す. 凝集エネルギ,格子定数,体積弾性率,弾性定数,空孔生成エネルギがほぼ合わ せ込みに用いた物性値と一致している. 比較のために Mishin らの Ni 系ポテンシャル の結果も示すが,同等の再現性を示している.

開発した原子間ポテンシャルを用いて算出したZr多形構造の凝集エネルギと平衡 結合長をそれぞれTable 6.5, Table 6.6 に示す. BCC型Zr, FCC型Zrの凝集エネルギ に関してはほぼ第一原理計算による値と一致している. DIAMOND型Zr, SC型Zrの 凝集エネルギに関してはやや第一原理計算と異なる値となったが, これらの構造は エネルギが高く, ほぼ出現しない構造であるため, あまり重要な物性値ではなく, 最 安定構造であるHCP型Zrよりエネルギがかなり大きいということさえ再現できて いれば問題はないと考えられる. BCC型Zr, FCC型Zrの平衡結合長に関してはほぼ スケーリングした第一原理計算による値と一致している. DIAMOND型Zr, SC型Zr の平衡結合長に関してはややスケーリングした第一原理計算と異なる値となったが, これらの構造はエネルギが高く, ほぼ出現しない構造であるため, あまり重要な物性 値ではなく, 大きな問題はないと考えられる.

開発した原子間ポテンシャルを用いて算出した HCP 型 Zr, FCC 型 Zr, BCC 型 Zr, SC 型 Zr の原子体積依存のエネルギ曲線をそれぞれ Fig. 6.12, Fig. 6.13, Fig. 6.11, Fig. 6.10 示す. また, HCP 型 Zr, FCC 型 Zr, BCC 型 Zr, SC 型 Zr の体積弾性率を Table 6.7 に示す. HCP 型 Zr, FCC 型 Zr, BCC 型 Zr の原子体積依存のエネルギ曲線と体積

第6章 金属結合2元系への適用

| Table 6.4: Material Properties for FCC Ni. | | | |
|--------------------------------------------|--------|---------------|--------------------|
| crystal | EAM | Exp. (GGA) | Mishin et al. d |
| Lattice Constant [Å] | 3.520 | 3.52^{a} | 3.52 |
| Cohesive Energy [eV/atom] | -4.440 | -4.44^{a} | -4.45 |
| Bulk Modulus [GPa] | 179.4 | 180.4 (200.4) | 181 |
| C ₁₁ [GPa] | 243.6 | 246.5^{b} | 247 |
| C ₁₂ [GPa] | 147.2 | 147.3^{b} | 148 |
| C ₄₄ [GPa] | 128.0 | 124.7^{b} | 125 |
| Vacancy Formation Energy [eV] | 1.70 | 1.6^{c} | 1.60 |
| ^a References[78] | | | |
| ^b References[79] | | | |

^cReferences[80]

^dReferences[7]

| Table 6.5: | Relative | Energies | for 7 | Zr Polytypes | in | eV/atom |
|------------|----------|-----------|-------|---------------|-----|-----------|
| Table 0.5. | Relative | Lifeigies | 101 2 | Li i orytypes | 111 | c v/atom. |

| crystal | EAM | GGA |
|---------|-------|-------|
| DIAMOND | 1.019 | 2.310 |
| SC | 0.462 | 0.841 |
| BCC | 0.061 | 0.078 |
| HCP | 0 | 0 |
| FCC | 0.034 | 0.040 |

| Table 6.6: | Lattice | Constants | for Zr | Polytypes. |
|------------|---------|-----------|--------|--------------------|
| 14010 0.01 | Lauree | Combranco | | 1 01 / 0 / 0 0 0 0 |

| | | | J J J I |
|---------|------|-------|-------------------|
| Crystal | Axis | EAM | Scaled GGA (Exp.) |
| DIAMOND | А | 6.245 | 6.114 |
| SC | А | 3.066 | 2.893 |
| BCC | А | 3.586 | 3.565 |
| HCP | А | 3.237 | 3.228 (3.232) |
| | С | 5.149 | 5.160 (5.149) |
| FCC | А | 4.542 | 4.519 |
| | | | |

弾性率は、ほぼ第一原理計算によるエネルギ曲線と体積弾性率に一致した. SC型Zr の体積弾性率やエネルギ曲線は第一原理計算によるものと大きく異なったが、SC型 Zr は重要ではない構造であるため問題にはならないと考えられる.



Fig. 6.10: Energy curve as a function of atomic volume for SC-Zr.

| | Bulk Modulus [GPa] | | |
|-----|--------------------|------------|--|
| | New Pot. | Scaled GGA | |
| SC | 86.3 | 65.3 | |
| BCC | 92.4 | 90.1 | |
| FCC | 87.4 | 93.7 | |
| HCP | 179.4 | 180.4 | |

| Table 6.7: Bulk | moduli for SC | C-Zr, BCC-Zr, | FCC-Zr and | HCP-Zr |
|-----------------|---------------|---------------|------------|--------|
| | | | | |

開発した原子間ポテンシャルを用いて算出した Ni 多形構造の凝集エネルギと平衡 結合長をそれぞれ Table 6.8, Table 6.9 に示す. BCC 型 Ni, FCC 型 Ni の凝集エネルギ に関してはほぼ第一原理計算による値と一致している. DIAMOND 型 Ni, SC 型 Ni の凝集エネルギに関してはやや第一原理計算と異なる値となったが, これらの構造は エネルギが高く, ほぼ出現しない構造であるため, あまり重要な物性値ではなく, 最 安定構造である HCP 型 Ni よりエネルギがかなり大きいということさえ再現できて いれば問題はないと考えられる. BCC 型 Ni, FCC 型 Ni の平衡結合長に関してはほぼ スケーリングした第一原理計算による値と一致している. DIAMOND 型 Ni, SC 型 Ni の平衡結合長に関してはややスケーリングした第一原理計算と異なる値となったが,



Fig. 6.11: Energy curve as a function of atomic volume for BCC-Zr.



Fig. 6.12: Energy curve as a function of atomic volume for HCP-Zr.



Fig. 6.13: Energy curve as a function of atomic volume for FCC-Zr.

これらの構造はエネルギが高く,ほぼ出現しない構造であるため,あまり重要な物性 値ではなく,大きな問題はないと考えられる.

| | Relative Energy [eV/atom] | | |
|---------|---------------------------|-------|--|
| crystal | EAM | GGA | |
| DIAMOND | 1.253 | 2.818 | |
| SC | 0.498 | 0.692 | |
| BCC | 0.089 | 0.095 | |
| HCP | 0.019 | 0.023 | |
| FCC | 0 | 0 | |

開発した原子間ポテンシャルを用いて算出した FCC 型 Ni, BCC 型 Ni, SC 型 Ni の 原子体積依存のエネルギ曲線をそれぞれ Fig. 6.16, Fig. 6.15, Fig. 6.14 示す. また, FCC 型 Ni, BCC 型 Ni, SC 型 Ni の体積弾性率を Table 6.10 に示す. HCP 型 Ni, FCC 型 Ni の原子体積依存のエネルギ曲線と体積弾性率は, ほぼ第一原理計算によるエネ ルギ曲線と体積弾性率に一致した. BCC 型 Ni の原子体積依存のエネルギ曲線の全体 的な形状は第一原理計算によるエネルギ曲線にほぼ一致したものの, 体積弾性率, エ ネルギ曲線の平衡点付近における細かな形状は第一原理計算によるものと大きく異 なってしまったが, これ以上の合わせ込みを行うことは出来なかった. Ni-SC 構造の 体積弾性率やエネルギ曲線は第一原理計算によるものと大きく異なったが, SC 構造 は重要ではない構造であるため問題にはならないと考えられる.

| Table 6.9: Lattice Constants for Ni Polytypes. | | | |
|------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------|
| | Lattice constants[Å] | | |
| Crystal | Axis | EAM | scaled GGA (Exp.) |
| DIAMOND | А | 5.171 | 5.100 |
| SC | А | 2.366 | 2.329 |
| BCC | А | 2.805 | 2.802 |
| HCP | А | 2.484 | 2.488 |
| | С | 4.107 | 4.082 |
| FCC | А | 3.520 | 3.520 (3.52) |



Fig. 6.14: Energy curve as a function of atomic volume for SC-Ni.

| | Bulk modulus | | |
|-----|--------------|------------|--|
| | New Pot. | Scaled GGA | |
| SC | 124.1 | 124.0 | |
| BCC | 80.5 | 172.1 | |
| FCC | 179.4 | 180.4 | |

Table 6.10: <u>Bulk moduli for SC-Ni, BCC-Ni and FCC-Ni.</u>



Fig. 6.15: Energy curve as a function of atomic volume for BCC-Ni.



Fig. 6.16: Energy curve as a function of atomic volume for FCC-Ni.

開発した原子間ポテンシャルを用いて算出した合わせ込みに用いた Zr-Ni 系結晶 の格子定数, 生成エネルギをそれぞれ Table 6.12, Table 6.3.2, 示す. SC 型 2 元系構造, BCC 型 2 元系系構造, FCC 型 2 元系構造の格子定数に関しては NaCl 型 ZrNi, FCC 型 Zr₃,Ni FCC 型 ZrNi₃ を除き, おおよそスケールした第一原理計算の値 (Scaled GGA) から 1%以内となっており, 良く一致している. NaCl 構造に関しては Scaled GGA か ら 4%程度, FCC 型 Zr₃Ni, FCC 型 ZrNi₃ に関しては 2%程度のずれである.

| | | Reaction energy [eV/atom] | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------|--------|--|
| Crystal | Stoichiometry | EAM | GGA | |
| SC | Zr ₇ Ni | -0.033 | -0.104 | |
| SC | Zr_6Ni_2 | 0.233 | -0.323 | |
| NaCl | Zr_4Ni_4 | -0.658 | -0.881 | |
| SC | Zr_2Ni_6 | -0.492 | -0.606 | |
| SC | ZrNi ₇ | -0.301 | -0.246 | |
| BCC | $Zr_{12}Ni_4$ | -0.189 | -0.052 | |
| BCC | $Zr_{10}Ni_6$ | -0.284 | -0.236 | |
| BCC | Zr_8Ni_8 | -0.465 | -0.446 | |
| CsCl | Zr_6Ni_{10} | -0.410 | -0.343 | |
| BCC | Zr_4Ni_{12} | -0.371 | -0.381 | |
| BCC | Zr_2Ni_{14} | -0.243 | -0.163 | |
| FCC | Zr ₃ Ni | -0.104 | -0.021 | |
| FCC | Zr_2Ni_2 | -0.407 | -0.379 | |
| FCC | ZrNi ₃ | -0.358 | -0.440 | |
| Cu ₂ Mg | Zr ₂ Ni | 0.385 | 0.596 | |
| Cu_2Mg | $ZrNi_2$ | -0.419 | -0.415 | |
| Al_2Cu | Zr_2Ni | -0.299 | -0.327 | |
| Al_2Cu | $ZrNi_2$ | -0.212 | -0.191 | |
| Fe_2P | Zr ₂ Ni | -0.207 | -0.213 | |
| Fe_2P | $ZrNi_2$ | -0.277 | -0.152 | |
| Ti ₂ Ni | Zr_2Ni_1 | -0.282 | -0.239 | |
| CrB | ZrNi | -0.352 | -0.462 | |

Table 6.11: Reaction Energies of Zr-Ni binary crystals used for fitting.

Table 6.14 に合わせ込みに用いた欠陥構造の生成エネルギを示す. FCC 型 ZrNi₃ への Zr-Octahedral 挿入型欠陥, Ni-Octahedral 挿入型欠陥, FCC 型 ZrNi₃ 構造への Zr-Zr-Split 挿入型欠陥, Ni-Zr-Split 挿入型欠陥を除いて, 新たに開発した原子間ポテンシャルを用いて算出した欠陥生成エネルギは多くの構造で第一原理計算による欠陥生成

| | | | Lattice constant [Å] | | | |
|----------|--------------------|------|----------------------|------------|--|--|
| Crystal | stoichiometry | Axis | EAM | Scaled GGA | | |
| SC | Zr ₇ Ni | А | 5.620 | 5.606 | | |
| SC | Zr_6Ni_2 | А | 5.431 | 5.414 | | |
| NaCl | Zr_4Ni_4 | А | 5.021 | 5.188 | | |
| SC | Zr_2Ni_6 | А | 4.788 | 4.833 | | |
| SC | ZrNi ₇ | А | 4.733 | 4.734 | | |
| BCC | $Zr_{12}Ni_4$ | А | 6.729 | 6.672 | | |
| BCC | $Zr_{10}Ni_6$ | А | 6.513 | 6.527 | | |
| BCC | Zr_8Ni_8 | А | 3.157 | 3.179 | | |
| CsCl | Zr_6Ni_{10} | А | 6.142 | 6.163 | | |
| BCC | Zr_4Ni_{12} | А | 5.992 | 5.940 | | |
| BCC | Zr_2Ni_{14} | А | 5.735 | 5.741 | | |
| FCC | Zr ₃ Ni | А | 4.334 | 4.239 | | |
| FCC | Zr_2Ni_2 | А | 4.465 | 4.492 | | |
| | | С | 3.157 | 3.187 | | |
| FCC | ZrNi ₃ | А | 3.642 | 3.721 | | |
| Cu_2Mg | Zr_2Ni | А | 7.701 | 7.693 | | |
| Cu_2Mg | $ZrNi_2$ | А | 6.950 | 6.916 | | |
| Al_2Cu | Zr_2Ni | А | 6.280 | 6.447 | | |
| | | С | 5.242 | 5.179 | | |
| Al_2Cu | $ZrNi_2$ | А | 4.814 | 4.978 | | |
| | | С | 7.624 | 7.270 | | |
| Fe_2P | Zr_2Ni | А | 6.605 | 6.827 | | |
| | | С | 4.338 | 4.156 | | |
| Fe_2P | $ZrNi_2$ | А | 7.393 | 7.356 | | |
| | | С | 2.681 | 2.719 | | |
| CrB | ZrNi | А | 3.009 | 3.267 | | |
| | | В | 9.510 | 9.903 | | |
| | | С | 4.329 | 4.107 | | |

Table 6.12: Lattice constants of Zr-Ni binary crystals used for fitting.

| crystal | stoichiometry | EAM | Scaled GGA |
|----------|--------------------|-------|------------|
| FCC | Zr ₃ Ni | 95.9 | 100.0 |
| FCC | ZrNi ₃ | 154.4 | 154.5 |
| Cu_2Mg | Zr_2Ni | 79.1 | 75.4 |
| Cu_2Mg | $ZrNi_2$ | 143.8 | 147.2 |

Table 6.13: Bulk moduli of Zr-Ni binary crystals used for fitting.

エネルギから 0.5 eV/defect 以内, それ以外の構造でも構造で第一原理計算による欠陥生成エネルギから 1.0 eV/defect 以内, となっている. 1.0 eV/defect 以内に収まらなかった欠陥構造の欠陥生成エネルギは総じて高い値であり, 新たに開発した原子間ポテンシャルを用いて算出した欠陥生成エネルギも第一原理計算による値と外れているものの, 欠陥生成エネルギが大きいという傾向そのものは再現している.

Table 6.14: Defect formation energies of Zr-Ni defected structures used for fitting. In this table, Octa , Split and Mono vac indicate Octahedral-type interstitial, split(100)-type interstitial and Mono vacancy, respectively

| | | | | Defect formation energy [eV/defec | |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Original Crystals | Stoichiometry | defect type | defected atom | EAM | GGA |
| FCC-type Zr ₃ Ni | Zr ₂₅ Ni ₈ | Octa | Zr | 4.575 | 6.114 |
| FCC-type Zr ₃ Ni | $Zr_{24}Ni_9$ | Octa | Ni | 1.043 | 2.772 |
| FCC-type Zr ₂ Ni ₂ | $Zr_{17}Ni_{16}$ | Octa | Zr | 2.670 | 3.321 |
| FCC-type Zr ₂ Ni ₂ | $Zr_{16}Ni_{17}$ | Octa | Ni | 1.130 | 2.250 |
| FCC-type ZrNi ₃ | Zr_9Ni_{24} | Octa | Zr | 0.167 | 0.219 |
| FCC-type ZrNi ₃ | Zr_8Ni_{25} | Octa | Ni | 0.946 | 0.339 |
| FCC-type Zr ₃ Ni | $Zr_{25}Ni_8$ | Split | Zr-Zr | 4.346 | 5.143 |
| FCC-type Zr ₃ Ni | $Zr_{25}Ni_8$ | Split | Zr-Ni | -2.192 | -1.761 |
| FCC-type Zr ₃ Ni | $Zr_{24}Ni_9$ | Split | Ni-Zr | 1.263 | 2.113 |
| FCC-type Zr ₃ Ni | $Zr_{24}Ni_9$ | Split | Ni-Ni | -4.366 | -3.995 |
| FCC-type Zr ₂ Ni ₂ | $Zr_{17}Ni_{16}$ | Split | Zr-Zr | 2.710 | 2.513 |
| FCC-type Zr ₂ Ni ₂ | $Zr_{17}Ni_{16}$ | Split | Zr-Ni | 2.639 | 3.178 |
| FCC-type Zr ₂ Ni ₂ | $Zr_{16}Ni_{17}$ | Split | Ni-Zr | 1.263 | 0.978 |
| FCC-type Zr ₂ Ni ₂ | $Zr_{16}Ni_{17}$ | Split | Ni-Ni | 1.174 | 1.328 |
| FCC-type ZrNi ₃ | Zr_9Ni_{24} | Split | Zr-Zr | 3.206 | 7.072 |
| FCC-type ZrNi ₃ | Zr_9Ni_{24} | Split | Zr-Ni | 0.161 | 0.232 |
| FCC-type ZrNi ₃ | Zr_8Ni_{25} | Split | Ni-Zr | 2.875 | 4.408 |
| FCC-type ZrNi ₃ | Zr_8Ni_{25} | Split | Ni-Ni | 0.940 | 0.524 |
| FCC-type Zr ₃ Ni | $Zr_{24}Ni_7$ | Mono Vac | Ni | 1.760 | 2.213 |
| FCC-type ZrNi ₃ | Zr ₇ Ni ₂₃ | Mono Vac | Zr | 3.100 | 2.932 |

6.3.3 Zr₇₀Ni₃₀アモルファスの特性

原子間ポテンシャル作成時においては節で述べたような手法でアモルファスを作成したが、本節ではより丁寧なチェックのためにより大きな空間スケール、時間スケールでアモルファス $Zr_{70}Ni_{30}$ を作成する. Zr 原子 700 個, Ni 原子 300 個を含む FCC 型構造を 5000K まで昇温し、5000K で 0.2nsec 保ち、これを 4×10^{12} K/sec で冷却して得られた as-quenched アモルファス構造を 8 ケース作成した. それぞれ 500K で 21.6nsec アニールを行って、緩和されたアモルファス構造を得た. 得られたアモルファスの密度は 7.14-7.17g/cm³ となり、実験値 (7.03g/cm³) より 1-2%程度大きくなった.

Fig. 6.17, に 500K でアニールした後の構造の 300K における RDF の 8 ケースの平 均を示す. これらの RDF に関しては, 全般的には実験による RDF とほぼ一致した. し かしながら, 実験による RDF にはなかった小さなショルダーが 4.5^A 付近にできる, 第 2 ピークの位置が実験値に比べて 0.1^A 程度短い, 高さがわずかに高い第 3 ピーク の位置が実験値に比べてやや長く, 高さがわずかに高いなどの特徴が現れた.



Fig. 6.17: Averaged radial distribution runctions for 8 case of $Zr_{70}Ni_{30}$ amorphous structures annealed at 500K. Experimeltal as-quenched data are shown for comparison.

6.4 考察

開発した原子間ポテンシャルの適用範囲を調べるために,開発した原子間ポテンシャルを用いた古典分子動力学計算によって合わせ込みに用いた Zr₇₀Ni₃₀以外の組成である Zr_{36.3}Ni_{63.7} アモルファス構造を作成し,実験による物性の再現性を確かめる.実

験による物性はX線回折によって得られたZr_{36.3}Ni_{63.7}アモルファス構造のZr-Zr, Ni-Zr, Ni-Niの部分動径分布関数 (Partial Radial Distribution Function: PRDF)[81]. (Xu et al.[82] が指摘しているように参考文献 [81] は"Anomalous wide angle x-ray scattering of amorphous Ni₂Zr alloy"となっているが実際に用いられている試料は Zr_{36.3}Ni_{63.7}.) これら実験から得られた PRDF から計算した RDF を計算との比較のために用いる. また, GEAM ポテンシャルを用いて計算した RDF も比較のために示す. 開発した原 子間ポテンシャルを用いて計算した RDF は、やや鋭い第1ピークを除いて GEAM ポ テンシャルを用いて計算された RDF 同様ほぼ実験による RDF と一致した.



Fig. 6.18: Radial distribution functions of $Zr_{36.3}Ni_{63.7}$ amorphous structure. That of experimental data[81] and that obtained using GEAM potential are shown for comparison.

6.5 結言

提案したポテンシャル作成手法を用いて、Zr-Ni 2 元系のための原子間ポテンシャ ルを作成した.ポテンシャル関数形には EAM ポテンシャル関数形を採用した. Zr 単 元系ポテンシャルパラメータ, Ni 単元系ポテンシャルパラメータを開発するために は安定構造の格子定数, 凝集エネルギ, 弾性定数, 体積弾性率, 原子体積依存のエネル ギ曲線, 多形構造の格子定数, 凝集エネルギ, 体積弾性率, を Standard Fitting Data と して採用し, 安定構造の空孔生成エネルギを Optional Fitting Data (A) として採用し た. Zr-Ni2 元系ポテンシャルパラメータを作成するためには, 広範な配位数を含む構 造の格子定数, 生成エネルギ, 体積弾性率を Standard Fitting Data として採用し, Zr-Ni 2 元系欠陥構造の欠陥生成エネルギ, 一部の Zr-Ni 2 元系に特有の結晶構造の物性を Optional Fitting Data (A) Zr₇₀Ni₃₀ アモルファス構造の RDF, 一部の Zr-Ni 2 元系に特 有の結晶構造の物性を Optional Fitting Data (B) として採用した. 開発した Zr-Ni 原子 間ポテンシャルは合わせ込みに用いた物性をほぼ再現することができた. これらの ことから, 提案した手法は金属結合単元系, 金属結合 2 元系に対して適用できること, 提案した手法を用いてアモルファス構造を再現できるような原子間ポテンシャルを 作成できることが確かめられた.

第7章 結言と将来の展望

7.1 結言

本研究において、以下のような結論を得た.

- これまで、原子間ポテンシャルの不足が古典分子動力学普及の障害となっていたため、解析者が自分の目的に合わせて、簡易に原子間ポテンシャルを作成するための枠組みを提案した。
- 2. 提案した原子間ポテンシャル作成のための枠組みは計算目的の設定,ポテンシャル関数の決定,合わせ込みデータの選択/収集,ポテンシャルパラメータ最適化, ポテンシャルパラメータセットの評価/選択の工程からなる.また,なるべく実用に耐えるような原子間ポテンシャルを作成できるように各工程における経験的な指針も示した.
- 3. 提案した原子間ポテンシャル作成の枠組みを共有結合単元系 (Si,B), 共有結合 2元系 (Si-B), 金属結合単元系 (Zr,Ni), 金属結合 2元系 (Zr-Ni) に適用できるこ とを確かめた.
- 提案した原子間ポテンシャル作成の枠組みを用いることによって,融点の再現, 拡散現象,クラスタリング現象の再現,アモルファス構造の再現できるような 原子間ポテンシャルを作成することができた.

7.2 将来の展望

本節では将来の展望について述べる.

7.2.1 枠組み適用範囲の拡大

本研究では、提案した枠組みの適用が共有結合単元系,共有結合2元系、金属結合 単元系、金属結合2元系に留まっている。これを将来的には、イオン結合系、イオン結 合/共有結合混合系、金属結合/共有結合混合系、イオン結合/金属結合混合系、3元系以 上の多元系などに提案した枠組みの適用範囲の拡げて行きたいと考えている。その ためには、3元系のための合わせ込み物性の選定や、電荷移動型ポテンシャルの合わ せ込み手法の開発が必要となってくる. 固体系に限らず、気体系や液体への適用につ いても考えたい. このように、提案した枠組みが広い範囲に適用できることを確認す る. もし、試した系に対して、提案した枠組みが上手く適用できなかった場合は、適用 が可能となるように適宜修正を加えて行きたい.

7.2.2 枠組みに基づく汎用ソフトウェアの開発

7.2.1 節で述べたように, ある程度広い範囲に適用できる原子間ポテンシャル作成 の枠組みが出来上がったら, この枠組みを基にして, 次は実際に汎用化された原子間 ポテンシャル作成ソフトウェアの開発を行う. 基本的には, 提案した工程に対応した ような設定画面が進んで行く形式となる. 各工程に対応するステップのデフォルト 値(もしくは推奨値)が提案した各工程の指針に対応するというシステムを考えてい る. このような汎用ソフトウェアを開発することによって, 手軽に原子間ポテンシャ ルを作成することが可能になる.

具体的には、スタートのウィンドウから順番に、「次へ」ボタンを押して、次のス テップのウィンドウへと進むウィザード形式を想定している.まず、1ステップ目は、 「使用する元素の選択」ウィンドウにおいて、ユーザは使用する元素を1種もしくは 複数種選択する.

2 ステップ目では、「ポテンシャル関数形の選択」ウィンドウにおいて、提示され る既存のポテンシャル関数リストから使用したいポテンシャル関数形を選ぶ. この とき、デフォルトでは、本研究で提案している「ポテンシャル関数の選択」工程にお ける指針に基づいて、元素の結合形態に適した既存のポテンシャル関数形が選ばれる ようになっている. 例えば、共有結合なら、Tersoff ポテンシャル関数形や Brenner ポ テンシャル関数形等が推奨される. また、任意の関数形の入力も可能となるようにし たいと考えている.

3 ステップ目では「合わせ込み物性の選択」ウィンドウにおいて,提示される候 補から合わせ込み物性を選択する.ここで,デフォルトでは,本研究で提案している 「合わせ込み物性の選択」工程における指針に基づいて,ポテンシャル関数形に応じ た Standard Fitting Data が選ばれる.この Standard Fitting Data にユーザが Optional Fitting Data を追加する.ここで,それぞれの物性値に関して,ユーザは第一原理計算 値もしくは実験値を用いるかの選択を行う.ここで,第一原理計算値を用いる物性を 算出するために,VASP などの第一原理計算ソフトウェアの初期設定ファイルを生成 できるようにすることも考えている.その場合,一時,原子間ポテンシャル作成プロ グラムを中断し,作成された初期設定ファイルを用いて,第一原理計算を行い,その 結果得られた物性をプログラムに再度入力する.

4ステップ目では「合わせ込み物性の収集」ウィンドウにおいて,選択した合わせ 込み物性の物性値の入力を行う.前のステップで実験値を用いることを選択した場合 は、集めてきた実験値を入力し、第一原理計算値を用いることを選択した場合は、第 一原理計算値を入力する.

5ステップ目では「ポテンシャルパラメータ最適化」ウィンドウにおいて、ポテンシャルパラメータの最適化を行う.ここでは各物性に関する合わせ込みのウェイトをスライドバーなどの形式で調節できるようにする.

6ステップ目では「ポテンシャルパラメータセットの評価」ウィンドウにおいて, 得られた複数のポテンシャルパラメータセットがリストの形式で表示される.ここ では,合わせ込みに用いた物性や適応度が表の形で提示され,ユーザは特定の物性値 の再現性や適応度によって,ポテンシャルパラメータセットを並べ替えたりできる. この機能を用いることによって,ユーザが実際に分子動力学計算に用いるポテンシャ ルパラメータセットを選ぶ作業を手助けすることができる.

7.2.3 ポテンシャルパラメータ情報の蓄積

本論文で開発した原子間ポテンシャルは、共有結合単元系、共有結合2元系、金属 結合単元系,金属結合2元系について1例ずつのみである.もし,今後,同様の系で原 子間ポテンシャル作成を行うのであれば、これらの例に倣って原子間ポテンシャル作 成していくことになる.しかしながら、同じ結合形態であったとしても、元素が異な れば、ポテンシャル作成過程はやや異なることが予想される.また、計算目的ごとに もポテンシャル作成過程は異なると考えられる.このため、本研究において提案した 枠組みを用いるユーザに、将来的には汎用ソフトウェアのユーザに、なるべく多くの 原子間ポテンシャル開発例を提供していく必要がある.しかしながら,原子間ポテン シャル開発例の収集作業を個人で行っても、収集される例の数には限界がある、よっ て、本研究において提案した枠組みを用いるユーザ、あるいは、汎用ソフトウェアの ユーザに、開発した原子間ポテンシャルの情報を提供してもらい、これを蓄積して行 く必要があると考えられる.最終的に用いられた原子間ポテンシャルのみでなく,開 発しても最終的に採用しなかった原子間ポテンシャルについても情報を提供しても らうことで、より原子間ポテンシャル開発例を充実させることができる.また、開発 した人間が採用しなかった原子間ポテンシャルを他の解析者が用いるという用途も 考えられる、さらに、上手く物性を再現できなかった原子間ポテンシャルを提供して もらうことにより、失敗例を蓄積することができる.例えば、特定の元素に関して使 えないポテンシャル関数の情報を明らかにできるだろう.

7.2.4 枠組みの使われ方に関する展望

背景でも述べたように、これまで原子間ポテンシャルというのは、開発するのに大きな手間がかかっていた.本論文で提案した手法はこの手間を軽減するものである.

このため、提案した手法を用いることにより作成した異なった特性を持つ原子間ポテ ンシャルを用いた古典分子動力学計算を行い、系の応答を確かめるという解析手法が 可能となる.このような解析手法によって、何が古典分子動力学計算の結果に影響し ているかということを調べられるようになると予測される.例えば、異なる欠陥生成 エネルギを持つ原子間ポテンシャルを用いた融解シミュレーションにより、欠陥生成 エネルギが固体の融解温度にどの程度、影響するか調べることが可能となる.これは、 古典分子動力学を用いた新たな解析手法となり、今後、古典分子動力学が普及するこ とへの一助となるだろう.

付録A AIN系への適用

A.1 ポテンシャル作成手法のAIN系への適用

本章では提案した手法の AIN 系への適用について述べる. AIN 系ポテンシャルパ ラメータは AI 同種原子間ポテンシャルパラメータ, N 同種原子間ポテンシャルパラ メータ, AI-N 異種原子間ポテンシャルパラメータからなる.

A.2 ポテンシャル関数の決定

式 (A.1)-(A.7) に示す共有結合系をよく表すボンドオーダポテンシャルの1つである Tersoff ポテンシャル関数形 [3][4] を2元系に拡張したポテンシャル関数形を用いる.

$$\Phi = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \phi_{ij} \tag{A.1}$$

$$\phi_{ij} = E_{a_i a_j}^{rep} (r_{ij}) + b_{ij} E_{ab}^{cov} (r_{ij})$$
(A.2)

$$E_{ab}^{rep}(r) = f_{c,ab}(r) A_{ab} \exp\left(-\lambda_{1,ab}r\right)$$
(A.3)

$$E_{ab}^{cov}(r) = f_{c,ab}(r) B_{ab} \exp\left(-\lambda_{2,ab}r\right)$$
(A.4)

$$b_{ij} = \left(1 + \zeta_{ij}^{\eta_{a_i a_j}}\right)^{-\delta_{a_i a_j}} \tag{A.5}$$

$$\zeta_{ij} = \sum_{k \neq i,j} f_{c,a_i a_k} \left(r_{ik} \right)$$

$$\left(c_{2,a_i a_j a_k} \left(h_{a_i a_j a_k} - \cos \theta_{ijk} \right)^2 \right)$$

$$\times \left\{ c_{1,a_{i}a_{j}a_{k}} + \frac{c_{i}c_{j}c_{k}}{c_{3,a_{i}a_{j}a_{k}} + \left(h_{a_{i}a_{j}a_{k}} - \cos\theta_{ijk}\right)^{2}} \right\}$$
$$\times \exp \left[\alpha_{a_{i}a_{j}a_{k}} \left\{ \left(r_{ij} - R^{e}_{a_{i}a_{j}} \right) - \left(r_{ik} - R^{e}_{a_{i}a_{k}} \right) \right\}^{\beta_{a_{i}a_{j}a_{k}}} \right]$$
(A.6)

$$f_{c,ab}(r) = \begin{cases} 1 & r \leq R_{1,ab} \\ \frac{1}{2} - \frac{9}{16} \sin\left[\frac{\pi\left(r - \frac{1}{2}R_{1,ab} - \frac{1}{2}R_{2,ab}\right)}{R_{2,ab} - R_{1,ab}}\right] \\ -\frac{1}{16} \sin\left[\frac{3\pi\left(r - \frac{1}{2}R_{1,ab} - \frac{1}{2}R_{2,ab}\right)}{R_{2,ab} - R_{1,ab}}\right] \\ R_{1,ab} < r < R_{2,ab} \\ 0 & r \geq R_{2,ab} \end{cases}$$
(A.7)

式 (A.1)-(A.7) において, *i*, *j*, *k* は原子のインデックス, *a_i* は原子インデックス *i* の 原子種, *a*, *b* は原子種, *r_{ij}* は原子 *i*, *j* 間の距離, θ_{ijk} は原子 *i*, *j* 間のボンドと原子 *i*, *k* 間のボンドのなす角度を表す. また, *A_{ab}*, *B_{ab}*, $\lambda_{1,ab}$, $\lambda_{2,ab}$, η_{ab} , δ_{ab} , α_{ab} , β_{ab} , R_{ab}^{e} は原子 種 *a*, *b* に依存するパラメータ, *c*_{1,abc}, *c*_{2,abc}, *c*_{3,abc}, *h_{abc}* は原子 *a*, *b*, *c* の原子種に依存す るパラメータである.

ほぼ Tersoff ポテンシャルと同じ関数形であるがカットオフ関数に関しては, 2 階 微分まで連続であるカットオフ関数形に変更した.式 (A.6) に示す ζ_{ij} の関数形はオ リジナルの Tersoff ポテンシャルと等価な関数形である [83].

A.3 合わせ込み物性の選択/収集

特定の用途を想定せず、Standard Fitting Dataのみを用いて合わせ込みを行う. もし、 例えば、SiC 基板上の AIN 結晶成長などを扱う場合などにおいては、AIN と SiC の反 応経路などが Optional Fitting Data として合わせ込まれることになる.

本研究で用いる原子間ポテンシャル関数形は主として、ボンド長さ、結合角、配位 数といった原子環境に依存するため、ポテンシャルにロバスト性を与え、想定外の状 態に陥らないようにするためにはこれらの原子環境について幅広く含んでいる系の 物性を合わせ込む必要がある.

AI 同種原子間ポテンシャルパラメータ, N 同種原子間ポテンシャルパラメータ作成のためには Tersoff[3][4] と同様, それぞれ単元系の多形構造の格子定数, 凝集エネルギと安定構造の弾性定数, 体積弾性率 (AI の場合は FCC の弾性定数, N の場合はダイマの振動数とダイヤモンド構造の体積弾性率) を合わせ込みに用いる. これらの物性はポテンシャルの依存する原子環境を幅広く含んでいる.

多種の原子種が存在する系においては、原子環境は単なる配位数や結合角だけで なく、配位数については結合原子の原子種の内訳、結合角については結合角をなす3 原子の原子種も原子環境として考慮に入れねばならない.よって、AIN 異種原子間ポ テンシャルパラメータ作成のために、多種の原子種が存在する系の多種の配位数と広 範な結合角を含むような Table A.3 に示す結晶 [83]の凝集エネルギと格子定数を合 わせ込む.これらの結晶は内部変位がなく、1種の格子定数のみで構造を表現できる ため、パラメータ合わせ込み時や第一原理計算における構造最適化を容易に行うこ とができる.

合わせ込みに用いる物性は安定構造の物性など実験から得られる物性は実験値を 用いた.それ以外の物性はCASTEP[84]を用いた平面波密度汎関数法による第一原 理計算によって算出した.

A.4 ポテンシャル合わせ込み結果

遺伝的アルゴリズムを用いて、AI 同種原子間ポテンシャルパラメータ、N 同種原 子間ポテンシャルパラメータ、AIN 異種原子間ポテンシャルパラメータを作成した. Table A.1, Table A.2 にそれぞれ示すように開発したポテンシャルは AI 単元系、N 単 元系それぞれの多形構造の格子定数,凝集エネルギを十分精度よく再現することが できた. Table A.3 に示すように AIN 異種原子間ポテンシャルパラメータ作成に用い た AIN2 元系の多形構造の格子定数,凝集エネルギを十分精度よく再現することがで きた. また,合わせ込みに用いた弾性的性質もよく再現することができた.

A.5 結言

提案した原子間ポテンシャル作成の枠組みを用いて、AIN 系原子間ポテンシャルを 開発した. 関数形には拡張 Tersoff ポテンシャル関数形を用いた. AI 同種原子間ポテ ンシャルパラメータ、N 同種原子間ポテンシャルパラメータ作成のためには、それぞ れ単元系の多形構造の格子定数、凝集エネルギと安定構造の弾性定数、体積弾性率を Standard Fitting Data として合わせ込みに用いた. AIN 異種原子間ポテンシャルパラ メータの合わせ込みには多種の配位数と広範な結合角を含む結晶の凝集エネルギと 格子定数を Standard Fitting Data として合わせ込みに用いた. 遺伝的アルゴリズムを 用いて開発した原子間ポテンシャルは合わせ込みに用いた物性をよく再現した.

| | $E_0[eV/atom]$ | | $d_0[A]$ | |
|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|
| Structure | Al Pot. | GGA(exp.) | Al Pot. | GGA(exp.) |
| DIMER | -0.792 | (-0.775) | 2.526 | (2.560) |
| CHAIN | -1.507 | -1.540 | 2.543 | 2.423 |
| GRAPHITIC | -2.162 | -2.224 | 2.557 | 2.593 |
| DIAMOND | -2.660 | -2.650 | 2.584 | 2.626 |
| SC | -3.067 | -3.000 | 2.670 | 2.731 |
| BCC | -3.234 | -3.310 | 2.746 | 2.802 |
| FCC | -3.390 | -3.390 | 2.864 | 2.864 |

Table A.1: Cohesive energies and equilibrium bond lengths of polytypes for Al. $F_0[eV/atom] = \frac{d_0[\mathring{A}]}{d_0[\mathring{A}]}$

Table A.2: Cohesive energies and equilibrium bond lengths of polytypes for N.

| | E ₀ [eV/atom] | | $d_0[\mathring{A}]$ | |
|-----------|--------------------------|-----------|---------------------|-----------|
| Structure | N Pot. | GGA(Exp.) | N Pot. | GGA(Exp.) |
| DIMER | -4.887 | -4.950 | 1.422 | 1.100 |
| CHAIN | -2.732 | -2.600 | 1.628 | 1.301 |
| GRAPHITIC | -1.945 | -2.252 | 1.749 | 1.510 |
| DIAMOND | -1.793 | -1.794 | 1.808 | 1.808 |
| SC | -1.694 | -1.740 | 1.883 | 1.855 |
| BCC | -0.739 | -0.632 | 2.146 | 2.109 |
| FCC | -0.393 | -0.398 | 2.232 | 2.198 |

Table A.3: Cohesive energies and equilibrium bond lengths of binary crystals for Al-N.

| | | $E_0[eV/atom]$ | | $d_0[A]$ | |
|-------------|-------------------|----------------|--------|----------|-------|
| Structure | | AlN Pot. | GGA | AlN Pot. | GGA |
| h-DIMER | AlN | -1.994 | -1.540 | 1.797 | 1.692 |
| h-CHAIN | AlN | -3.630 | -4.033 | 1.826 | 1.672 |
| h-GRAPHITIC | AlN | -5.202 | -5.344 | 1.840 | 1.791 |
| ZnS | AlN | -5.812 | -5.812 | 1.894 | 1.894 |
| b-GRAPHITIC | Al_2N_3 | -3.943 | -3.823 | 1.857 | 1.757 |
| b-DIAMOND | AlN_2 | -3.488 | -3.478 | 1.927 | 1.806 |
| b-SC | AlN_3 | -2.869 | -2.805 | 2.023 | 1.869 |
| b-BCC | AlN_4 | -2.596 | -2.697 | 2.157 | 1.955 |
| b-FCC | AlN ₆ | -1.893 | -1.929 | 2.487 | 2.181 |
| SC | Al ₇ N | -2.982 | -3.012 | 2.540 | 2.598 |
| SC | Al_6N_2 | -3.107 | -2.993 | 2.383 | 2.494 |
| NaCl | AlN | -5.286 | -5.632 | 2.163 | 2.025 |
| SC | Al_2N_6 | -3.570 | -3.652 | 2.047 | 1.987 |
| SC | Al_1N_7 | -2.533 | -2.608 | 2.045 | 1.943 |
| BCC | Al ₇ N | -2.911 | -3.145 | 2.646 | 2.711 |
| BCC | Al_6N_2 | -2.927 | -2.895 | 2.540 | 2.662 |
| BCC | Al_5N_3 | -3.510 | -3.240 | 2.488 | 2.466 |
| BCC | Al_3N_5 | -3.230 | -3.209 | 2.276 | 2.156 |
| BCC | Al_2N_6 | -2.703 | -2.255 | 2.212 | 2.147 |
| BCC | AlN_7 | -1.274 | -1.558 | 2.261 | 2.099 |

付録B Standard Fitting Data におい て用いられる構造

本章ではStandard Fitting Data において用いた2元系構造について示す.

B.1 架橋型2元系構造

Fig. B.1, Fig. B.2, Fig. B.3, Fig. B.4, Fig. B.5 にそれぞれ架橋型グラファイト構造 (b-GRAPHITIC), 架橋型ダイヤモンド構造 (b-DIAMOND), 架橋型正方格子型構造 (b-SC), 架橋型体心立方格子構造 (b-BCC), 架橋型面心立方格子構造 (b-FCC), の原子 図を示す.



Fig. B.1: A schematic figure of bridged graphitic structure.



Fig. B.2: A schematic figure of bridged diamond-type structure.



Fig. B.3: A schematic figure of bridged SC-type structure.



Fig. B.4: A schematic figure of bridged BCC-type structure.



Fig. B.5: A schematic figure of bridged FCC-type structure.

B.2 等配合2元系構造

Fig. B.6, Fig. B.7, Fig. B.8 にそれぞれダイマ型構造 (h-DIMER), 直鎖型構造 (h-CHAIN), 等配合グラファイト型構造 (h-GRAPHITIC) の原子図を示す.



Fig. B.6: A schematic figure of hetro dimer structure.

 $\bigcirc \bullet \bigcirc \bullet \ominus \bullet \ominus$

Fig. B.7: A schematic figure of hetro chain structure.



Fig. B.8: A schematic figure of hetro graphitic structure.

B.3 Diamond 型構造

Fig. B.9, Fig. B.10, Fig. B.11 にそれぞれ Diamond 型 X₇Y 構造, Diamond 型 X₅Y₃ 構造, ZnS 構造の原子図を示す.



Fig. B.9: A schematic figure of Diamond-type X₇Y₁



Fig. B.10: A schematic figure of Diamond-type X_5Y_3



Fig. B.11: A schematic figure of ZnS (Diamond-type X₄Y₄)

B.4 SC型構造

Fig. B.12, Fig. B.13, Fig. B.14 にそれぞれ SC 型 X₇Y 構造, SC 型 X₆Y₂ 構造, NaCl 構造の原子図を示す.



Fig. B.12: A schematic figure of SC-type X₇Y₁



Fig. B.13: A schematic figure of SC-type X_6Y_2



Fig. B.14: A schematic figure of NaCl (SC-type X_4Y_4)

B.5 BCC型構造

Fig. B.15, Fig. B.16, Fig. B.17, Fig. B.18 にそれぞれ BCC 型 $X_{14}Y_2$ 構造, BCC 型 $X_{12}Y_4$ 構造, BCC 型 $X_{10}Y_6$ 構造, CsCl 構造の原子図を示す.



Fig. B.15: A schematic figure of BCC-type $X_{14}Y_2$



Fig. B.16: A schematic figure of BCC-type $X_{12}Y_4$



Fig. B.17: A schematic figure of BCC-type $X_{10}Y_6$



Fig. B.18: A schematic figure of CsCl (BCC-type X_8Y_8)

B.6 FCC型構造

Fig. B.19 Fig. B.20 にそれぞれ FCC 型 X₃Y 構造, FCC 型 X₂Y₂ 構造の原子図を示す.



Fig. B.19: A schematic figure of FCC-type X_3Y_1



Fig. B.20: A schematic figure of FCC-type X_2Y_2

B.7 Cu₂Mg型構造

Fig. B.21 に Cu₂Mg 型 X₂Y 構造の原子図を示す.



Fig. B.21: A schematic figure of Cu_2Mg -type X_2Y

参考文献

- Murray S. Daw, M. I. Baskes, Embedded-atom method: Derivation and application to impurities, surfaces, and other defects in metals, Phys. Rev. B, Vol. 29, 6443-6453, 1984.
- [2] M. I. Baskes, Modified embedded-atom potentials for cubic materials and impurities, Phys. Rev. B 46, 2727-2742, 1992.
- [3] J. Tersoff, New empirical approach for the structure and energy of covalent systems, Phys. Rev. B, Vol. 37, 6991-7000, 1988.
- [4] J. Tersoff, Empirical interatomic potential for silicon with improved elastic properties, Phys. Rev. B, Vol. 38, 9902-9905, 1988.
- [5] J. Tersoff, Modeling solid-state chemistry: Interatomic potentials for multicomponent systems, Phys. Rev. B, Vol. 39, 5566-5568, 1989.
- [6] D. W. Brenner, Empirical potential for hydrocarbons for use in simulating the chemical vapor deposition of diamond films, Phys. Rev. B, Vol. 42, 9458-9471, 1990.
- Y. Mishin, D. Farkas, M. J. Mehl, D. A. Papaconstantopoulos, Interatomic potentials for monoatomic metals from experimental data and ab initio calculations, Phys. Rev. B, Vol. 59, 3393-3407, 1999.
- [8] Y. Mishin, M. J. Mehl, D. A. Papaconstantopoulos ,A. F. Voter, J. D. Kress, Structural stability and lattice defects in copper: Ab initio, tight-binding, and embeddedatom calculations, Phys. Rev. B, Vol. 63, 224106, 2000.
- [9] Rajendra R. Zope, Y. Mishin, Interatomic potentials for atomistic simulations of the Ti-Al system, Phys. Rev. B, Vol. 68, 024102, 2003.
- [10] Y. Mishin, M.J. Mehl, D.A. Papaconstantopoulos, Phase stability in the FeNi system: Investigation by first-principles calculations and atomistic simulations, Acta Materialia, Vol. 53, 4029-4041, 2005.
- [11] A. E. Carlsson, Beyond Pair Potentials in Elemental Transition Metals and Semiconductors, Solid State Physics, Vol. 43, 1-91, 1990.
- [12] 岡田勲, ケイ酸塩ガラス・融体の構造の関連物性の分子動力学シミュレーション, 日本金属学会会報, Vol. 23, 600-607, 1984.
- [13] 香山正憲, 東京大学大学院工学系研究科講義資料.
- [14] ASNOP 研究会編, パソコン FORTRAN 版非線形最適化プログラミング, 日刊工業新聞社, 1991.
- [15] W. H. Press, B. P. Flannery, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling 著, 丹慶勝市, 奥村晴 彦, 佐藤俊郎, 小林誠訳, NUMERICAL RECIPES in C [日本語版] C 言語による 数値計算のレシピ, 技術評論社, 1993.
- [16] Kalyanmoy Deb, Multi-Objective Optimization using Evolutionary Alogorithms, Wiley, 2001.
- [17] F. H. Stillinger, T. A. Weber, Computer simulation of local order in condensed phases of silicon, Phys. Rev. B Vol. 31, 5262-5271, 1985.
- [18] A Simple Empirical N-Body Potential for Transition Metals, M. W. Finnis, J. E. Sinclair, Philosophical Magazine A, Vol. 50, 45-55, 1984.
- [19] Long-range Finnis-Sinclair potentials, A. P. Sutton, J. Chen, Philosophical Magazine Letters, Vol. 61, 139-146, 1990.
- [20] B. W. H. van Beest, G. J. Kramer, R. A. van Santen, Force fields for silicas and aluminophosphates based on ab initio calculations, Phys. Rev. Lett., Vol. 64, 1955-1958, 1990.
- [21] B. P. Feuston, S. H. Garofalini, Empirical three-body potential for vitreous silica, The Journal of Chemical Physics Vol. 89, 5818-5824, 1988.
- [22] F. H. Streitz, J. W. Mintmire, Energetics of aluminum vacancies in gamma alumina, Phys. Rev. B, Vol. 60, 773-777, 1999.
- [23] T. Kumagai, S. Izumi. S. Hara, S. Sakai, Development of a variable-charge molecular dynamics potential for Si/SiO₂ systems, International Conference on Computational Methods (ICCM 2004), Singapore, Abstract 75, 2004.
- [24] Z. Jiang, R. A. Brown, Atomistic Calculation of Oxygen Diffusivity in Crystalline Silicon, Phys. Rev. Lett., Vol. 74, 2046-2049, 1995.

- [25] G. Kresse, J. Hafner, Ab initio molecular dynamics for liquid metals, Phys. Rev. B, Vol. 47, 558-561, 1993.
- [26] G. Kresse, J. Furthmüller, Efficient iterative schemes for ab initio total-energy calculations using a plane-wave basis set, Phys. Rev. B, Vol. 54, 11169-11186, 1996.
- [27] James H. Rose, John R. Smith, Francisco Guinea, John Ferrante, Phys. Rev. B, 29, 2963-2969, 1984.
- [28] M. Z. Bazant, E. Kaxiras, J. F. Justo, Environment-dependent interatomic potential for bulk silicon, Phys. Rev. B, Vol. 56, 8542-8552, 1997.
- [29] G. C. Abell, Empirical chemical pseudopotential theory of molecular and metallic bonding, Phys. Rev. B, Vol. 31, 6184-6169, 1985.
- [30] H. Blamane, T. Halicioglu, W. A. Tiller, Comparative study of silicon empirical interatomic potentials, Phys. Rev. B, Vol. 46, 2250-2279, 1992.
- [31] 原祥太郎,構造緩和アモルファスシリコンの原子モデリング及び表面・界面特 性評価:分子動力学アプローチ,東京大学博士論文,2004.
- [32] M. Kitabatake, J. E. Greene, Molecular dynamics and quasidynamics simulations of low-energy particle bombardment effects during vapor-phase crystal growth: Production and annihilation of defects due to 50 eV Si incident on (2 × 1)-terminated Si(001), J. Appl. Phys., Vol. 73, 3183-3194, 1993.
- [33] T. Motooka, Model for amorphization processes in ion-implanted Si, Phys. Rev. B, Vol. 49, 16367-16371, 1996.
- [34] T. Motooka, K. Nisihira, S. Munetoh, K. Moriguchi, A. Shintani, Moleculardynamics simulations of solid-phase epitaxy of Si: Growth mechanisms, Phys. Rev. B, Vol. 61, 8537-8540, 2000.
- [35] K. Nordlund, M. Ghaly, R. Averback, M. Caturla, T. D. Rubia, J. Tarus, Defect production in collision cascades in elemental semiconductors and fcc metals, Phys. Rev. B, Vol. 57, 7556-7570, 1998.
- [36] B. Weber, D. M. Stock and K. Gärtner, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B-Beam MD simulations of ion beam induced epitaxial crystallization at a-Si/c-Si interfaces: interface structure and elementary processes of crystallization, Interact. Mater. Atoms, Vol. 148, 375-380, 1999.

- [37] L. A. Marqués, L. Pelaz, J. Hernández, J. Barbolla, G. H. Gilmer, Stability of defects in crystalline silicon and their role in amorphization, Phys. Rev. B, Vol. 64, 045214, 2001.
- [38] S. Izumi, S. Hara, T. Kumagai, S. Sakai, Classification of amorphous-silicon microstructures by structural parameters: molecular dynamics study, Comp. Mat. Sci., Vol. 31, 258-268, 2004.
- [39] S. Izumi, S. Hara, T. Kumagai, S. Sakai, A method for calculating surface stress and surface elastic constants by molecular dynamics: application to the surface of crystal and amorphous silicon, Thin Solid Films, Vol. 467, 253-260, 2004.
- [40] S. Izumi, S. Hara, T. Kumagai, S. Sakai, Molecular dynamics study of homogeneous crystal nucleation in amorphous silicon, J. Cryst. Growth, Vol. 274, 47-54, 2005.
- [41] S. Izumi, S. Hara, T. Kumagai, S. Sakai, Structural and mechanical properties of well-relaxed amorphous-crystal interface in silicon: molecular dynamics study, Comp. Mat. Sci., Vol. 31, 279-286, 2004.
- [42] M. I. Baskes, Many-Body Effects in fcc Metals: A Lennard-Jones Embedded-Atom Potential, Phys. Rev. Lett., Vol. 83, 2592-2595, 1999.
- [43] S. Izumi, S. Sakai, The Development of the Empirical Bond-Order Potentials for Silicon Clusters, J. Soc. Mat. Sci. Japan (in Japanese) 51, 536-542, 2002.
- [44] M. T. Yin, M. L. Cohen, Will Diamond Transform under Megabar Pressures?, Phys. Rev. Lett., Vol. 50, 2006-2009, 1983.
- [45] M. T. Yin , M. L. Cohen, Structural theory of graphite and graphitic silicon, Phys. Rev. B, Vol. 29, 6996-6998, 1984.
- [46] K. Yamaguchi, K. Itagaki, Measurement of high temperature heat content of silicon by drop calorimetry, J. Therm. Anal. Calorim., Vol. 69, 1059-1066, 2002.
- [47] M. V. R. Murty, H. A. Atwater, Empirical interatomic potential for Si-H interactions, Phys. Rev. B, Vol. 51, 4889-4993, 1995.
- [48] S. Izumi, S. Sakai, Internal Displacement and Elastic Properties of the Silicon Tersoff Model, JSME Int. J. Ser. A-Solid Mech. Mat. Eng., Vol. 47, 54-61, 1998.
- [49] P. E. Blöchl, Projector augmented-wave method, Phys. Rev. B, Vol. 50, 17953-17979, 1994.

- [50] G. Kresse, D. Joubert, From ultrasoft pseudopotentials to the projector augmentedwave method, Phys. Rev. B, Vol. 59, 1758-1775, 1999.
- [51] H. J. Monkhorst, J. D. Pack, Special points for Brillouin-zone integrations, Phys. Rev. B, Vol. 13, 5188-5192, 1976.
- [52] E. Anastassakis, A. Cantarero, M. Cardona, Piezo-Raman measurements and anharmonic parameters in silicon and diamond, Phys. Rev. B, Vol. 41, 7529-7535, 1990.
- [53] J. F. Justo, Martin Z. Bazant, Efthimios Kaxiras, V. V. Bulatov, S. Yip, Interatomic potential for silicon defects and disordered phases, Phys. Rev. B, 58, 2539-2550, 1988.
- [54] H. Seong, L. J. Lewis, First-principles study of the structure and energetics of neutral divacancies in silicon, Phys. Rev. B, Vol. 53, 9791-9796, 1996.
- [55] W. K. Leung, R. J. Needs, G. Rajagopal, S. Itoh, S. Ihara, Calculations of Silicon Self-Interstitial Defects, Phys. Rev. Lett., Vol. 83, 2351-2354, 1999.
- [56] L. Shao, J. Liu, Q. Y. Chen, W.-K. Chu, Boron diffusion in silicon: the anomalies and control by point defect engineering, Materials Science and Engineering: R: Reports, Volume 42, 65-114, 2003.
- [57] T. E. Haynes, D. J. Eaglesham, P. A. Stolk, H.-J. Gossmann, D. C. Jacobson, J. M. Poate, Interactions of ion-implantation-induced interstitials with boron at high concentrations in silicon, Applied Physics Letters, Vol. 69, 1376-1378. 1996.
- [58] Ji-Wook Jeong, Atsushi Oshiyama, Atomic and electronic structures of a Boron impurity and its diffusion pathways in crystalline Si, Phys. Rev. B, Vol. 64 235204, 2001.
- [59] W. Windl, W.; X.-Y. Liu, M. P. Masquelier, First-Principles Modeling of Boron Clustering in Silicon, Physica Status Solidi (B), Vol. 226, 37-45, 2001.
- [60] Paola Alippi, P. Ruggerone, L. Colombo, Neutral boron-interstitial clusters in crystalline silicon, Phys. Rev. B, Vol. 69, 125205, 2004.
- [61] M. Nakamura, H. Fujioka, K. Ono, M. Takeuchi, T. Mitsui, M. Oshima, Molecular dynamics simulation of III-V compound semiconductor growth with MBE, Journal of Crystal Growth, Vol. 209, 232-236, 2000.

- [62] David Vanderbilt, Soft self-consistent pseudopotentials in a generalized eigenvalue formalism, Phys. Rev. B, Vol. 41, 7892-7895, 1990.
- [63] G. Kresse, J. Hafner, Norm-conserving and ultrasoft pseudopotentials for first-row and transition elements, J. Phys.: Condens. Matter, Vol. 6, 8245-8257, 1994.
- [64] John P. Perdew, Yue Wang, Accurate and simple analytic representation of the electron-gas correlation energy, Phys. Rev. B, 45, 13244-13249, 1992.
- [65] 井上明久, 過冷金属バルク金属ガラス相への異常安定化現象, 応用物理, Vol. 67, 1176-1180, 1998.
- [66] M. Shimono, H.Onodera, Geometrical and chemical factors in the glass-forming ability, Scripta Materialia, Vol. 44, 1595-1598, 2001.
- [67] 下野昌人, 小野寺秀博, 分子動力学法によるアモルファス金属の形成と結晶化の 研究, まてりあ, Vol. 41, 473-480, 2002.
- [68] M. Shimono, H.Onodera, Material Transactions, JIM, Vol. 39, 147-153, 1998.
- [69] 新國大介, 熊谷知久, 原祥太郎, 泉聡志, 酒井信介, アモルファス金 属の構造特性 の分子動力学シミュレーション: ポテンシャルの影響, 粉体粉末冶金協会平成 17 年度春季大会, 講演 概要集, 162, 2005.
- [70] X. W. Zhou, H. N. G. Wadley, R. A. Johnson, D. J. Larson, N. Tabat, A. Cerezo, A. K. Petford-Long, G. D. W. Smith, P. H. Clifton, R. L. Martense, T. F. Kelly, Atomic scale structure of sputtered metal multilayers, Volume 49, 4005-4015 2001.
- [71] X. W. Zhou, R. A. Johnson, and H. N. G. Wadley, Misfit-energy-increasing dislocations in vapor-deposited CoFe/NiFe multilayers, Phys. Rev. B, Vol. 69, 144113, 2004.
- [72] 新国大介, 熊谷知久, 原祥太郎, 泉聡志, 酒井信介, GEAM ポテンシャルによる Zr 基金属ガラスの構造解析, 第11回分子動力学シンポジウム講演論文集, 16-19, 2006.
- [73] John P. Perdew, Kieron Burke, Matthias Ernzerhof, Generalized Gradient Approximation Made Simple, Phys. Rev. Lett., Vol. 77, 3865-3868, 1996.
- [74] M. Methfessel, A. T. Paxton, High-precision sampling for Brillouin-zone integration in metals, Phys. Rev. B, Vol. 40, 3616-3621, 1989.
- [75] E. Matsubara, T. Ichitsubo, J. Saida, S. Kohara, H. Ohsumi STRUCTURAL STUDY OF Zr-BASED METALLIC GLASSES, ISMANAM2005, 2005.

- [76] G. J. Ackland, S. J. Wooding, D. J. Bacon, Defect, surface and displacementthreshold properties of α -zirconium simulated with a many-body potential, Philosophical Magazine. A., Vol. 71, 553-565, 1995.
- [77] W. Hu, B. Zhang, B. Huang, F. Gao, D. J. Bacon, Analytic modified embedded atom potentials for HCP metals, Journal of Physics: Condensed Mater, Vol. 13, 1193-1213, 2001.
- [78] C. Kittel, Introduction to Solid State Physics 7th edition, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1996.
- [79] G. Simmons, H. Wang, Single crystal elastic constants and calculated aggregate properties., Cambridge (MA), MIT Press, 1977.
- [80] W. Wycisk, M. Feller-Kniepmeier, Quenching experiments in high purity Ni Journal of Nuclear Materials, Vol. 69-70, (1978), 616-619.
- [81] J.C. de Lima, J. M. Tonnerre, D. Raoux, Anomalous wide angle X-ray scattering of amorphous Ni₂Zr alloy Journal of non-crystalline solids, Vol. 106, 38-41, 1988.
- [82] Yan Xu, W. B. Muir, Z. Altounian, W. J. L. Buyers, R. L. Donaberger, Consistent partial structure factors for amorphous $Ni_{0.33}(Zr_yHf_{1-y})_{0.67}$ using x-ray and neutron diffraction, Phys. Rev. B, Vol. 53 8983-8992, 1996.
- [83] T. Kumagai, S. Hara, S. Izumi, S. Sakai, Development of a bond-order type interatomic potential for Si-B systems, Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, Vol. 14, S.29-S.37, 2006.
- [84] M. C. Payne M. P. Teter, D. C. Allan, T. A. Arias, J. D. Joannopoulos, Iterative minimization techniques for ab initio total-energy calculations: molecular dynamics and conjugate gradients, Rev. Mod. Phys. 64, 1045-1097, 1992.

研究業績

(1)研究論文

- T. Kumagai, S. Hara, S. Izumi, and S. Sakai, "Development of a method for making interatomic potential: an application to metallic systems", Materials Science Forum, Vol. 539-543, 2123-2128, 2006.
- 2. T. Kumagai, S. Izumi, S. Hara, S. Sakai. "Development of bond-order potentials that can reproduce the elastic constants and melting point of silicon for classical molecular dynamics simulation", (In Press).
- 3. T. Kumagai, S. Hara, S. Izumi, S. Sakai, "Development of a bond-order type interatomic potential for Si-B systems", Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, Vol. 14, S.29-S.37, 2006.
- 4. 熊谷知久, 原祥太郎, 泉聡志, 酒井信介, "シリコンの融点と弾性定数を再現する ボンドオーダ型原子間ポテンシャルの開発", 材料, Vol.55, 1-7, 2006.

(2) 発表論文. (国際学会)

- T. Kumagai, S. Hara, S.Izumi and S. Sakai, "Development of a Method for Making Interatomic Potential for Binary Systems: An application to Metallic Systems.", International Conference on Processing and Manufacuring of Advanced Materials(THERMEC'2006), Vancouver Canada, July, 2006, Abstracts, 276(ポスター発表).
- 2. T. Kumagai, S. Hara, S.Izumi and S. Sakai, "Development of a bond-order type interatomic potential for Si-B systems", MIcromechanics and Microstructure Evolution: Modeling, Simulation and Experiments", Madrid, Spain, September, 2005 (ポスター発表).
- 3. T. Kumagai, S. Hara, S.Izumi and S. Sakai, "Development of a bond-order type interatomic potential for binary systems: Application to Si-B systems", International Anniversary Symposium on Molecular Dynamics Simulations, Osaka University, Osaka, Japan, August, 2005, P7 (ポスター発表).

4. T. Kumagai, S. Izumi. S. Hara, S. Sakai, "Development of a variable-charge molecular dynamics potential for Si/SiO2 systems", International Conference on Computational Methods (ICCM 2004), Singapore, December 2004, 75.

(3) 発表論文(国内学会)

- 1. 熊谷知久, 原祥太郎, 泉聡志, 酒井信介, 竹内久雄, "共有結合系のためのボンド オーダ型原子間ポテンシャル作成手法の開発", 日本機械学会 2006 年度年次大 会, 2006 年 9 月, 915-916.
- 2. 熊谷知久, 新国大介, 原祥太郎, 泉聡志, 酒井信介, "一般化された原子間ポテンシャル作成手法の開発:金属系への適用", 第11回分子動力学シンポジウム, 2006年5月, 73-78.
- 3. 熊谷知久, 原祥太郎, 泉聡志, 酒井信介, "Si-B 系のためのボンドオーダ型原子間 ポテンシャルの開発", 日本機械学会 2005 年度年次大会, 2005 年9月, 電気通信 大学, 講演論文集 (6) 239-240.
- 4. 熊谷知久, 泉聡志, 原祥太郎, 酒井信介, "Si/SiO2 系のための電荷移動原子間ポ テンシャルの開発", 応用物理学会 薄膜・表面物理分科会・シリコンテクノロ ジー分科会共催 特別研究会「ゲートスタック研究会」材料・プロセス・評価の 物理」(第10回研究会),2005年1月, 東レ研修センター, 157-160 (ポスター 発表).
- 5. 熊谷知久, 泉聡志, 原祥太郎, 酒井信介, "Development of an Environmental Dependent Charge-Transfer Interatomic Potential: Application to Si/SiO2 systems", The 15th Symposium of The Materials Research Society of Japan, 日本大学, 2004 年 12 月, 233.
- 6. 熊谷知久, 泉聡志, 原祥太郎, 酒井信介, "シリコンの弾性定数と融点を再現する ボンドオーダーポテンシャルの開発", 日本機械学会第17回計算力学講演会, 仙 台市民会館, 2004年11月, 講演論文集281-282.
- 7. 熊谷知久, 原祥太郎, 泉聡志, 酒井信介, "Si/SiO2 系のための電荷移動原子間ポ テンシャルの開発", 日本機械学会 2004 年度年次大会, 北海道大学, 2004 年9 月, 講演論文集 (6) 213-214.
- 8. 熊谷知久, 泉聡志, 原祥太郎, 酒井信介, "Si/SiO2 界面のための電荷移動原子間 ポテンシャルの開発", 日本機械学会第16回計算力学講演会, 神戸大学, 2003 年 11月, 講演論文集 525-526.

9. 熊谷知久, 寺田実, "Web サイト改良支援のための構造と履歴の視覚化システム", インタラクション 2002, 早稲田大学, 2002 年 3 月, 論文集 197-198 (ポスター発表).

(5) 表彰

- 1. International Anniversary Symposium on Molecular Dynamics Simulations 2005, MD Award (Best Poster)
- 2. MD 賞 (学生部門), 第 11 回分子動力学シンポジウム.

そのほか研究の一部を担当した論文 (6)研究論文

- S. Hara, S. Izumi, T. Kumagai, S. Sakai, "Surface energy, Stress and Structure of Well-relaxed Amorphous Silicon: A Combination Approach of ab-initio and Classical Molecular Dynamics", Surface Science, Vol. 585, 17-24, 2005.
- 2. 原祥太郎, 泉聡志, 熊谷知久, 酒井信介, "シリコンのアモルファス-結晶界面の 構造/力学的特性: 分子動力学的アプローチ",日本機械学会論文集A, vol. 71, pp. 23-29. 原祥太郎, 熊谷知久, 泉聡志, 酒井信介, "第一原理計算と古典分子動 力学の組み合わせ解析によるアモルファスシリコン表面の構造・力学的特性評 価", 材料, Vol. 54, 45-50 2005.
- 3. S. Izumi, S. Hara, T. Kumagai and S. Sakai, "Molecular Dynamics Study of Homogeneous Crystal Nucleation in Amorphous silicon", Journal of Crystal Growth, Vol. 274, 47-54, 2005.
- 4. S. Izumi, S. Hara, T. Kumagai and S. Sakai, "A method for calculating surface stress and surface elastic constants by molecular dynamics: Application to the surface of crystal and amorphous silicon", Thin Solid Films, Vol. 467, 253-260, 2004.
- 5. S. Izumi, S. Hara, T. Kumagai and S. Sakai, "Structural and mechanical properties of well-relaxed amorphous-crystal interface in silicon: Molecular dynamics study", Computational Material Science, Vol. 31, 279-286, 2004.
- Izumi, S. Hara, T. Kumagai and S. Sakai, "Classification of amorphous-silicon microstructures by structural parameters: Molecular dynamics study", Computational Material Science, Vol. 31, 258-268, 2004.
- (7) 発表論文. (国際学会)
 - S. Hara, T. Kumagai, S. Izumi, S. Sakai, "Atomistic Simulation of Dislocation-Interface Interaction in the FCC/HCP Incoherent Systems.", Third International Conference Multi-scale Materials Modeling (MMM-2006), Freiburg, Germany, September 2006, 172-174.
 - S. Izumi, K. Murai, S. Hara, T. Kumagai, S. Sakai, "Influence of Impurity Atoms on the Rate of Solid Phase Epitaxy: Molecular Dynamics Study.", Third International Conference Multi-scale Materials Modeling (MMM-2006), Freiburg, Germany, September 2006, 183-185.

- 3. S. Hara, S. Izumi, T. Kumagai, S. Sakai, "Structural and Mechanical properties of amorphous silicon: ab-initio and classical molecular dynamics study", 11th International congress on fracture (ICF11), Turin, Italy, March 2005, 233.
- S. Hara, S. Izumi, T. Kumagai, S. Sakai, "Structural and mechanical properties of amorphous silicon surfaces: ab-initio and classical molecular dynamics study", Second Multi-scale Materials Modeling (MMM-II) Conference, Los Angenles, CA, USA, Oct. 2004, 579-581.
- 5. S. Hara, S. Izumi, T. Kumagai, S. Sakai, "Molecular dynamics study of homogeneous crystal nucleation in amorphous silicon", The 1st International Symposium on Micro & Nano Technology (ISMNT-1), March 2004, Hawaii, USA. 158.
- S. Izumi, S. Hara, T. Kumagai, S. Sakai, "A method for calculating surface stress and elastic constants by molecular dynamics", Mesomechanics 2003, Tokyo, JAPAN 2003, 56-63.
- S. Izumi, S. Hara, T. Kumagai, S. Sakai, "Elastic properties of the surfaces and interfaces of crystal and amorphous silicon", IUTAM Symposium 2003, Osaka, JAPAN, July 2003, 117-127.
- (8) 発表論文(国内学会)
- 原祥太郎, 熊谷知久, 泉聡志, 酒井信介, "ナノレイヤー金属材料における界面と 転位の相互作用計算", 第19回計算力学講演会, 2006年11月, 名古屋大学, 講演 論文集, 607-608.
- 新国大介,熊谷知久,原祥太郎,泉聡志,酒井信介,"GEAM ポテンシャルによる Zr基金属ガラスの構造解析",第11回分子動力学シンポジウム,2006年5月,講 演論文集16-19.
- 原祥太郎, 熊谷知久, 泉聡志, 酒井信介, "薄膜の力学的特性評価に向けた分子動 力学-有限要素法連結解析", M&M2005 材料力学部門講演会, 九州大学 2005 年 11月, 講演論文集 551-552.
- 新國大介,熊谷知久,原祥太郎,泉聡志,酒井信介,"アモルファス金属の構造特 性の分子動力学シミュレーション:ポテンシャルの影響",粉体粉末冶金協会平 成17年度春季大会,2005年6月,早稲田大学,講演概要集162.
- 5. 原祥太郎, 泉聡志, 熊谷知久, 酒井信介, "三次元分子動力学 有限要素法連結手 法に関する基礎的検討", 日本機械学会第17回計算力学講演会, 仙台市民会館, 2004年11月, 講演論文集137-138.

- 6. 原祥太郎, 熊谷知久, 泉聡志, 酒井信介, "第一原理 古典分子動力学ハイブリッド手法によるアモルファスシリコン表面の力学的特性評価", 第9回分子動力学シンポジウム, 岡山大学, 2004年5月, 55-60.
- 7. 村井 克成, 原祥太郎, 熊谷知久, 泉聡志, 酒井信介, "分子動力学によるシリコンの固相成長速度の評価", 第9回分子動力学シンポジウム, 岡山大学, 2004年5月, 19-22.
- 原祥太郎, 泉聡志, 熊谷知久, 酒井信介, "第一原理 古典分子動力学ハイブリッド法によるアモルファスシリコンの最安定構造の探索", 日本機械学会第16回計算力学講演会, 神戸大学, 2003 年11 月, 講演論文集 485-486.
- 9. 泉聡志, 原祥太郎, 熊谷知久, 酒井信介, "Tight-binding 分子動力学による SiH4 の解離吸着シミュレーション", 日本機械学会第 16 回計算力学講演会, 神戸大 学, 2003 年 11 月, 講演論文集 517-518.
- 10. 原祥太郎, 熊谷知久, 泉聡志, 酒井信介, "シリコンの固相成長に関する分子動力 学シミュレーション", M&M2003 材料力学部門講演会, 富山大学, 2003 年 9 月 , 講演論文集 487-488.
- 原祥太郎, 泉聡志, 熊谷知久, 酒井信介, "アモルファス / 結晶シリコン界面の構造 / 力学的特性に関する分子動力学シミュレーション", 第8回分子動力学シン ポジウム, 工学院大学, 2003 年 5 月, 講演論文集 69-74.
- 12. 泉聡志, 原祥太郎, 熊谷知久, 酒井信介, アモルファスシリコンのオーダーパラ メータによる分類化, 第8回分子動力学シンポジウム, 工学院大学, 2003年5月, 講演論文集 7-11.
- 13. 泉聡志, 原祥太郎, 熊谷知久, 酒井信介, "半導体材料の界面応力 / 弾性定数の原 子レベル評価", 日本機械学会材料力学部門 2003 年春のシンポジウム, 東京工 業大学, 2003 年 3 月, 1-6.
- 14. 原祥太郎, 熊谷知久, 泉聡志, 酒井信介, "アモルファスシリコンのオーダーパラ メータと力学的特性の相関", 第 52 回理論応用力学講演会, 日本学術会議, 2003 年1月, 講演論文集 211-212.

謝辞

本論文は著者が東京大学大学院在学中,東京大学泉聡志助教授のご指導の下に研 究したことをまとめたものです.泉聡志助教授には、5年間にわたり,研究について の考え方,進め方,発表の仕方,論文へのまとめ方をはじめ,研究に関する手法を丁寧 に指導していただきました.長い期間にわたり,あきらめずに指導を続けていただき、 本当に感謝しております.研究室のリーダーである酒井信介教授には、要所要所での 研究に対するご指摘をいただき、また、素晴らしい研究環境を整えていただきました. 心より御礼申し上げたいと思います.原祥太郎助手には、最初は近い研究分野の先輩 として、また後には研究室スタッフとして、多くの実用的なアドバイスと協力を頂く ことが出来ました.近い年代に、このように優秀な先輩を得られたことを非常な幸運 でした.ありがとうございました.また、様々な研究会においてアドバイスを頂いた 先生方にも深く感謝申し上げたいと思います.

研究室のスタッフ,先輩,同期,後輩のおかげで,楽しく研究生活を過ごすことが出 来ました.皆さん本当にどうもありがとうございます.最後に研究活動をサポートし てくれた家族に感謝の意を表したいと思います.